

Nikon Research Report

刊行の趣旨

株式会社ニコンが行った研究開発活動の成果を,広く紹介することが刊行の趣旨である.ニコン のコア技術である「光利用技術」と「精密技術」をベースにした研究開発成果として,新製品に 盛り込まれた技術と,学会等の機関から評価を頂いた技術を中心に紹介している. 巻 頭 言



代表取締役 兼 社長執行役員 馬立 稔和

今もなお続いている COVID-19に加え,国際情勢の不安定化などにより,私たちは様々な課題に直面しています.そのような中でも,お客様の欲しいモノやコトの本質を理解し,解決策を一緒に考え,お客様のイノベーション創出を支援していきたいと考えています.

2022年4月に、さらなる「信頼と創造」にむけて中期経営計画を発表しました.2030年のニコンのあり たい姿を「人と機械が共創する社会の中心企業」とし、映像や精機という主要事業だけでなく、戦略事業 のヘルスケア、コンポーネント、デジタルマニュファクチャリングにおいて、お客様の欲しいモノやコト をお客様にとって最適な方法で実現していきます.これらの事業の価値提供領域として、高度なものづく りを実現して人間の可能性を拡げる「インダストリー」と、高度な医療やエンターテインメントを実現し て人生を豊かにする「クオリティオブライフ」の二つの領域を定めています.

本レポートでは、「インダストリー」でものづくりの世界に革新をもたらす材料加工技術や、「クオリ ティオブライフ」で医療を高度化する AI 画像処理技術など、ニコンの技術開発の一端をお伝えします.

> エグゼクティブ・フェロー 先進技術開発本部長 土肥 正明



世界的に大きな制約が続き、また不透明性が増しています.技術開発においては、これらの状況に柔軟 に、そして素早く対応することがこれまで以上に求められています.ニコンの研究および開発職場でも、 お客様のニーズに応える製品・サービスを一日でも早く実現するために、様々な工夫のもと、主要事業に 向けた技術開発と、中期経営計画で定めた成長ドライバーに向けた技術開発を進めています.特に成長ド ライバーでは、これまで技術開発を続けてきた成果が実績として徐々に目に見える形になってきています.

これら成長ドライバーの技術開発の取り組みを中心に、2021年度に発売・発表した製品の技術解説と、 様々な学会に投稿・発表して高い評価を頂いた論文テーマを本レポートにまとめ、ニコングループの研 究・開発成果として、今年も皆様にお伝えします。ニコンが行っている技術開発の一端ではありますが、 我々の取り組みを皆様に知っていただくとともに、ニコンの技術が社会に役立つ契機になればと思います。

Nikon Research Report Vol.4 目次/CONTENTS

技術解説/Technical Reports

5

 フラッグシップフルサイズミラーレスカメラ「ニコン Z 9」の開発 尾崎浩二,斉藤義久
 Development of Flagship Full-Size Mirrorless Camera with Interchangeable Lenses: Nikon Z 9 Koji OZAKI and Yoshihisa SAITO

光加工機 Lasermeister1000SE/1000S の開発 江上茂樹 Development of the Lasermeister1000SE/1000S Optical Processing Machine Shigeki EGAMI

 LiB 検査市場に貢献するニコンの X-Ray CT 技術 坂口直史, David Bate, Jan De Geeter, Jos Jans and Ben Morgan
 Nikon's X-Ray CT Technology that Contributes to the LiB Inspection Market Naoshi SAKAGUCHI, David BATE, Jan DE GEETER, Jos JANS and Ben MORGAN

19 顕微鏡対物レンズ CFI Plan Apochromat λD シリーズの開発 高木英嗣 Development of the CFI Plan Apochromat Lambda D Series Objectives for Biological Microscopes Hidetsugu TAKAGI

26 AI 画像処理技術を活用したミトコンドリアの詳細解析 門井宏平,武居俊輔 Detailed Analysis of Mitochondria using AI Image Processing Technology Kohei KADOI and Shunsuke TAKEI

研究開発論文/Research and Development Reports

32 発電用ガスタービン実験機の翼への最適リブレット効果予測と、そのレーザー加工によるリブレット性能評価 白石雅之、土橋晋太郎、Peter A. Leitl, Andreas Flanschger, Stefan Schreck, Richard Benauer, Simon Pramstrahler, Andreas Marn

Numerical and Experimental Investigation of Laser Processed Riblets on Turbine Exit Guide Vanes of Gas Turbine Test Rig and the Impact on the Performance

Masayuki SHIRAISHI, Shintaro TSUCHIHASHI, Peter A. LEITL, Andreas FLANSCHGER, Stefan SCHRECK, Richard BENAUER, Simon PRAMSTRAHLER and Andreas MARN

40	超小型ジェットエンジンの最適リブレット計算とそのレーザー加工,およびエンジン性能での効果検証 稲崎慎也, Peter A. Leitl, Andreas Flanschger, Stefan Schreck, Richard Benauer Numerical and Experimental Investigation of Laser Processed Riblets on Ultra-small Jet Engines and the Impact on the Performance Shinya INASAKI, Peter A. LEITL, Andreas FLANSCHGER, Stefan SCHRECK and Richard BENAUER
48	ガスタービン圧縮機部材へのレーザー加工によるリブレット形成と機械的特性評価 綿引健二, 蘆田憲一, 土橋晋太郎, 土橋広和 Riblet Formation by Laser Ablation on Gas Turbine Compressor Materials and Evaluation Results of Mechanical Properties Kenji WATAHIKI, Kenichi ASHIDA, Shintaro TSUCHIHASHI and Hirokazu TSUCHIHASHI
55	仮想環境におけるレイキャスティングを用いたインタラクティブ・サーフィスの設計と没入型フォト ブラウザへの応用 高階知已,伊藤 充,長浦 仁,若林英佑 Design of Curved Raycasting-based Interactive Surfaces in Virtual Environments and Its Application to an Immersive Photo Browser Tomomi TAKASHINA, Mitsuru ITO, Hitoshi NAGAURA and Eisuke WAKABAYASHI
61	領域別に適正露光制御可能な高ダイナミックレンジ1型17 Mpixel 1000 fps 積層 CMOS イメージセンサ 平田友希,村田寛信,有井 卓,松田英明,米持 元,手塚洋二郎,綱井史郎 A 1-inch 17 Mpixel 1000 fps Block-Controlled Coded-Exposure Back-Illuminated Stacked CMOS Image Sensor for Computational Imaging and Adaptive Dynamic Range Control Tomoki HIRATA, Hironobu MURATA, Taku ARII, Hideaki MATSUDA, Hajime YONEMOCHI, Yojiro TEZUKA and Shiro TSUNAI
68	エシェロンミラーを用いた高スループットなテラヘルツ分光ラインイメージング 浅井 岳,秦 大樹,原田真太郎,笠井達基,嵐田雄介,片山郁文 High-throughput Terahertz Spectral Line Imaging using an Echelon Mirror Gaku ASAI, Daiki HATA, Shintaro HARADA, Tatsuki KASAI, Yusuke ARASHIDA and Ikufumi KATAYAMA
75	 ミストデポジションと高水分散性 ITO ナノ粒子によるフレキシブル基板上への高性能 ITO 薄膜の作製 鈴木涼子,西康孝,松原正樹,村松淳司,蟹江澄志 Fabrication of High-Performance ITO Flexible Thin Films Utilizing Mist Deposition and ITO Nanoparticles with High Water Dispersibility Ryoko SUZUKI, Yasutaka NISHI, Masaki MATSUBARA, Atsushi MURAMATSU and Kiyoshi KANIE
82	燃焼~溶融の CAE による機能性評価と感度調整による試作レス開発プロセスの確立 小西洋平,武村直輝,中野史康,齊藤卓一 Establishment of a Prototype-less Development Process by Functionality Evaluation and Sensitivity Setting using Numerical Simulation for Combustion to Melt Yohei KONISHI, Naoki TAKEMURA, Fumiyasu NAKANO and Takuichi SAITO

技術解説

Technical

Reports



Development of Flagship Full-Size Mirrorless Camera with Interchangeable Lenses: Nikon Z 9

Koji OZAKI and Yoshihisa SAITO

ニコンの最先端技術を結集させ、静止画・動画ともにニコン史上最高の機能・性能を備えた「ニコンZマウント」を 採用した初のフラッグシップモデルとなるフルサイズ(ニコンFXフォーマット)ミラーレスカメラ「ニコン Z9」を 2021年12月に発売した.ここでは、Z9の様々な開発要素について説明する.

In December, 2021, we launched the sales of the full-frame (Nikon FX-format) mirrorless camera Nikon Z 9. The Z 9 is the first flagship model of the Z series mirrorless cameras, combining Nikon's leadingedge technologies to deliver the best still and video features and performance in Nikon's history. Here, we explain the various development elements of the Z 9.

Key words レンズ交換式、ミラーレスカメラ interchangeable lenses, mirrorless camera

はじめに

2021年12月,ニコン初のフラッグシップモデルとなる FX フォーマットミラーレスカメラ「ニコン Z 9」を発売した. 本稿では Z 9 の様々な開発要素について解説する.



Fig. 1 ニコン Z 9

2 AF と連続撮影性能

高性能 AF は 3 つのテクノロジーに支えられている. ニ コン初となる120回/秒の高速 AF 演算,ディープラーニン グ技術を用いて開発した優れた被写体検出, Z マウントな らではの高速 AF 情報通信である. これらのテクノロジー が融合し,高速連続撮影中でもランダムに動く被写体を正 確に捉える高次元の AF 追従性能を実現している. 120回/ 秒の高速 AF 演算は,新規 CMOS センサーによる高速読み 出しと EXPEED 7の高速処理の連携により正確な AF 演算 を実現. 被写体検出は,ディープラーニング技術を用いて 開発したアルゴリズムを搭載し,9種類の被写体検出を実 現. 人物,犬,猫,鳥,車,バイク,自転車,列車,飛行 機の検出が可能. 人物検出では従来よりも小さなサイズの 瞳を検出,ゴーグルやサングラス越し,顔が逆さまの状態 でも瞳を検出が可能なように対応. カメラボディーとレン ズの情報伝達において距離情報を1コマ毎に伝達すること で高精度な AF を実現している. また, CFexpress Type B の高速書き込みによって JPEG FINE (L) または高効率



Fig. 2 検出可能な被写体イメージ

RAW 設定時,約20コマ/秒で1000コマ以上の連続撮影が可能. AF 性能と相まって,バッファを気にすることなく長時間の連続撮影が可能となった.

3 電子ビューファインダー

Real-Live Viewfinder と高輝度 3000 cd/m²を対応した Quad-VGA パネルの搭載により従来の電子ビューファイン ダーからの大きな進化を実現. 従来の電子ビューファイン ダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラー アップによる像消失で見ることができなかった瞬間まで、 そのすべてを表示する Real-Live Viewfinder を搭載.ファイ ンダー像の消失が起きないよう同一画像を表示する従来の ブラックアウトフリー撮影とは異なり、実際の被写体の動 きを常にそのまま表示する. ニコン新開発のデュアルスト リーム技術によって、メモリーカードに記録するための静 止画画像データと、電子ビューファインダー、画像モニ ターに表示するライブビューデータを個別に同時処理. こ れによりライブビューに特化した処理ができるため、一つ ひとつの瞬間を逃さず見られる Real-Live Viewfinder を可能 にした. 周囲が明るく、これまで被写体のディテールを確 認しにくかった状況でも,新たに搭載した輝度を 3000 cd/ m²まで調整できる Quad-VGA パネルにより, 被写体をクリ アーに確認できる. 真夏のビーチや晴れた雪原などの非常 に明るいシーンでもはっきり確認できる.



Fig. 3 Real-Live Viewfinder のメカニズム



熱源から外観カバーまでの放熱経路を最適化し,前カ バー,背面カバーは底カバーと一体にすることで分割ライ ンを減らし伝熱効率を上げ,強制空冷無しで,8K UHD/30p約125分の動画をカメラボディー内のメモリー カードに記録可能とした.優れた解像力を誇る「S-Line」の NIKKOR Z レンズと組み合わせることで,画面の隅々まで 高い描写性能を発揮する.また,4K UHD/120p/60p/30pに も対応し映像クリエイターの多様な動画制作のニーズに応 える.4K UHD/120p動画でも画面クロップ無しで撮影で きるため,異なるフレームレートで撮影しても,同じ画角 で揃えた動画編集が可能.8K オーバーサンプリングによる 高解像な4K UHD/60p,8K を超えるオーバー8K /60pを含 む12bit RAW 動画にも対応.10bitでニコン独自の「N-Log」, HLG (Hybrid Log-Gamma),「N-RAW」収録に対応.さら に,記録フォーマット「ProRes 422 HQ」にも対応し,動画 制作の幅広いニーズに応える.さらに,9種類の被写体検 出は動画撮影にも対応している.



Fig. 4 8K UHD/30p, 4K UHD 動画の内部記録に対応

5 高画質

撮像素子には、有効画素4571万画素、積層型 CMOS セン サーを搭載. 常用感度は ISO 64~25600. 1 段(ISO 32相 当)までの減感、2 段(ISO 102400相当)までの増感、感 度自動制御が可能. 高感度時には、夜空などの平坦な部分 と、ライトアップされた建物などのディテールとで異なる 強度のノイズ処理を行い、細部の高い解像感をそのまま保 ちながら、夜空に発生しがちなざらざらとしたノイズを効 果的に軽減させた.



Fig. 5 積層型ニコン FX フォーマット CMOS センサー

6 デザイン

撮影で失敗の許されないプロフェッショナルフォトグラ ファーの道具としての使いやすさと高い信頼性を追求した 結果このデザインになった.縦位置グリップ一体にするこ とで横位置・縦位置での快適な操作性,ボディーの強度, 剛性の向上を図り高い信頼性を確保している.プロが使用 しやすいよう.カスタム設定が可能なボタン類も多く配置 した.一日に多くの撮影をするプロユーザーに対し, 階層 が深いメニューは何度もボタンを押すことで疲労を蓄積さ せる. そんなときダイレクト操作できるボタンが多いほど 撮影負荷を軽減させることができる. このようなニーズを 満たしながら, D6と比較して体積で約20%の小型化を実現 した.



Fig. 6 D6と比較して体積で約20%の小型化を実現

操作性と信頼性

操作性は、画像モニターにニコン初となる縦横4軸チル トを搭載し、縦位置、横位置問わずハイアングルおよび ローアングル撮影の高い操作性を実現. 縦位置撮影時には 静止画ライブビューのユーザーインターフェースが縦表示 へ自動で切り替わるため、表示確認や操作が容易.メ ニュー設定や画像確認に必要なボタンはイルミネーション で明確に視認できるため、暗所でも昼間同様にスムーズな 操作が可能. 信頼性は、高速スキャンレートにより、ロー リングシャッターゆがみを抑え、メカシャッターレスを実 現. そのため耐久性や故障のリスクを気にすることなく大 量の写真を躊躇なく撮影可能でシャッター幕の摩耗による ダストの発生もない. イメージセンサー前の光学フィル ターにダブルコートを採用し、導電コートでダストの付着 を軽減するとともに、フッ素コートで付着したダストの拭 き取りを容易にしている. さらに、センサーシールドを搭 載しカメラの電源 OFF 時にセンサーシールドを閉じること を可能とし、レンズ交換時にもダストが付着しにくく、指 も触れにくくなっている.上カバー,前面,背面カバーに マグネシウム合金を採用しD6同等のニコン最高クラスの優 れた堅牢性,高い防塵・防滴性能,構成部品を見直すこと でマイナス10℃でも動作する耐寒性能を実現している.



Fig. 7.1 アングルの自由度が高い,ニコン初の縦横4軸チル ト式画像モニター



Fig. 7.2 マグネシウム合金採用ボディー

8 まとめ

ニコンZ9はフラッグシップミラーレスカメラとして静 止画,動画を問わずニコンが今持てる技術をすべて盛り込 んだカメラになっており,時や場所を選ばずあらゆるシー ンでカメラに最高のパフォーマンスを求めるプロフェッショ ナルフォトグラファーにとって最高の一台になっている.

すでに多くのユーザーに使って頂き「今まで撮れなかっ たものが撮れるようになった」など多くの意見を頂いてい る. 今後も現状に満足せずユーザーの期待に応え,期待を 超える製品を作り続けたいと考えている. 尾崎浩二 Koji OZAKI 映像事業部 開発統括部 設計部 Designing Department Development Sector Imaging Business Unit 斉藤義久 Yoshihisa SAITO 映像事業部 開発統括部 設計部 Designing Department Development Sector Imaging Business Unit

光加工機 Lasermeister 1000SE/1000S の開発

Development of the Lasermeister1000SE/1000S Optical Processing Machine

Shigeki EGAMI

光加工機はニコンの半導体露光装置の技術を応用して開発された加工機であり、2021年9月に初の光除去加工機であ る「Lasermeister1000S」をリリースした。Lasermeister1000Sの座標系は高精度・広範囲に管理されており、加工デー タを忠実に再現することができる。光源には超短パルスレーザーを採用しており、あらゆる材料に対して非熱のレーザー アブレーション加工を実現できる。さらに、機上には3D光計測機を搭載しているため、計測結果を精確にフィードバッ ク加工することが可能である。加工パスは CAD データ、加工パラメーター、対象物の3D 計測結果から自動生成される ため、作業者のスキルに依存せずにサブマイクロメートルの高精度加工も実現できる。本稿では、これらの Lasermeister1000S の開発要素と、アプリケーションとして考えているきさげ、精密金型、セラミックス材料の加工事 例を解説する。

An optical processing machine has been developed by applying Nikon's semiconductor lithography technology. The first optical subtractive processing machine, "Lasermeister1000S," was released in September 2021. The coordinate system of the Lasermeister1000S is adjustable with high accuracy over a wide range. Therefore, model data can be accurately reproduced with high fidelity in processing. An ultra-short pulse laser is used as the light source, with which non-thermal laser ablation processing can be applied to almost all materials. Furthermore, because a high-precision three-dimensional (3D) optical measuring device is mounted on-machine, accurate feedback of the measurement results to the laser processing for improved process quality is realized. The machining path is automatically generated from computer-aided design (CAD) data, processing parameters, and 3D measurement results of the object; hence, sub-micrometer processing accuracy can be achieved without relying on the operator's skill. In this paper, the development of the aforementioned elements is explained and processing examples with scraping, precision molding and processing on ceramic material are discussed, which are areas of application for this optical processing machine.

Key words 光加工機, 超短パルスレーザー, レーザーアブレーション, 機上3D 計測 optical processing machine, ultra-short pulse laser, laser ablation, on-machine 3D measurement

1 はじめに

光加工機は、ニコンが長年にわたり蓄積してきた半導体 露光装置の技術を応用して開発され、2019年4月に金属3D プリンタである「Lasermeister100A」を初リリースした. コンパクトかつ低コストで高精度の金属積層造形を実現で きるこの光加工機は市場のニーズをさらに取り込み、2020 年には5軸化、2021年にはチタン合金対応など機能を強化 したモデルもリリースした.

ニコンの光加工機はこの金属3Dプリンタである"+(プ ラス)"の積層造形加工に留まらず、"-(マイナス)"の除 去加工の製品開発も進めてきた.この加工機は機上の光計 測機による精密3D計測と超短パルスレーザーによる非 熱・非接触加工を繰り返して、高精度な面形状加工を実現 することが可能である.この高精度面形状加工機は、 「Lasermeister1000SE」「Lasermeister1000S」(以降,総称してLasermeister1000Sと呼ぶ)として2021年9月にリ リースした (Fig. 1).





2 Lasermeister1000Sのコンセプト

Lasermeister1000Sは、"Remake manufacturing (モノづ くりを、つくり変える)"をコンセプトとした高精度な面形 状加工や微細加工を実現する新しい加工機である.この加 工機は、従来の加工機で常識だった CAM (Computer-Aided Manufacturing)・条件出し・チャッキング・基準面出し等 の段取りを省略もしくは自動化することができ、刃物工具 の摩耗や加工対象物の材料・形状・剛性等の制約で難し かった加工をマイクロ〜サブマイクロメートルの精度でス キル不要に実現することが可能となる.

各製品モデルのうち、「Lasermeister1000SE」は、超短パ ルスレーザーと機上の非接触3D光計測を用いた加工・計測 システムを搭載し、高精度な除去加工を実現するエントリー モデルである.この基本性能に加え、「Lasermeister1000S」 はより高精度な位置決め機構や座標補正システムを搭載し、 広範囲に精確な面形状仕上げや微細加工ができるスタン ダードモデルとなる.本稿ではこのLasermeister1000Sの 特長やアプリケーションを解説する.

3 Lasermeister1000Sの特長

Lasermeister1000Sの特長について、その開発要素を含め て以下に紹介する.

3.1. 高精度・広範囲に管理されたグローバル座標

CAD (Computer-Aided Design) で設計したデータを忠 実に加工で再現するためには,加工機は正確な座標系を構 築・管理しなければならない (Fig. 2).汎用加工機の座標 系は,作業者のスキルや段取りによって必ずしも正確な座 標系を広範囲に構築できないが,Lasermeister1000Sの座標 系はニコンの半導体露光装置で培った高度な補正システム (傾斜・スケーリング・直交度等)を適用しており,作業者 のスキルに依らず,正確なグローバル座標系を構築するこ とができる (Fig. 3).従来の高精度加工機は,環境温度変 動によって生じるドリフトを抑制するために,多くの労力



Fig. 2 座標系が及ぼす加工への影響イメージ



Fig. 3 Lasermeister1000Sのグローバル座標系

を割く必要があったが、本加工機はこの高度に補正された 座標系を逐次補正して、管理することも可能である.また、 光によって非接触に計測・加工できる本加工機は、エアベ アリングと相性が良く、ステージにこの技術を採用してい る.高い平面度で仕上げられた定盤に対して、ステージに 備え付けられたエアベアリングが滑走することにより、駆 動軸によるガタつきを生じさせることなく、ストローク全 域で高い走り再現性を確保できる.

3.2. 超短パルスレーザーアブレーションによる幅広い形 状・材料への加工

レーザーアブレーションは、対象物の表面に高強度のパ ルスレーザーを照射することで表面の物質が爆発的に飛 散・蒸発する現象である、熱伝導にかかる時間より短いパ ルス幅の超短パルスレーザー(フェムト秒〜数ピコ秒)を 用いたアブレーション加工は、レーザーのエネルギーを熱 に変化させることなく材料を除去することができるため、 CW レーザーやナノ秒レーザーの加工に比べ、加工対象物 の熱変形や HAZ (Heat Affected Zone)を生じさせずに加 工できる (Fig. 4). また、レーザー加工は非接触で反力ほ ぼゼロでの加工ができることから、チャックレスで加工で き、薄板の母材や低剛性部品において、従来加工機で問題



Fig. 4 レーザーパルス幅による加工の違い:(a) CW/ナノ 秒レーザーによる熱加工,(b) フェムト秒/ピコ秒 レーザーによる非熱加工

となっているチャッキングや加工力による変形を起こさず に高精度な加工を実現することができる.

超短パルスレーザーによるアブレーション加工のメリッ トとして,加工する材料の制約が少ないことも挙げられる. 超短パルスレーザーは極めて短いパルスで生じる非線形な 光子挙動により,光子エネルギーより大きいバンドギャッ プを持つ材料(光を吸収しない材料)に対しても加工でき る特徴がある.Lasermeister1000Sで採用している超短パル スレーザーは,一般的な金属はもちろん,超硬・ダイヤモ ンド等の硬くて加工が難しい材料や,セラミックスや光学 ガラスといった破損しやすい脆性材料等,幅広い材料への 加工が可能である(Table 1).

このように超短パルスレーザーを用いたレーザーアブ レーションは被加工品への影響を最小限に抑制し,幅広い 形状や材料への加工を実現できる.

汎用金属	高反射材	難削金属材	セラミックス・ 焼結材・半導体	その他	
オーステナイト系ステンレス SUS303, SUS304 マルテンサイト系ステンレス	銅 C1100P	ニッケル基合金 Ni 基合金	ケイ素 Si		
SUS420, SUS440C フェライト系ステンレス SUS430		タングステン	窒化ケイ素 Si ₃ N ₄	ガラス	
炭素鋼 S50C クロムモリブデン鋼	金 Au	W	炭化ケイ素 SiC	石英, BK7	
SCM440 亜鉛 Zn		ダイス鋼 SKD11	窒化アルミニウム AIN		
真鍮(Cu-Zn) C2801P	プラチナ Pt	工力ン人公	アルミナ A1:02 96%		
クロム銅(Cu-Cr) Z3234 2種 アルミニウム合金(AI-Mg)		チタン合金 TAP6400H	ジルコニア	ダイヤモンド	
A5052P アルミニウム合金 (AI-Zn-Cu)	アルミ ニウム AI	純チタン	ZrO ₂	単結晶ダイヤ モンド, PCD	
A7075P		TP340H	超硬合金 WC		

Table 1 Lasermeister1000S で加工できる材料

加工精度や安全対応は材料によって異なる。上記以外の材料の加工も可能。

3.3. 機上3D 計測によるオンマシンフィードバック加工

Lasermeister1000Sに搭載されている機上3D 計測は光干渉 技術を用いた計測であり,高精度かつ高スループットな3D 計測を可能とする.この機上3D 計測で加工対象物の面形状 を高精度に計測することで,加工目標形状に対する加工量 を精確にフィードバックすることができる.この高精度計 測による加工へのフィードバックを機内で繰り返すことで, 容易に所望の高精度面を得ることが可能となる (Fig. 5).

オンマシンフィードバック加工を用いた共通平面出し加 工(複数箇所の平面度を均一にする加工)の実施例を Fig. 6 に示す. 母材は SUS304の薄板(80 mm×75 mm×1 mm 厚)で, この4 隅に 10 mm×10 mmの共通平面出し加工を 行った. この SUS の薄板は母材の状態で約 100 um のうね



Fig. 5 機上3D 計測によるオンマシンフィードバック加工

りを持っていたが、加工した領域はカラーコンター図から もわかるように幾何公差サブマイクロメートルの極めて高 い共通平面度(0.4 um)で加工ができていることがわかる. このような薄板の超高精度加工を研削盤で実現するのは非 常に困難であるが、Lasermeister1000Sはこれをチャックレ スかつスキル不要で容易に実現することが可能である.



Fig. 6 SUS304薄板の共通平面出し加工:(a)加工前後の加 工対象物の写真と高さの斜めコンター図,(b)加工後 の平面コンター図;共通平面度 0.4 um を達成

3.4. オンマシン CAM・3D アライメントによる加工データ の自動生成

既存のNC工作機械は、CADで作製した設計モデルを元 にCAMで加工プログラムを作成する必要がある. CAM は 工程の作業効率を上げ、複雑な加工形状にも対応でき、加 エシミュレーションもしやすいが、その反面、プログラミ ングに専門知識が求められ、作業者のスキルによって作成 にかかる時間やデータの質がばらついてしまう.

Lasermeister1000S は装置のソフトウェアに CAM 相当の 機能(オンマシン CAM)を組み込んでいる(Fig. 7).装置 にインプットするのは、母材と加工目標の3D モデル、加 工・計測パラメーターのみである。加工領域や加工パスは これらのモデルデータやパラメーターと機上3D 計測結果か ら自動生成されるため、作業者の専門知識が不要となり、 プログラムの作成時間も短縮できて、データの質が安定す る.

加工対象物の位置決めを自動で実施する "3D アライメン ト"による段取りレス化も Lasermeister1000S の特長の一 つとして挙げられる.従来の加工機は,作業者が母材を治



Fig. 7 Lasermeister1000Sの加工フロー

具で固定し、スタイラスを複数ポイント接触させて位置計 測を実施するが、非常に煩雑な作業である. Lasermeister1000S はオンマシン計測が可能であるため、このような 作業を自動で実施することができる.

3D アライメントのプロセスを Fig. 8 に示す.まず.母材 をテーブルの任意の位置に設置する. Lasermeister1000Sに は光切断方式による広域3Dスキャナと光干渉方式による ファイン3Dスキャナの2種類の3D計測機を搭載しており、 まずは広域3Dスキャナにより短時間で母材の全体像を計測 し. 母材の3D モデルと3D マッチングを行う. このマッチ ング結果より、母材の設置位置や姿勢を自動的にアライメ ントすることができ、コンピューター上の仮想空間に現実 の母材の位置や姿勢を再現できる。ただし、広域3Dスキャ ナでの3D アライメントは数 100 um の誤差を持っているた め、より精度の高いアライメントが必要となる場合は、 ファイン3Dスキャナによるアライメントを実施する.広域 3Dスキャナの結果に基づき、ファイン3Dスキャナで母材 の複数領域のエッジ位置や高さを精確に計測することで, 加工空間の母材のモデル位置と姿勢をマイクロメートルの オーダーでファインに位置出しすることが可能となる.こ の母材の設置位置や姿勢をもとに加工目標の3Dモデルを仮 想空間に配置し、入力した加工パラメーターで加工を精確 に実施することが可能となる.



Fig. 8 3D アライメントのプロセス: (a) 広域3D スキャナによる母材計測,(b) 仮想空間への広域3D スキャナ計測結果の配置,(c) 母材の3D モデルと計測結果の3D マッチング,(d) 3D マッチング結果,(e) ファイン3D スキャナで母材の複数領域のエッジ位置や高さを計測(f) ファイン3D スキャナ計測結果に基づく母材原点のファイン位置出し,(g) ファイン位置出し結果,(h) 仮想空間への加工目標の3D モデルの配置

4 アプリケーション

これらの技術が統合された Lasermeister1000S は様々な アプリケーションに対して,幾何公差マイクロ〜サブマイ クロメートルの高付加価値加工を容易に実現することがで きる.アプリケーションの例としては,精密金型・精密平 面・刃物工具・砥石・低剛性部品・難削材加工(セラミッ クス・ダイヤモンド・超硬・光学ガラス等)・微細加工と多 岐に渡るが,ここではその一部の事例を紹介する.

4.1. きさげの再現加工

きさげは研削盤を代表とする工作機械の摺動部や基準面 となる土台に用いられ,工作機械には欠くことができない 重要技術である.従来の加工機では実現できない超平面仕 上げであるきさげ加工は,高精度な平面かつ,面と面が滑 らかに動くように数ミクロンの油だまりを職人が手感で作 り出す伝統的な加工技法を未だに必要とする. このきさげ をデジタルに再現した加工を Fig.9 に示す.

母材にはねずみ鋳鉄(FC300)を用意し,母材の中央60 mm×60 mm に職人が加工したきさげを再現加工した(加 工時間:35分). Fig.9(a)-(c)には加工後の写真,高さコ ンター図とプロファイルをそれぞれ示している. Fig.9(c) のプロファイル結果からわかるように,加工後形状は目標 形状に対してサブマイクロメートルで忠実に再現できてお り,習熟に10年以上必要とされるきさげ加工の自動化を実 現できた. 摺動性評価も別ケースで実施しており,きさげ 職人が作ったきさげと遜色ないデータも得られている. ま た,油だまりのパターンを任意な形状かつ,規則的に並べ ることも容易となり,作業者ごとの質のばらつきをなくす ことができる. このように,本加工機がきさげのデジタル マニュファクチャリングを実現する強力なツールであるこ とを実証できた.



Fig. 9 きさげの再現加工: (a) 加工したきさげの写真, (b) 加工目標と加工後形状の高さのコンター図と (c) そ れぞれの形状プロファイル

4.2. 燃料電池セパレーターの金型加工

燃料電池のセパレーターはプレス成形で作製されるが, その金型材料としてダイス鋼・高速度工具鋼・超硬合金等 の硬さと耐摩耗性が優れた材料が用いられるため,従来の 加工機で高精度加工を実現するのは非常に困難である.加 えて,セパレーター金型の加工形状は複雑で加工難易度も 高い. セパレーターにはガスが流れる流路があるが, ガス 拡散を促進させるために異形状な流路を作製することがあ り,スタックして用いることから高い平面度も求められる. このセパレーター金型をイメージしたモデルの加工事例を Fig. 10 に示す.

本加工の母材にはダイス鋼である PD613 (大同特殊製鋼) を用いた.加工目標の3D モデルの流路には,絞りやテー パーを取り入れ,自由度の高い構造をこの金型材料に対し て加工した(加工時間:3.3時間).流路には45度のテー パーが設けられており,それを精密に再現できていること が加工結果からわかる.加工後形状と加工目標形状との差 分の平均値は1.3 um と非常に高い精度で面形状を加工で きており,表面粗さは最深部で Ra 0.15 um であった.超 硬合金においても同様な加工が実施できることを別事例で 確認しており,精密金型のアプリケーションの一つである 燃料電池用セパレーター金型の加工を実証することができ た.



Fig. 10 燃料電池のセパレーター金型をイメージしたモデル の加工事例:(a)加工目標の3Dモデルと加工後の ワーク,(b)加工後形状の高さコンター図と絞り部 の流路の断面プロファイル

4.3. セラミックス材の微細形状加工

アルミナをはじめとするセラミックス材は, 機械的強度, 耐摩耗性, 電気絶縁性に優れており, シリコンウェハを高 精度に平面把持する静電チャックや真空チャックの構造材 料として用いられる.これらチャック部品の表面にはゴミ 挟みを抑制するために直径数 100 um かつ高さ数 10 um の 何万本もの微細ピン形状が形成されているが, 生産性が求 められる部品であり、短時間で加工しなければならない. 通常このピン形成にはブラスト加工が用いられる.ブラス ト加工は表面研削、梨地加工、表面改質を工作機械のツー ルが届かない箇所でも処理することができるが、マスキン グやマスク剥離工程の段取りが煩雑かつ自動化も難しく、 加工形状の自由度も工程が複雑で制約も多い.そこで、 Lasermeister1000Sによるセラミックス加工の事例を紹介す る.

Fig. 11 はアルミナ基板に溝加工,共通平面出し加工,微 細ピン加工を実施した結果である. 溝加工はエアベアリン グや静電チャックのガス流路用の溝を想定した加工である. 各溝において目標加工深さ 20 um を ± 1 um 以下の加工精 度で実現できていることがわかる (Fig. 11 (b)). 共通平面 出し加工はSUSの加工事例と同様に平面度0.4umをアルミ ナに対しても実現することができた (Fig. 11 (c)). ピン加 工は静電チャックや真空チャックをイメージし, 直径 250 um と 500 um のモデルで加工を実施した. 直径 250 um の ピン加工の高さは 22.0±0.9 um とこちらもピン毎のバラ つきを抑制した加工が実現できている (Fig. 11 (d)). チャック部品の加工精度はウェハの平面把持時の歪みだけ ではなく、ウェハの温度を一定に保つための温度制御性に も影響を与えるため、ピンの高さや溝深さは均一に加工す ることが要求されるが、Lasermeister1000Sではマイクロ~ サブマイクロメートルでこれらを制御可能であることを実 証できた.



Fig. TT アルミナ基板への限細形状加工 (a) 限細形状を加工 したアルミナ基板の写真, (b)-(d) それぞれ溝加工, 共通平面加工, 微細ピン加工の断面プロファイル

5 まとめ

Lasermeister1000Sは、モノづくりの現場で行われる様々 な設計を抜本的に変え、"今まで常識だった工程"の無駄を 削減し、"今まで不可能だった加工"を実現させる新しい加 工機である。多種多様な機械部品のひとつひとつを光で簡 単に加工できるようになることは、モノづくりに革命をも たらす。我々はこれを実現すべく、今後、自動加工条件出 し・加工ムラ補正等の加工支援ツールの導入や5軸ステー ジ・レーザーリメルト等の要素開発を進め、ユーザーに とってさらに価値ある光加工機を提供していきたいと考え ている。

江上茂樹 Shigeki EGAMI 次世代プロジェクト本部 第一開発部 1st Development Department Next Generation Project Division



江上茂樹 Shigeki EGAMI

LiB 検査市場に貢献するニコンの X-Ray CT 技術

坂口直史, David Bate, Jan De Geeter, Jos Jans, Ben Morgan

Nikon's X-Ray CT Technology that Contributes to the LiB Inspection Market

Naoshi SAKAGUCHI, David BATE, Jan DE GEETER, Jos JANS and Ben MORGAN

電気自動車の急速な普及に伴い、バッテリーセルの適切な検査は、バッテリーセルの長期的な性能と安全性を保証す るために重要な要素となる.

本稿では、この市場ニーズに応えるニコンの新しい XT H 225 ST 2x X 線コンピューター断層撮影(CT)システムと、システムに搭載する新機能を紹介する.

最初に,X線の生成とイメージングの原理,および従来のCT取得と再構成の手法について説明する.続いて新機能とアプリケーションの紹介を行う.

改良された Rotating.Target2.0により、従来の静的反射ターゲットと比較して、特定の焦点スポットサイズに対して 3倍の高出力 X 線を得る. 独自の Half.TurnCT 取得および再構成アルゴリズムにより、より高速なスキャンが可能にな り、X.Tend ヘリカル CT は、高解像度でアーチファクトのないデータを提供する. Auto.FilamentControl はフィラ メントの寿命を 2 倍にする. これらすべての新しい2x の機能は、生産環境でのエンドオブラインテストおよびプロセス 制御に X 線 CT を使用するための重要な要件である高速で高品質の CT スキャンを可能にする.

最後に産業用アプリケーションの実例として、リチウムイオン電池セルの高速検査のための XT H 225ST2x システムの使用例について紹介する.

With the rapid adoption of Electrical Vehicles, proper inspection of battery cells is critical to guarantee their long term performance and safety. This paper introduces Nikon's new XT H 225 ST 2x X-ray Computed Tomography (CT) system as well as the new features that come with the system to meet this market need. First the principles of X-ray generation and imaging are explained as well as the traditional CT acquisition and reconstruction techniques. Next, we will introduce new features and applications. The improved Rotating.Target 2.0 makes it possible have a 3 times higher X-ray flux for a given focal spot size compared to a traditional static reflection target. The unique Half.Turn CT acquisition and reconstruction algorithms enables faster scans while X.Tend helical CT provides high-resolution, artefact free data. Auto. Filament Control doubles the lifetime of the filament. All these new 2x features enable fast and high quality CT scans that are a key requirement for the usage of X-ray CT for end-of-line testing and process control in a production environment. Finally, as an example of such an industrial application, the paper discusses the usage of the XT H 225 ST 2x system for fast inspection of Li-lon battery cells.

Key words X線, コンピュータートモグラフィー, リチウムイオンバッテリー, 検査, 生産 X-ray, Computed Tomography, Lithium-ion battery, inspection, production

1 Introduction

Nikon offers a wide range of industry-leading X-ray and Computed Tomography (CT) systems to do non-destructive inspection of parts as small as MEMS up to large castings and this for a wide range of industries including aerospace, automotive, consumer products, electronics and much more. At the heart of these systems are Nikon's X-ray microfocus sources, ranging from 130 kV through to 450 kV, that Nikon X-Tek Systems in Tring (UK) has been developing and manufacturing in-house since 1986. Unique X-ray source technology such as rotating target, integrated generator and the worlds-only 450 kV microfocus source allow superior image quality across the entire range of systems.

In the early days, X-ray CT was mainly used in Research & Development (R&D) and Failure Analysis. More recently, production quality control teams have seen the benefit of using CT to shorten production set-up time by doing detailed first article inspection and to improve process control by doing systematic end-of-line inspection. In both cases, a single CT scan enables inspection of internal and external dimensions and reveals defects and assembly issues, all in a non-destructive way and faster than other technologies. The latest trend is to move CT inspection into the production line to catch issues as early as possible. This trend can certainly be seen in the growing market of Li-Ion battery cells that power hybrid and electrical vehicles. Manufacturing quality in this case is important to guarantee long term battery performance and safety.

In the production line, the challenge is to reduce inspection cycle times as much as possible without compromising on data quality. The remainder of the paper will explain how Nikon has responded to this challenge by further improving source performance and implementing innovative CT scanning techniques and reconstruction algorithms which resulted in the new XT H 225 ST 2x X-ray CT system.

2 Technology Background

2.1. Principle of X-ray Imaging

X-rays are a form of electromagnetic radiation, just like visible light, but compared to many other types of radiation, X-rays are more energetic. An X-ray photon can be hundreds or thousands of times more energetic than a photon of visible light, see Fig. 1.

Wilhelm Roentgen first described X-rays in 1895, an achievement for which he was awarded the very first Nobel Prize in Physics. During World War I, X-rays were already being used for medical purposes.

Most of the X-rays in the universe arise when highly excited atoms decay back to their ground state configuration. For example, if an electron is removed from the inner shell orbitals of an atom — perhaps by a collision with something — then the atom will emit an X-ray photon as it returns to its equilibrium state.

Another common source of X-rays is from a process called "bremsstrahlung", which is German for "braking radiation." X-rays are emitted when a highly energetic beam of charged particles such as electrons is rapidly decelerated — because it runs into a metal target, for example.

In medical and industrial X-ray sources, a beam of energetic electrons is focused onto a target, usually a piece of Tungsten. As the electrons are decelerated, this generates bremsstrahlung X-rays. In addition, the incoming electrons can collide with a Tungsten atom and knock an electron out from its inner orbit. This kind of device actually produces X-rays by both mechanisms simultaneously.

The high energy of the X-rays combined with their inter-

actions with the electron cloud in the atoms means that X-rays can penetrate significant amounts of material; the exact length depends on density and atomic number and broadly falls off as either increases. The X-rays that pass through the material (as well as those scattered) can then be detected. Originally this was done using film but over the years a number of electronic means have become available.

Today the most common type of detector in industrial X-ray is the flat panel detector, that consists of a scintillator material (most often Caesium Iodide (CI) or Gadolinium Oxysulphide (GadOx)) that converts the incident X-rays into light. These scintillators sit on top of a layer of photo diodes which convert the light generated into a 2D image which is read out to a computer.

The key equation in X-ray image formation is the Beer Lambert law which describes how the intensity of the detected X-rays falls off with the thickness of material:

$$I = I_0 e^{-\mu t} \tag{1}$$

The equation (1) is true for a monochromatic beam traversing a uniform material with attenuation coefficient μ , the equation can be extended to polychromatic beams as found in typical microfocus sources and to multiple materials.

Electromagnetic Spectrum



of X-rays within it.

When an image is collected the values of I_0 and I can be measured before and after the sample is introduced. This in turn will allow calculation of the attenuation along that path, this will be important later when we discuss Computed Tomography.

2.2. Features of Microfocus X-ray Sources

There are several different types of X-ray sources. Of most use in industry are the Mini-focus tube (X-ray focal spot size > 100 microns) and the Microfocus tube (focal spot size < 100 microns, typically < 10 micron at best). Within each type there are two competing construction methods: sealed tube in which the source is put under vacuum and then sealed and runs in a sealed state until failure, when it is replaced. Next to this, there is or the open tube, in which the source can be vented to air and the filament or other failed parts replaced, giving it an unlimited lifetime.

The customer will choose the type that best matches their sample and imaging needs.

A typical Microfocus tube will consist of the following elements, see Fig. 2.

- 1) A high voltage receptacle to allow the high voltage (typically around 200 kV) to be delivered
- 2) An electron source, often a heated Tungsten hairpin
- 3) A cathode/anode assembly causing electrons to be extracted from the filament and accelerated
- 4) A drift space with steering coils to make sure the beam passes through the centre of the lens
- 5) An electromagnetic lens to focus the beam
- A metallic target of a suitable material to generate X-rays (typically Tungsten).



Fig. 2 Outline of a microfocus source.

The biggest remaining variation is on the type of target used, there are two axes:

a) Stationary or Rotating

A stationary target is fixed in place; it has the advantage that with no moving parts it can give a stable source. The rotating target allows a much higher power density (electrons per unit area) which leads to a much higher X-ray flux for a given spot size.

b) Reflection or Transmission

A reflection target sends the beam of electrons into a large block of the target material and the X-rays used are those that come back out of the target (i.e. are 'reflected' back), it is easier to cool but allows the electrons to spread in the target so limits the X-ray source size. A transmission target is a thin film where the electrons hit one side and the X-rays are taken off the other side (i.e. they are 'transmitted'). This enables a smaller spot to be achieved but is harder to cool so can only be used at lower powers. 2.3. Introduction to Computed Tomography and Reconstruction Algorithms

By combining 2D radiographs from an object taken from different directions, a 3D representation of the object can be created. The most commonly used Computed Tomography algorithm is Circular FDK CT.

In this mode individual images (call projections) are taken while the object rotates 360 degrees in the X-ray beams, see Fig. 3. By application of the Radon transform to the attenuation found from the images the data can be back projected into the 3D volume of the sample.



Fig. 3 Schematic of CT data acquisition.

It was found that if the attenuation was simply back projected then the resulting image was blurred and so a filtering step was introduced to form Filtered Back Projection, the most commonly used algorithm for this is the FDK algorithm from Feldkamp et al [1].

The FDK algorithm is imperfect and can lead to errors in the final volume Below is a short list of the most common errors:

- Off axis errors the algorithm is only fully correct on the central horizontal slice that passes through the focal spot of the source. As the angle to the object increases there is a loss of information and this introduces off axis errors, usually a blurring or drop in SNR.
- Field of view the algorithm relies on the whole object being contained with the cone subtended by the detector. If parts of the object are outside this cone then errors will occur; usually this introduces a bright ring.
- 3) Beam hardening as the X-ray beam is polychromatic and the Beer Lambert law is monochromatic there is a mismatch. This is made worse as attenuation changes with kV but only the integrated intensity is measured, which leads to a non-linear value of the attenuation. There are extensions of FDK that allow for correction of this effect for single and multiple materials.

3 New XT H 225 ST 2x features

3.1. Introduction of the XT H 225 ST 2x System

The XT H 225 ST 2x standard system is equipped with a 225 kV source with Rotating.Target 2.0 with a focal spot size of 10 μ m < 30 W and a maximum focal spot size of 160 μ m at 450 W. The 8.3 MP flat panel has a pixel size of 150 μ m. Fig. 4 is a system picture.



Fig. 4 Picture of the XT H 225 ST 2x system.

3.2. Improved Rotating.Target 2.0

One ongoing issue with all X-ray CT is that the image quality of the result is directly related to the amount of X-ray flux collected. This means that for a given flux a longer scan will have better image quality than a shorter scan.

In order to improve the quality of short scans the 2x system incorporates a Rotating. Target 2.0. Such a target consists of a rotating disc with a sloped surface and Tungsten coating. As 99% of the power of the electrons hitting the target is converted into heat and only 1% into X-rays, focusing the electron beam on a very small area of the target will melt the target. With the rotating target, this focal spot is not a single spot but a much larger circular area that can be cooled much more efficiently through a combination of water cooling and radiative cooling. This approach allows a much higher electron power density on the target. This can then be used to either have a much higher flux at the same spot size or a much smaller spot size at a given flux. For the 2x the main use is the former, where the X-ray flux can be increased by a factor of about 3x from the static reflection target, this can then shorten the time taken for a given quality by the same factor.

3.3. Auto.Filament Control Doubles the Life of Filaments

High-resolution microfocus X-rays start with electrons emitted from a thin filament that has to be replaced periodically due to wear. Less frequent changing of the filament is desirable, as it means that system availability is higher. Long-life filaments are available but they are thicker, so the high resolution nature of the microfocus X-rays is lost. With the XT H 225 ST 2x, the user no longer has to choose between high-resolution and long-life filaments. Auto.Filament Control intelligently controls the X-ray source to double the lifetime of the filament and increase system availability.

Auto.Filament Control carefully controls the current through the filament to optimize its lifetime. The current through the filament causes the filament to warm up, which allows electrons to be emitted which are then accelerated and focused on the X-ray target to generate X-rays. Increasing the current through the filament will increase the temperature and the amounts of electrons produced, up to a point where this saturates, and further increasing the current will not significantly increase the amounts of electrons emitted This function has the general shape of a logistic function, or S-shaped function. The challenge is to determine at every point in time, and for every combination of desired beam current and energy $(\mu A, kV)$ where this saturation point or "knee" point is. Whilst this needed to be identified by an operator before, this is now fully automated in the XT H 225 ST 2x. After the installation of a new filament, with one click of a button, the system automatically identifies this knee point in the filament demand curve for every combination of beam current and energy (μA , kV), see Fig. 5.



Fig. 5 Identified filament demand map, showing the knee point in the filament demand curve (arbitrary units from high-voltage generator) as a function of desired beam current (μ A) and energy (kV). This graph shows two repeated runs with several days in between, showing that the identified values are stable and repeatable.

Experiments have shown that the map shown in Fig. 5 is stable over time. However, as the filament starts to wear, and other parameters in the source vary slightly, the map becomes slightly offset, but the shape remains the same. Therefore, the XT H 225 ST 2x periodically identifies this offset without further operator intervention, achieving the optimal lifetime of the filament all the way to the end when it will finally break. This way, this new Auto.Filamant Control function has proven to extend the lifetime of filaments by a factor of 2 compared to filaments that are manually tuned.

3.4. X.Tend, Error-Free Helical CT Reconstruction

In the above discussion of FDK one of the errors was that the equations were only accurate on the central plane. Helical CT was devised to address this weakness. There are a number of different helical algorithms but they all work on the same basic principle. By moving the sample vertically as the sample rotates the angles at which the object is seen vary continuously changing the volume of correct slices.

Many helical algorithms work to smear out the errors over the whole volume, however, there are a few algorithms that are exact, one of which is the Katsevich algorithm [2], [3], [4] which Nikon uses for its helical CT reconstruction, this uses a smaller region of the detector during the scan combined with an algorithm to arrive at an accurate reconstruction which does not contain any errors due to the reconstruction process.

Another benefit of helical CT is that for taller samples, the whole part does not need to be in the field-of-view of the flat panel. In practice this means that the part can be brought closer to the source and can be scanned at higher magnification, see Fig. 6.



Fig. 6 Cylindrical battery cell on the left scanned with circular CT at 3 times magnification and scanned on the right hand side with X.Tend helical CT at 15 times magnification.

3.5. Half.Turn CT Doubling the Speed of the Acquisition The new XT H 225 ST 2x system doubles the speed of the acquisition compared to a similar acquisition on the XT H 225 ST, without giving in on data quality. This is achieved by a more sensitive detector, in combination with the new Half. Turn CT acquisition and reconstruction software.

The duration of a CT acquisition is shown as (2)

$$T_a = \frac{\Delta \theta * R_\theta}{F} \tag{2}$$

where T_a is the time of the acquisition in (sec), $\Delta\theta$ is the angular range of the scan (rad), R_{θ} is the desired angular resolution (frames/rad) and *F* is the frame rate of the detector (frames/sec).

 R_{θ} is usually optimized based on the resolution of the detector, such that $\frac{r}{R_{\theta}}$ is more or less equal to the pixel size of the imager, where *r* is the radius of the object begin scanned. Reducing R_{θ} will reduce the resolution of the reconstructed volume, and will increase motion blur, which is undesirable.

F is limited by the maximum frame rate of the detector, and its sensitivity. The Varex XRD4343CT panel is more sensitive than the Varex PE1621EHS used before. Running the XRD4343CT detector at 15 frames per second gives a similar quality image as the PE1621EHS detector at 11 frames per second. Further increasing the frame rate is not possible, as 15 frames per second is the maximum speed of the detector in full frame mode.

Therefore, if we want to double the speed of the acquisition without compromising the resolution while the imager is already at full frame rate, then the only remaining parameter we can play with is $\Delta\theta$, the angular range of the scan. For regular CT scans, $\Delta\theta$ is $2^*\pi$ or a full turn. However, is that really needed? In case we have a system with a parallel X-ray beam, the image at angle θ should contain the exact same information as the image at angle $\theta + \pi$. So, $\Delta\theta = \pi$ should give the same resolution of the reconstructed volume, albeit with a lower signal to noise ratio compared to the full turn scan as we capture only half the number of images.

In case of a cone beam, $\Delta\theta$ needs to be larger than π because of the cone beam opening angle. For every point on the scanned object to be seen by rays in the whole range from 0 to π , the rotate stage needs to turn over an angular range $\Delta\theta = \pi + \alpha$, where α is the cone beam opening angle. Fig. 7 explains this.

This scan over a range $\Delta \theta = \pi + \alpha$ with a cone beam system presents a particular challenge to reconstruction. It is well known that straightforward reconstruction of such an acquisition with standard Filtered Back Projection introduces artefacts. The origin of these artefacts is the "asymmetry" in the dataset caused by the cone beam. As Fig. 7 shows, some parts of the objects are penetrated by more rays than others, and hence more information is available about the parts closer to the source. The new Half.Turn CT reconstruction solves this unfairness, and provides a reconstruction of the



Fig. 7 For every region of the object to be seen by rays in a range of 0 to π , the stage needs to rotate over an angle of π + cone beam angle α . (A) Consider regions at opposite ends of the sample. The beam passes through these at an angle. (B) After 90° of rotation, the blue feature receives a wider angular coverage for the same rotation. The red feature on the opposite end receives less coverage. (C). After 180° of rotation, the blue feature has over 180° of coverage, and therefore has more than enough projection data to allow reconstruction. The red feature, however, has insufficient coverage. It will be missing detail at angles which have not been covered. (D) We must therefore rotate further to cover this missing angle. This additional angle is equal to the cone beam angle.

same quality as a full turn CT, without adding noticeable computation time. Fig. 8 shows that the quality of the new Half.Turn CT reconstruction is comparable to that of a standard FDK reconstruction of a full turn scan of the same opbject, while needing only about half of the images.

Fig. 9 compares the acquisition time of 2 CT acquisitions that produce equivalent data quality, one full turn scan on the XT H 225 ST, and one Half.Turn CT scan on the new XT H 225 2x system. The doubling of the speed is achieved through a combination of a more sensitive detector, allowing it to run at full frame rate of 15 frames per second, and the new Half.Turn CT reconstruction providing a reconstruction quality that is similar to that of the full turn scan.



Fig. 8 Comparison between a Half.Turn CT acquisition reconstructed with standard FDK (left), the same acquisition reconstructed with the new Half.Turn CT reconstruction (middle), and a full turn CT acquisition reconstructed with standard FDK (right). The left figure clearly shows artefacts, while the quality of the Half.Turn CT reconstruction (middle) is comparable to that of a standard FDK reconstruction of a full turn scan (right).

4 2x improvements applied to Li-Ion battery cell inspection

For Li-Ion batteries, defects like inclusion of foreign particles, electrode delamination and incorrect anode overhang can be disastrous for their long-term performance and safe

	XT H 225 ST	XT H 225 ST & Half.Turn CT
Detector panel	PE1621EHS	XRD4343CT
Beam energy	165kV	180kV
Beam current	236μΑ	222µA
Power	39W	40W
Exposure time	88ms	67ms
Projections per full turn	3141	3800
Number of projections	3141	2126
Acquisition time	4m52s	2m26s

Fig. 9 Comparison of the acquisition time between a full turn CT acquisition on a XT H 225 ST, and a Half.Turn CT scan on the new XT H 225 ST 2x system. Acquisition speed is exactly doubled by the use of a more sensitive detector, combined with the new Half.Turn CT reconstruction.

operation. That's why it is important to catch these issues at the end of the line or even better, during the assembly process. As this is high volume production, cycle time is key without compromising on image quality.

The examples below show how the combination of Rotating.Target 2.0, the latest flat panel technology and Half.Turn CT allows users to drastically reduce scan time. See Fig. 10–14.



Fig. 10 Comparison of image quality of battery anode overhang using Rotating. Target 2.0 and ever shorter scan times.

Fig. 10 is a CT image of the anode overhang of the electrode stack of a Li-Ion battery cell, demonstrating the change of image quality when the scan time is shortened by using a Rotating.Target 2.0. The image on the left was acquired using a standard static reflection target; for the center image a Rotating.Target 2.0 was used and the scan time was reduced with a factor 3, while for the image on the right the scan time was further reduced with a factor 12. Even in the last case where the scan time is 36 times shorter than the original scan time, the image maintains sufficient resolution for proper overhang analysis.



Fig. 11 Comparison of image quality using traditional circular CT versus Half.Turn CT.

Fig. 11 is a comparison of the image acquired in 90 seconds using traditional circular CT and the image acquired in 45 seconds using Half.Turn CT. In the last case, almost equivalent image quality is obtained in half of the time needed to scan the battery cell.



Fig. 12 Delamination and deformation of battery electrodes are clearly visible in a 15 seconds scan.

During the winding or stacking process of the anode, separator and cathode and during the further assembly process of the battery cell, delamination or deformation of the electrodes can happen. Fig. 12 is a CT image showing electrode delamination and deformation inside such a Li-Ion battery cell. The data set is acquired in just 15 seconds using Rotating Target 2.0 and Half.Turn CT.

Fig. 13 shows a CT image that captures the crack in a battery electrode. Cracks are a critical internal defect that can be introduced during the slitting process. A normal CT scan takes 45 seconds to acquire, but Nikon has made it possible to acquire it in just 15 seconds with Rotating.Target 2.0 and



Fig. 13 Visualisation of an electrode crack in a 15 second CT scan.

Half.Turn CT. Almost equivalent image quality is obtained with a 3 times shorter scan.



Fig. 14 Visualisation of foreign particle in a Li-Ion battery cell.

During the whole process from winding or stacking of electrodes up to the sealing of the battery cell, foreign particles can be catched inside the cell. Also the welds that connect the anode and cathode to the external battery terminal can include voids that result in bad electrical conductivity.

On Fig. 14 some foreign particles can be clearly seen on the CT image that was acquired in only15 seconds using Rotating.Target 2.0 and Half.Turn CT.

5 Conclusion

In this paper the new and improved features of Nikon's latest XT H 225 ST 2x industrial CT system were explained. These include Auto.Filament Control, that doubles filament lifetime, Half.Turn CT and X.Tend helical acquisition and reconstruction algorithms and the improved 225 kV Rotating.Target 2.0 X-ray source. It was shown how these features increase the scan speed of the system while maintaining or improving the image quality.

Fast scans and reliable analysis are a key requirement to enable the usage of X-ray CT for end-of-line testing and process control in a production environment. As an example of such an industrial application, the paper discusses the usage of the XT H 225 ST 2x system for fast inspection of Li-Ion battery cells. The results show that critical defects like incorrect anode overhang, electrode delamination and foreign particle inclusions can be detected in scans that take no more than 15 seconds.

This makes Nikon's X-ray CT system with its unique X-ray source and software technology, particularly suited for the inspection of Li-Ion battery cells, of which production volumes are increasing rapidly with the growing demand for Electric Vehicles. Also the mass production of other components like Plastic Injection Moulded connectors and small castings, that are widely used in Electrical Vehicles, will benefit from these advances in X-ray CT inspection.

References

[1] Feldkamp, L.A, David. L.C, Kress, J.W., "Practical cone

beam algorithm," Journal of the Optical Society of America A, vol. 1, no. 6, p. 612-619, 1984.

- [2] A. Katsevich, "Exact Filtered Back Projection (FBP) algorithm for spiral Computer Tomography," US Patent 6,574,299, Jun. 3, 2003.
- [3] A. Katsevich, "Theoretically exact Filtered Back Projectiontype inversion algorithm for spiral cone-beam," SIAM J. Appl. Math., vol. 62, no. 6, p. 2012-2026, 2002.
- [4] A. Katsevich, "An improved exact Filtered Back Projection algorithm for spiral Computed Tomography," Adv. Appl. Math., vol. 32, no. 4, p. 681-697, 2004.

坂口直史 Naoshi SAKAGUCHI 産業機器事業部 マーケティング部 **Global Marketing Department** Industrial Metrology Business Unit

David BATE Nikon X-TEK Systems Ltd

Jan DE GEETER Nikon Metrology NV





坂口直史 Naoshi SAKAGUCHI

David BATE





Jos JANS

Jos JANS

Nikon Metrology NV

Nikon Metrology NV

Ben MORGAN



Ben MORGAN

顕微鏡対物レンズ CFI Plan Apochromat λD シリーズの開発

高木英嗣

Development of the CFI Plan Apochromat Lambda D Series Objectives for Biological Microscopes

Hidetsugu TAKAGI

プランアポクロマートλDシリーズを2021年12月に発売した.世界最高レベルのNAとWDを有し,視野全域における優れた光学性能を誇り,広波長帯域の色収差補正がなされたプランアポクロマート対物レンズシリーズである.ニコンの顕微鏡対物レンズの最高峰に位置するプランアポクロマート対物レンズシリーズには,これまでλシリーズとVCシリーズがあった.本論文ではλシリーズとVCシリーズの長所を継承したλDシリーズの光学設計技術と製造技術について紹介する.

顕微鏡システムにおいて最も重要な心臓部と言われる顕微鏡対物レンズの重要事項の1つに光学硝材選択がある.特に,広波長帯域の色収差補正を実現するには,最適な光学硝材を選択する必要がある.ここでは2枚の薄肉単レンズの 色消しから出発し,3枚の薄肉単レンズの色消しについて説明する.更に共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡における色 収差の影響を解説し,観察画像を比較する.

ニコンの誇る波面収差計測技術と最適化技術から生まれた波面収差最適化システムについて説明する.この波面収差 最適化システムのシミュレーション結果を報告する.

In December 2021, we launched seven models of CFI Plan Apochromat Lambda D Series objectives for biological microscopes. The Plan Apochromat objective lens series provides the world's highest levels of Numerical Aperture and Working Distance, excellent optical performance over the entire field of view, and chromatic aberration correction across a wide wavelength range.

To date, the Plan Apochromat objective lens series, which is the highest spec of Nikon's microscope objective lenses, comprised the λ and VC series. Herein, we introduce the optical design and manufacturing technologies of the λ D series, which has the advantages of both λ and VC series.

We begin with the achromatism of two thin lenses, explain that of three thin lenses and the influences of chromatic aberration in a confocal laser scanning fluorescence microscope, and finally show the actual images.

Furthermore, we explain the wavefront aberration optimization system developed using Nikon's wavefront aberration measurement and optimization technologies. Finally, we report the simulation results of this wavefront aberration optimization system.

Key words 対物レンズ,解像限界,顕微鏡 objective lens, resolution limit, microscopy

はじめに

近年,光学顕微鏡システムは目覚ましい進歩を遂げている.しかし,E.Abbeの時代から現代においても,光学顕微鏡に置いて解像力を決定づける心臓部は,顕微鏡対物レンズであることに変わりはない.

本論文では、2021年12月に発売した CFI Plan Apochromat *λ*D シリーズについて紹介する (Fig. 1).

2 開発背景

ニコンの顕微鏡対物レンズの最高峰に位置するプランア ポクロマート対物レンズシリーズには、これまでλシリー ズ、そして VC シリーズがあった.

λシリーズは、ニコンの顕微鏡システムの最大の特徴で ある広視野と周辺視野での高い収差性能を有し、ナノクリ スタルコートを用いた可視域から近赤外領域までの高い透 過率を実現している.一方、VCシリーズはλシリーズには 無い 405 nm から可視域における軸上色収差性能を有して おり、特に、共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡観察におい て市場から高い評価を頂いていた.

近年, 生物顕微鏡市場において, デジタルイメージング 技術や蛍光色素技術が発展し, 明視野観察から共焦点レー ザー走査型蛍光顕微鏡まで対応した広視野かつ広波長帯域 での観察を可能にする顕微鏡対物レンズが望まれていた. まさしくλシリーズと VC シリーズの長所を継承した顕微 鏡対物レンズが必要とされていた.



Fig. 1 本対物レンズシリーズの図

3 仕様

CFI Plan Apochromat λD シリーズは、世界最高レベルの NAとWDを有し、優れた視野周辺における光学性能を誇 り、広波長帯域の色収差補正がなされたプランアポクロ マート対物レンズシリーズである.

ニコンの全ての顕微鏡観察・システムを支えている.開 発するにあたって、パワー配置を一から見直し、設計から 製造・検査に至るまで新シリーズとして一新した.

下記に、本対物レンズシリーズの仕様を示す(Table 1).

Table 1 CFI Plan Apochromat λD シリーズの仕様

	60x	100x	40x	20x
NA	1.42	1.45	0.95	0.80
WD [mm]	0.15	0.13	0.21*	0.80
色収差	Аро	Аро	Аро	Аро
平坦性	Plan	Plan	Plan	Plan
浸液	油	油	乾燥	乾燥

泛液			汨	が田		乾燥		乾燥	
			10x		4	х		2 x	
	NA		0.4	5	0.	20	0	.10	
	WD [mn	n]	4.0	0	20	.0	8	. 50	
	色収差		Аро)	Aj	00	I	Apo	
	平坦性		Plan		Pl	an	F	Plan	

乾燥

乾燥

乾燥

浸液 * 補正環付き

ム波長帯域における色収差補正

顕微鏡対物レンズの光学設計において,最も重要な項目 の1つが光学硝材選択である.ここでは広波長帯域の軸上 色収差補正を実現するのに必要な3枚の薄肉単レンズに依 る軸上色収差について紹介し,倍率色収差補正の基本概念 について解説する.

はじめに2枚の薄肉単レンズa, bにおける1次の色消し 条件と2次の色消し条件を確認し、3枚の薄肉単レンズへ と拡張する.ここで1次の色消しとは、2波長の焦点位置 が重なることを指し、2次の色消しとは3波長の焦点位置 が重なることを意味する.広波長帯域での色収差補正では 2次の色消しが必須となる.2枚の薄肉単レンズの合成焦 点距離と色消し条件は下記と書ける.

$$\Phi_a + \Phi_b = \Phi \tag{1}$$

$$\frac{\Phi_a}{\nu_a} + \frac{\Phi_b}{\nu_b} = 0 \tag{2}$$

$$P_a \frac{\Phi_a}{\nu_a} + P_b \frac{\Phi_b}{\nu_b} = 0 \tag{3}$$

ここで、 Ф_a, v_a, P_a はそれぞれ薄肉単レンズのパワー、 アッベ数、部分分散比とした.パワーは焦点距離の逆数で ある.2枚の薄肉単レンズで、1次の色消しと2次の色消 しを実現するには、式(4)の条件を満たす光学硝材が必 要になる.上記の色消し条件に限りなく近づけるには、薄 肉単レンズ a, b の光学硝材の恒数値は、アッベ数の差は より大きく、部分分散比の差はより小さくする必要があ る.

$$\frac{(\mathbf{P}_a - \mathbf{P}_b)}{(\mathbf{v}_a - \mathbf{v}_b)} \mathbf{\Phi} \cong \mathbf{0} \tag{4}$$

しかし,光学硝材は実際には離散的に存在し,蛍石など を用いても限りがあり,広波長帯域での軸上色収差補正を 実現することはできない.

その為, 2枚の薄肉単レンズの考え方を3枚の薄肉単レ ンズ a, b, cへと拡張する.

$$\Phi_a + \Phi_b + \Phi_c = \Phi \tag{5}$$

$$\frac{\Phi_a}{v_a} + \frac{\Phi_b}{v_b} + \frac{\Phi_c}{v_c} = 0 \tag{6}$$

$$P_a \frac{\Phi_a}{\nu_a} + P_b \frac{\Phi_b}{\nu_b} + P_c \frac{\Phi_c}{\nu_c} = 0$$
(7)

薄肉単レンズの式をまとめると、下記のように書ける [1]-[3].

$$\Phi_b = \frac{P_c - P_a}{P_b - P_a} \frac{v_b}{T} \Phi \tag{8}$$

$$T = \frac{v_a(P_b - P_c) + v_b(P_c - P_a)}{P_b - P_a} - v_c$$
(9)

Fig. 2 に光学硝材の恒数表を示す. ここでTは光学硝材 恒数表においては、点 c から横軸に平行に点 a と点 b を結 ぶ直線へ伸ばした直線の長さである. 言い換えれば、2 枚 の色消し条件を満たすような光学硝材は現実には得られな いが、二つの光学硝材 a. b を用いることで、仮想的な光学 硝材 d' を作り出していることを表している. 特に着目すべ き点が Φ_b の符合である. Fig. 2 の様な恒数値を有する硝材 を用いる際には、 Φ_b は正のパワーをもつ. 蛍石、クラウン 系光学硝材だけでなく、正の部分分散比を持つフリント系 光学硝材を加えることで、軸上色収差が低減できることを 示している.

実際の光学系では、上記の様な単純な議論だけでは成り 立たず、10数枚の光学硝材を組み合わせて、広波長帯域の 軸上色収差補正を実現している.



次に, 倍率色収差補正について説明する前に, ここで顕 微鏡対物レンズの開発の歴史について触れておきたい. 100 年以上前に, E. Abbe は高倍対物レンズで課題になってい た倍率色収差を補正するために, コンペンセーション方式 を開発した. しかし, コンペンセーション方式は, 接眼レ ンズと対物レンズの組み合わせで倍率色収差を補償してい た為, 接眼レンズの無いカメラ観察時に倍率色収差が発生 するという課題があった. そこで1976年頃にニコンは Chromatic aberration Free (CF) 方式を採用し, 対物レン ズと接眼レンズがそれぞれ単体で収差が補正されている顕 微鏡システムを開発した [4]. 更に, 一般的な観察方法と して広く使われている共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡観 察においては, これまで問題にならなかった倍率色収差に よる視野周辺のシェーディングが課題となった.ここでは, 特に高倍対物レンズにおける倍率色収差補正技術について 紹介する.

高倍対物レンズの主なパワー配置は、Fig.3のように物 体(標本)側から,正のパワーを持つ前群と負のパワーを 持つ後群の順に並んでいる。簡単の為,図には主光線とし て d 線の光線(緑)を示し、短波長側の色収差を表すため にF線の光線(紫)が発生する向きだけを示す.前群は像 面湾曲,軸上色収差,球面収差を補正している.一方で、 後群は光線の通過する光軸からの距離が高い. すなわち, 軸外収差の1つである倍率色収差を補正するのに適したレ ンズ群は後群である. Fig.3 に示すように、正のパワーを 持つ前群と負のパワーを持つ後群はどちらも像面上でプラ スに倍率色収差を発生させる。その為、前群と後群で打ち 消しあうように、後群の光学硝材を正のパワーを持つ高分 散のフリント系光学硝材と負のパワーを持つ低分散のクラ ウン系光学硝材に分ける. Fig.3のようにフリント系光学 硝材はクラウン系光学硝材よりも高分散の為、効率良くF 線を補正することができる.



特に,油浸対物レンズの浸液は水やシリコーン浸液に比 べて,高分散の為,浸液による色収差は軸上色収差だけで なく倍率色収差の発生量も大きく対物レンズで補正しなけ ればならない色収差の量も大きい.前述の正のパワーを持 つフリント系光学硝材には,高分散の光学硝材を用いるこ ともある.この時,倍率色収差の1次スペクトルの補正後 の残渣として,倍率色収差の2次スペクトルが発生する. その為,部分分散比がより低い光学硝材を後群の正レンズ に,部分分散比がより高い光学硝材を負レンズにするのが 望ましい.ニコンは光学硝材の開発から生産まで,グルー プ内で一貫して行っている為,硝材選択の自由度は高く, 軸上色収差はもちろんのこと倍率色収差の2次スペクトル まで補正された光学設計を可能にした.この倍率色収差の もたらす画質への影響と設計の効果については,次の章で 示す.

5 共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡

ここでは共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡における倍率 色収差の2次スペクトルの影響について議論する. 共焦点 レーザー走査型蛍光顕微鏡の配置は次のような構成を考え る(Fig. 4). 光源となるレーザー光源による励起光が対物 レンズを通って蛍光試料を照射し,発せられる蛍光を信号 として対物レンズが検出する.この時,ストークスシフト で励起光の波長と蛍光の波長は数10~数 100 nm 程度異なっ てくる.この波長差におけるわずかな色収差がどのように 画質に影響するかをここでは考える.



Fig. 4 共焦点レーザー走査型顕微鏡の模式図

共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡の励起光学系による点 像強度分布を PSF_{ex}(x), 蛍光光学系における点像強度分布 を PSF_{em}(x) とする. ピンホール形状を表す透過率分布を PH(x) とするとレーザー走査で得られる点像強度分布 I は 以下のようにかける.

I = o(x)*[*PSF*_{ex}(x) · (*PSF*_{em}(x)**PH*(x))] (10)
 ここで o(x) は蛍光試料の密度分布である. *は畳み込み
 積分とする. 依って, 実効的な点像強度分布 *PSF*_{eff}(x) を以
 下のように定義する [5].

$$I = o(x) * PSF_{eff}(x) \tag{11}$$

$$PSF_{eff}(x) = [PSF_{ex}(x) \cdot (PSF_{em}(x) * PH(x))]$$
(12)

ここでは倍率色収差が実効的な点像強度分布 $PSF_{eff}(x)$ に 与える影響を見積もる為、 $PSF_{ex}(x) \ge PSF_{em}(x)$ を色収差以 外は無収差と仮定して計算した. Fig. 5 は、励起光の点像 強度分布 $PSF_{ex}(x) \ge$ 蛍光の点像強度分布 $PSF_{em}(x) \ge$ ピン ホールの透過率分布 PH, そして実効的な点像強度分布 $PSF_{eff}(x)$ である. Fig. 5A は $PSF_{ex}(x) \ge PSF_{em}(x)$ が重なっ た無収差における計算結果である. この時、 $PSF_{ex}(x) \ge$ $PSF_{em}(x) \ge PH(x)$ は最大1になるように規格化して表示し ている.

一方, 倍率色収差が発生した時の計算結果が Fig. 5B で ある. 励起光の点像強度分布 *PSF*_{ex}(x) と蛍光の点像強度分 布 *PSF*_{em}(x) は横にシフトし, 得られる実効的な点像強度分 布 PSF_{eff}(x) の強度は低下する. その結果, 共焦点レーザー 走査型蛍光顕微鏡の画像は, シェーディングとなって表れ る.より直感的には, レーザーで励起された蛍光試料が検 出光学系を通って, ピンホールを抜けて信号を検出するわ けだが, 検出光学系が色収差を持つ場合に信号強度が低下 する.また同程度の明るさを得ようとすると, 光毒性は高 くなり蛍光試料は損傷してしまう.軸上色収差が発生して いる場合は, 光軸方向で類似の振る舞いを示す.



Fig. 5 の計算では、倍率色収差の影響を議論する為に含めなかったが、軸外コマ収差や軸外アス収差が発生すると 実効的な点像強度分布 *PSF*_{eff}(*x*) は低下し、更に *PSF*_{eff}(*x*) の 形状が崩れて解像力が失われる。今回開発した対物レンズ シリーズでは、コマ収差とアス収差を徹底的に排除し、視 野周辺までシェーディングも少なくシャープな画像が得ら れるようにした。

効果を実証する為に,FOV25の広視野共焦点レーザー 走査型蛍光顕微鏡観察における新開発の対物レンズと従来 対物レンズの比較をおこなった.Fig.6にCFI Plan Apochromat λ D 60xのFOV25共焦点レーザー走査型蛍光顕微 鏡の観察画像を示す.対物レンズ以外の観察条件は,全て 同一条件下で行った.従来品は,DAPI染色された細胞核 は軸上色収差の影響で視野中央部でも暗く,視野周辺部に 及ぶと倍率色収差の影響で極端に暗くなっていることが分かる.この視野中央部から視野周辺部にわたるシェーディングの変化は、レーザーパワーを上げても変わらない.一方で、軸上色収差と倍率色収差が補正された CFI Plan Apochromat λD 60x は、視野中央部から視野周辺部まで均一でシャープな画像が得られることが分かる.

CFI Plan Apochromat λD60xOil



CFI Plan Apochromat λD60xOil



Conventional product



Fig. 6 CFI Plan Apochromat λD60xOil と従来対物レンズの 共焦点レーザー走査型顕微鏡 FOV25画像 Hela 細胞: DAPI, 488-Actin, 568-Mitochondria

6 波面収差最適化システム

ここでは顕微鏡対物レンズの製造技術について、紹介す る.顕微鏡対物レンズは無収差に近い光学設計がなされて いるが、実際には製造誤差により収差が発生する.その為、 対物レンズの有する波面収差量を正確に測定する波面収差 測定装置と限りなく設計値へ近づける最適化技術が重要と

なる.

試料から発せられる点光源の集まりを物体として,顕微 鏡は観察している.理想的な点光源から発せられる光は, 顕微鏡対物レンズを通して,平行な平面波へと変換される. 顕微鏡対物レンズが収差を持つ場合,理想的な平面波から わずかに誤差を持つ.このわずかな誤差を波面収差と呼び, 光学系の結像性能の評価に用いられる.特に,Zernike多 項式は単位円上で定義された直交多項式で,光学収差との 相性が良い.ニコンの持つ波面計測技術は,顕微鏡対物レ ンズだけでなく,半導体露光装置やカメラの交換レンズに も使われておりイメージング技術を支える最も重要な技術 の1つである.

仮に、数ミクロン精度の製造公差で各レンズが製造され ていても、光の波長は数 100 nm の為、発生する波面収差 の量としては無視することはできない、その為、組立調整 時に波面収差が最小になるように最適化を行う必要があり、 次のような問題を解くことに相当する。例えば、式(13) のように表現することが出来る.式(13)では、Zernike 多 項式で表現された計測波面収差を z で表し、変数 x はコン ペンセーターの状態を表す.また、敏感度を表す変化マト リックスが H である。各 Zernike 成分がゼロとなるような コンペンセーターの最適解 x を求める必要がある.このよ うな計算は、多くの場合、最小二乗法を用いて最適解を得 ることができる[6].

$$\min_{\mathbf{x}} \left\| \mathbf{H}\mathbf{x} - \mathbf{z} \right\|^2 \tag{13}$$

顕微鏡対物レンズでは、視野全域にわたって高い収差性 能が要求され、広波長帯域の軸上色収差を補正しなければ ならない為,同焦点わずか 60 mm の中に10数枚のレンズが 用いられる、その為、収差成分への敏感度を示すコンペン セーターの変化マトリックス Hの各成分は、ほとんど独立 していない. 例えば、この変化マトリックスの各成分の独 立性が良くない場合、あるコンペンセーターx1を用いて収 差成分z1をコンペンセートすると別の収差成分z2が大きく なってしまう. 現実にはコンペンセーターの可動範囲は有 限で、コンペンセーター自身も誤差を持つ為、式(13)の ような簡単な表現で表すことはできず、より複雑な制約付 き最適化問題となる、すなわち、波面収差計測された1本 1本の対物レンズに対して、複雑な制約付き最適化問題を 解いて最適化しなければならない. 波面収差最適化システ ムが登場する以前までは、顕微鏡対物レンズの作業者は手 探りで調整を行わなければならなかった. とりわけ, 高倍 高 NA 対物レンズは、非常に高い敏感度を持ち、球面収差 や偏芯コマ収差は解像限界まで要求される為、製造は困難 を極めていた.

近年のAI技術が活発になる以前から,ニコンは光学設計 ソフトから自社開発し,光学系の評価計算はもちろんのこ と,最適化分野においても長年にわたって研究開発を続け てきた.我々は、この顕微鏡対物レンズの組立調整時にお ける複雑な制約付き最適化問題を解くために、独自に開発 した最適化エンジンを適用させた.最適化システムのシ ミュレーション結果として、調整する前の対物レンズの波 面収差と波面収差最適化システムで最適化した後の対物レ ンズの波面収差をそれぞれ Fig. 7A と Fig. 7B に示す.無収 差光学系の波面収差は、より平坦な形状となる.すなわち、 光学系は無収差結像に近づいていると言える(Fig. 7B).

この波面収差計測技術と波面収差最適化技術が,1本1 本の顕微鏡対物レンズを光学設計者の設計値に限りなく近 づけている.まさに理想的な顕微鏡対物レンズ製造システ ムといえる.



Fig. 7 波面収差最適化システムのシミュレーション

7 まとめ

CFI Plan Apochromat λD シリーズは、 λ シリーズと VC シリーズを統合し、NA、WD、平坦性、視野数を両立した 顕微鏡対物レンズである.ニコンの顕微鏡システムの最大 の特徴である広視野と周辺視野での高い収差性能を有し、 広波長帯域の色収差補正がなされたニコンの顕微鏡システ ムの心臓部にふさわしい対物レンズシリーズである.

ニコンのもつ光学設計技術と製造技術の粋を集めた本対 物レンズシリーズは、今後、バイオイメージングなどを始 めとした科学・産業技術の発展に貢献していくと考えてい る.

今回,代表する形で筆を取らせていただいた.多くの方 のご尽力の上の開発である.この場を借りて,深く感謝を 申し上げる.

引用文献

- A. E. Conrady, *Applied Optics and Optical design*, Part 1. Dover Publications, 1929.
- [2] H. Gross, H. Zugge, M. Peschka, F. Blechinger, *Handbook of Optical Systems*, Vol. 3. Wiley-VCH, 2007.
- [3] 小穴純, 幾何光学, 新技術コミュニケーションズ, 1986.
- [4] 牛田一雄, "新しい顕微鏡光学系,"光学, vol. 10, no. 5, pp. 22-29, 1981.
- [5] 渋谷眞人,大木裕史,回折と結像の光学,朝倉書店, 2005.
- [6] 高橋友刀, レンズ設計-収差係数から自動設計まで, 東 海大学出版会, 1994.

高木英嗣 Hidetsugu TAKAGI 光学本部 第一設計部 1st Designing Department Optical Engineering Division



高木英嗣 Hidetsugu TAKAGI

AI 画像処理技術を活用したミトコンドリアの 詳細解析

門井宏平,武居俊輔

Detailed Analysis of Mitochondria using Al Image Processing Technology

Kohei KADOI and Shunsuke TAKEI

ミトコンドリアは主要な細胞内小器官の一つであり、エネルギー代謝を司るため基礎研究分野のみならず創薬開発等 の応用分野で幅広く研究されている。ミトコンドリアの研究では、ミトコンドリアを蛍光分子で標識し解析する手法が 主流であり、動態の解析にはタイムラプス撮影が不可欠である。しかし、蛍光観察では蛍光分子の励起を行うことによ り、光毒性によるミトコンドリア活性や形態への影響、蛍光の褪色が生じ得る。また、ミトコンドリアは微細な構造で あるため、定量解析を行う場合には鮮明な画像を用意する必要がある。このため、可能な限り低い励起光強度や短時間 露光の条件で、細胞へのダメージや蛍光褪色を回避し、鮮明な画像を得る技術が求められている。

顕微鏡画像統合ソフトウェア NIS-Elements は artificial intelligence (AI) の一種である深層学習技術を用いた画像 処理機能 (NIS.ai) を搭載している.本稿では、低い励起光強度で取得した不明瞭な画像から明瞭な画像を生成する機能 (Enhance.ai) を用いることで、ミトコンドリア解析における光毒性を回避できる効果を確認した.さらに、焦点面外か ら発せられる蛍光シグナルを除去する機能 (Clarify.ai) もミトコンドリアの定量解析に有用であることを示した.これ らの技術により、従来よりも正確かつ詳細なミトコンドリア動態解析が可能になり、現象解明への寄与が期待される.

Mitochondria, which are one of the major organelles for controlling energy metabolism, have been extensively studied in the fields of basic and applied research of biology, drug discovery research, and so on. Mitochondrial studies generally utilize the method of staining with fluorescent molecules while timelapse imaging is indispensable for analyzing mitochondrial dynamics. However, in fluorescence experiments, the excitation of fluorescent molecules may affect mitochondrial activity and morphology owing to phototoxicity and fluorescence photo bleaching. In addition, owing to the fine structure of mitochondria, it is necessary to prepare a clear image when performing quantitative analysis. Therefore, a technique for obtaining clear images which avoids damage to cells and fluorescence photo bleaching under the conditions of excitation light intensity and short exposure as low as possible is desired.

The NIS-Elements imaging software for microscope, is implemented with an image processing function using deep learning technology (NIS.ai). In this study, we confirmed the effect of avoiding phototoxicity in mitochondrial analysis by using the function (Enhance.ai) to generate a clear image from an unclear image acquired using low excitation light intensity. Furthermore, it was shown that the function for removing blurred light from outside the focal plane (Clarify.ai) is also useful for the quantitative analysis of mitochondria. These technologies enable more accurate and detailed mitochondrial dynamics analysis than before, and are expected to contribute to the elucidation of phenomena.

Key words ライフサイエンス, 顕微鏡, 画像処理, 深層学習, ミトコンドリア life science, microscopy, image analysis, deep learning, mitochondria

はじめに

ライフサイエンスの分野において, 生物顕微鏡で取得し た標本画像のデジタル画像処理は広く一般に行われる.ま た, 近年では, 深層学習技術を用いた様々な画像処理技術 が検討されている.これらの技術は, 取得画像の画質改善 機能等として提案され, 生物標本への影響の少ない条件で の撮影の実現や定量解析における効率向上効果が見込まれ るため, 多様な研究分野の応用が期待されている. NIS-Elements は、顕微鏡やカメラの制御、画像処理、解 析、レポート機能を備えた顕微鏡システム用の画像統合ソ フトウェアである。NIS-Elements における深層学習技術を 応用した顕微鏡画像処理機能(NIS.ai)として、ニコンは これまでにいくつかの機能を実装してきた、本稿では、生 物標本への染色処理等による影響の少ない条件で撮影した 不鮮明な画像から鮮明な画像を生成する機能(Enhance.ai) の他、複数の NIS.ai 機能の有効な適用事例を、ミトコンド リア研究に焦点を当て紹介する。

2 ミトコンドリア研究の重要性と課題

ミトコンドリアは細胞内小器官の一つであり, 生物の活 動に用いられるエネルギー生成の場として重要な役割を担 う. そのため, ミトコンドリアの活性や品質維持機構は多 様な疾患に関わることが知られており, 基礎研究から創 薬・応用研究まで広く着目されている [1].

顕微鏡を用いたタイムラプス観察は、経時的に変化する 生物現象をリアルタイムに可視化できる. そのため、形態 や挙動の経時変化が解析指標になるミトコンドリア研究に 顕微鏡タイムラプス撮影は不可欠な手法である [2]. しか し、ミトコンドリアの可視化には蛍光染色が用いられ、定 量解析が可能な明瞭な蛍光画像の取得には強い励起光強度 や長時間露光が必要となる. タイムラプス撮影では度重な る励起光の照射により、褪色や活性酸素種の産生による光 毒性の影響は避けられない [3]. これにより、褪色による 構造の検出や定量精度の低下、または細胞にダメージが生 じて観察対象となる生物現象にも影響を与える懸念があ る[4].一方で、光毒性や褪色の回避のために励起光強度 を抑え露光時間を短くした場合、ミトコンドリアの形態を 検出可能な鮮明な画像の取得が困難となる.このため、可 能な限り低い励起光強度や短時間露光の条件で、細胞への ダメージや蛍光褪色を回避し、鮮明な画像を得る技術が求 められている.



Fig. 1 NIS.ai を用いた学習・推論の流れ

3 AI 画像処理技術とミトコンドリアのタイムラプス 形態解析

NIS.ai は深層学習の一種である Convolutional Neural Network を用いており、学習データを必要とする supervised 型の学習を採用している.ユーザーが学習させること が可能である機能も複数提供しており、Enhance.ai もその 一機能である.学習を要する Enhance.ai 他による処理は、 ユーザーが準備した学習用データを用いて学習済みモデル を学習する学習フェーズと、学習した結果を利用して対象 データ(入力画像)から目的の画像を出力する推論フェー ズの二つのフェーズから成り立つ(Fig. 1). Enhance.ai は バックグラウンド領域とシグナル領域の蛍光強度の差が小 さい不明瞭な低 Signal / Noise (S/N) 蛍光画像と明瞭な高 S/N 蛍光画像のペアを学習データとして学習させる. これ により作成された学習モデルを,処理対象とする低 S/N 蛍 光画像に適用することで高 S/N 蛍光画像が得られる. Fig. 2 左の蛍光画像はミトコンドリアを標識した低 S/N 蛍光画 像で,コントラスト調整で強調すると,ノイズが強調され た不鮮明な画像になる. その画像に対し Enhance.ai を適用 することで, Fig. 2 右画像で示したように個々のミトコン ドリアを観察可能な高 S/N 画像が得られる.



Fig. 2 Enhance.ai を用いた低 S/N 画像の高 S/N 化 入力: Enhance.ai に入力した低 S/N 蛍光画像. Enhance.ai: Enhance.ai による推論結果. 下段は上段の黄四角領域の拡大画 像. スケールバーはそれぞれ 10 μm.

そこで、蛍光の励起光強度を抑えて Enhance.ai を用いる ことによるミトコンドリア形態への効果を検証するため、 共焦点顕微鏡を用いて、励起光となるレーザー強度の調整 により高 S/N 画像を取得した条件と、レーザー強度を最低 限に設定することで低 S/N 画像が得られる条件で、それぞ れ10秒ごと120分のタイムラプス画像を取得した.低 S/N 条件画像に対しては Enhance.ai を適用した.

その結果、レーザー強度の調整により高 S/N 画像を取得 した場合、ミトコンドリアは観察開始から10分程度で光毒 性が顕在化し、120分後には断片化が進行し完全に崩壊して いることが確認された(Fig. 3 (a), (d)). これは、励起光 による光毒性がミトコンドリアや細胞本来の機能に大きな 影響を及ぼしたものと考えられる.一方、最低限のレー ザー強度で蛍光画像を取得した場合、不明瞭な画像が得ら れた(Fig. 3 (b), (e))が、Enhance.ai により個々のミトコ ンドリアが非常に明瞭となった(Fig. 3 (c), (f)). また、観



Fig. 3 励起光によるミトコンドリア様態比較と Enhance.ai 出力

(a-c) 10秒ごとに撮影したタイムラプスの0分(左),10分(中央),120分(右)時点の画像.スケールバーは20 µm.

- (a) 高出力レーザーにより励起された MitoTracker Red CMXRos (Thermo Fisher Scientific, Waltham, US) 蛍光画像.
- (b) 低出力レーザーにより励起された MitoTracker Red CMXRos 蛍光画像. Enhance.ai への入力画像として使用し
- た. (a) と比較し, コントラスト設定を4倍に上げた.
- (c) (b) を入力画像として Enhance.ai を使用した出力画像. (a) とコントラストを合わせた. 赤矢尻は細胞分裂が進行している細胞を示した.
- (d-f) それぞれ(a-c) 画像内の黄四角領域の拡大画像.スケールバーは 20 µm.

察開始から120分後もミトコンドリアの断片化や褪色による 画質の変化は生じなかった. さらに,120分間の観察の中 で,細胞分裂の進行も確認され(Fig.3(c),赤矢尻),細 胞全体として通常の機能が維持できていることが示唆され た.

次に、ミトコンドリア形態の経時変化を定量的に評価し た(Fig. 4). 定量解析には NIS-Elements の画像処理,計測 機能である General Analysis 3を用いた. Enhance.ai により 明瞭となった画像を画像解析に用いることで、ミトコンド リアの形態を正確に捉え、計測が可能となった(Fig. 5). 計測項目としてミトコンドリア領域を検出した画像視野内 のミトコンドリア長さの総和と、細胞当りのミトコンドリ ア長さの総和の変化率を算出し、経時変化を観測した.視 野内の細胞数は、NIS.ai 機能の一つである Convert.ai 機能 を用いてミトコンドリアの蛍光画像から細胞核領域を検出 し、定量した. その結果、強いレーザー強度での観察では、 観察開始後10分程度からミトコンドリアの形態の変化が生 じ、光毒性の影響が定量的に示された. 一方で、最低限の レーザー強度で画像を取得し Enhance.ai を使用した場合、 120分間の観察を通してミトコンドリアの長さが一定で維持



Fig. 4 Enhance.ai を用いたミトコンドリア解析の流れ

されることが示された (Fig. 6).

以上の結果から、Enhance.ai 機能を用いることで、光毒 性によるミトコンドリアへの影響を回避し、定量的な形態



Fig. 5 Enhance.ai 出力画像を用いたミトコンドリア領域の検出 Enhance.ai: Enhance.ai 出力結果. 領域検出: General Analysis 機能を用いて検出したミトコンドリア領域. 下段は上段の黄四 角領域の拡大画像. スケールバーはそれぞれ 20 μm.





視野内のミトコンドリア総長 [µm](上)とミトコンドリア総 長の変化率 [A.U.]の経時変化を示したグラフ.低出力で蛍光 を励起し取得した画像に Enhance.ai を使用した結果(黄)と 高出力で蛍光を励起して取得した画像を使用した結果(灰). 時間間隔は10秒. の解析が可能であることが示された.そのため, Enhance. ai は長時間に及ぶミトコンドリアの品質評価や、ミトコン ドリアや関連分子の詳細な動態の解析へ有効なツールであ り、ミトコンドリアを対象とした基礎研究や創薬研究への 活用が期待される.

4 その他 AI 機能のミトコンドリア解析への活用事例

NIS.aiの一機能である Clarify.ai は学習を必要とせずに, 焦点外から発せられる蛍光成分を取り除く画質改善機能で ある. 共焦点顕微鏡を用いて撮影した画像と比較して,通 常の落射型蛍光顕微鏡を用いて CMOS イメージセンサーを 搭載したカメラで画像を取得した場合,焦点外から発せら れる蛍光成分の漏れ込みにより像が滲む場合がある.細胞 内でミトコンドリアは XY 方向のみでなく,Z軸方向にも 伸展,分布するため,焦点外から発せられる蛍光成分の漏 れ込みが生じ得る.焦点外からの蛍光成分を多く含むミト コンドリア画像を取得すると,画像処理によりミトコンド リアの領域検出を正確に行うことが困難である.そのよう な画像を Clarify.ai へ入力することにより,焦点内の像が明 瞭な画像が得られる (Fig. 7).そのため,共焦点顕微鏡の ような Z 分解能の高い顕微鏡観察法を用いることなく,ミ トコンドリア領域を検出し定量することが可能である.

その他にも、NIS.ai は画像の入力から目的の領域を直接 抽出する Segment.ai 機能や、非染色画像の入力から蛍光画 像を出力する用途に使用可能な Convert.ai 機能を有する.



Fig. 7 Clarify.ai を用いたミトコンドリア蛍光画像の鮮明化 入力: Clarify.ai に入力した焦点外からの漏れ光の多い画像. Clarify.ai: Clarify.ai による推論結果. 下段は上段の黄四角領域 の拡大画像. スケールバーはそれぞれ 20 μm.


Fig. 8 Segment.ai を用いたミトコンドリア領域の検出 入力:Segment.ai に入力した蛍光画像. Segment.ai: Segment. ai により検出されたミトコンドリア領域. 下段は上段の黄四角 領域の拡大画像. スケールバーはそれぞれ 20 µm.



Fig. 9 Convert.ai を用いた透過明視野画像からのミトコンド リア蛍光画像生成

入力: Convert.ai に入力した透過明視野画像. Convert.ai: Convert.ai により生成されたミトコンドリア蛍光画像. 正解:正解 となる実蛍光画像. 下段は上段の黄四角領域の拡大画像. ス ケールバーはそれぞれ 20 µm.

Segment.ai を用いると、例えば蛍光画像と手書きで作成した抽出領域を学習させることにより、ミトコンドリアのような複雑な形態の構造を、高度な画像解析技術の検討無しに領域抽出を行うことが可能となる(Fig. 8). また、Convert.ai に明視野画像と蛍光画像をセットで学習させることで、ラベルフリー標本の明視野画像から、蛍光画像を生成可能である(Fig. 9). このようなデジタルステイン技術には、標本や対象とする細胞内構造に向き不向きがあるが[5]、適用可能な標本の場合、光毒性の低減や染色試薬による毒性を完全に取り除くことが可能である.

5 材料概要

紹介した検証に用いた細胞,顕微鏡,NIS.ai 機能の概要 は下記(Table 1)である.

Table 1 実験材料概要

	Fig. 2, 3	Fig. 7	Fig. 8	Fig. 9	
細胞	HeLa cells				
顕微鏡	Eclipse Ti2-E				
蛍光撮影	共焦点 (A1R)	落射照明 (CMOS)	客射照明共焦点CMOS)(A1R)		
対物倍率	60x	100x	20x	20x	
NIS.ai 機能	Enhance.ai	Clarify.ai	Segment.ai	Convert.ai	
学習回数	1000	学習不要	1000	1000	
入力画像	蛍光	蛍光	蛍光	明視野	
出力画像	蛍光	蛍光	検出領域	蛍光	

NIS.ai により,強い励起光照射や長時間の露光を行わず に高 S/N 画像を得ることが可能である.これにより,従 来は躊躇されていたような短いインターバルまたは長時間 のタイムラプス観察,解析が容易となる.ミトコンドリア の例以外にも,細胞内の小胞輸送など高速な現象をとらえ る必要のある研究への応用が見込まれる[6],[7].また, 細かい構造の検出の妨げとなっていた焦点外からの漏れ光 除去も可能であるため,解析効率の向上への貢献も期待さ れる.

引用文献

- J. Nunnari and A. Suomalainen, "Mitochondria: in sickness and in health," *Cell*, vol. 148, pp. 1145–1159, 2012.
- [2] K. Mehta, L. A. Chacko, M. K. Chug, S. J. Jhunjhunwala, and V. Ananthanarayanan, "Association of mitochondria with microtubules inhibits mitochondrial fision by precluding assembly of the fission protein Dnm1," *J. Biol. Chem.*, vol. 294, no. 10, pp. 3385–3396, 2019.
- [3] P. P. Laissue, R. A. Alghamdi, P. Tomancak, E. G. Reynaud, and H. Shroff, "Assessing phototoxicity in live fluorescence imaging," *Nature methods*, vol. 14, no. 7, pp. 657– 661, 2017.
- [4] M. M. Knight, S. R. Roberts, D. A. Lee, and D. L. Bader, "Live cell imaging using confocal microscopy inducing intracellular calcium transients and cell death," *Am. J. Physiol. Cell Physiol.*, vol. 284, pp. 1083–1089, 2003.
- [5] C. Ounkomol, S. Seshamani, M. M. Maleclar, F. Collman, and G. R. Johnson, "Label-free prediction of three-dimen-

sional fluorescence images from transmitted-light microscopy," *Nature methods*, vol. 15, pp. 917–920, 2018.

[6] T. Tojima, Y. Suda, M. Ishii, K. Kurokawa, and A. Nakano, "Spatiotemporal dissection of the *trans*-Goldi network in budding yeast," *J. of Cell Science*, vol. 132, no. 15, jcs231159, 2019.

[7] M. Rosendale and D. Perrais, "Imaging in focus: Imaging the dynamics of endocytosis," *Int. J. of Biochem. and Cell Biol.*, vol. 93, pp. 41–45, 2017.

門井宏平 Kohei KADOI ヘルスケア事業部 技術統括部 システム開発部 System Development Department Technology Solution Sector Healthcare Business Unit 武居俊輔 Shunsuke TAKEI ヘルスケア事業部 技術統括部 システム開発部 System Development Department Technology Solution Sector Healthcare Business Unit 研究開発論文

Research and

Development

Reports

発電用ガスタービン実験機の翼への最適 リブレット効果予測と、そのレーザー加工 によるリブレット性能評価[†]

白石雅之, 土橋晋太郎, Peter A. Leitl, Andreas Flanschger, Stefan Schreck, Richard Benauer, Simon Pramstrahler, Andreas Marn

Numerical and Experimental Investigation of Laser Processed Riblets on Turbine Exit Guide Vanes of Gas Turbine Test Rig and the Impact on the Performance

Masayuki SHIRAISHI, Shintaro TSUCHIHASHI, Peter A. LEITL, Andreas FLANSCHGER, Stefan SCHRECK, Richard BENAUER, Simon PRAMSTRAHLER and Andreas MARN

リブレットは、流体機器の表面に設けられたサメ肌状の構造で流線に沿った溝により乱流境界層の粘性抵抗を低減す ることが知られている.低圧の発電用ガスタービンを模した実験評価機において、タービン出口案内翼(TEGV)の負 圧面にリブレットを施した場合の圧損やwakeの低減を流体解析により求め、流体力学上最適なリブレットデザインを 算出した.実際に鉄系ブレードである出口案内翼に直接レーザー加工でデザインを忠実に再現したリブレットを形成し、 実験評価機に設置してリブレットの効果や流れへの影響を実測した.出口案内翼で6.3%の圧損低減が得られた.レー ザー加工は金属に直接リブレットを加工できるので、発電用ガスタービンのような高温環境でもリブレットを適用でき、 発電効率向上などに寄与することができる.

The reduction of pressure loss and wake in a low-pressure turbine test rig containing turbine exit guide vanes (TEGVs) with laser-processed riblet surface were numerically and experimentally investigated. Riblets are streamwise grooved surfaces which reduce the viscous drag in a turbulent boundary layer, similar to shark-skin. An optimized riblet design was calculated by computational fluid dynamics (CFD), and the designed riblets were laser-processed directly onto the suction side of steel TEGVs. The TEGVs with and without riblets were installed on the test rig, and the effect of the riblets on the flow were measured. Pressure loss around the TEGVs was reduced by 6.3%. This result shows the benefit of laser-processed riblets directly fabricated on 3-dimensionally curved parts, such as gas turbine blades, which operate at high temperature.

Key words リブレット、レーザー加工、流体解析、粘性抵抗低減、発電効率 riblet, laser processing, CFD, drag reduction, power generation efficiency

1 はじめに

発電用ガスタービンをはじめとする流体機器が受ける流 体抵抗は,圧力抵抗(慣性抵抗)と摩擦抵抗(粘性抵抗) に大別される.特に高レイノルズ数の乱流領域においては, 壁面境界層に強いヘアピン渦が発生し,それに伴って壁面 ごく近傍に低速ストリークとよばれる構造によって連続的 に縦渦が生じ,層流に比べて大きな壁面乱流摩擦抵抗が発 生する[2].摩擦抵抗は流体機器の損失の一因であり,こ れを低減することは流体機器の効率を向上させる大きな課 題の1つである.

一方,速く泳ぐ種のサメにおいて鱗の1つ1つの表面に 35~100 μm 程度の微小な縦溝があることが知られていた [3],[4].流れに沿ったこの縦溝はリブレット(riblet)と 呼ばれ,平滑面に対して8~10%程度の乱流摩擦抵抗低減 を引き起こすことが実験的にも明らかにされている[5]. リブレットは,縦渦が壁面から離れて壁面との相互作用が 抑制される効果を持つ[6].Fig.1にリブレットと縦渦の

^{*}本稿は、自著の引用文献[1]に対して実測と解析の乖離の要因、および実用条件を想定した場合の影響に考察を加えたものである。



Fig. 1 Eddy-wall interaction without and with riblets. The flow is in the depth direction of the paper.

相互作用の模式図を表す.壁面近傍の縦渦の寸法は壁剪断 応力に依存するため、最適なリブレットピッチ(リブレッ トの嶺トップの間隔)も各所の壁剪断応力に依存し、壁剪 断応力が大きいほど最適なリブレットピッチは小さくなる. リブレットによる摩擦抵抗の低減量は縦渦の寸法,すなわ ち流速によって変化する.リブレットピッチsを次の式の ように無次元化した s⁺という尺度においては,s⁺=17付近 で摩擦抵抗の低減効果が最大となる.

$$s^{+} = \frac{s\sqrt{\frac{\tau_{w}}{\rho}}}{v} \tag{1}$$

ここで、τ_wは壁剪断応力,ρは流体の密度,vは流体の動粘 度である.これより流速が相対的に遅く、もしくはリブ レットピッチが小さくなると摩擦抵抗の低減効果はゼロに 漸減する.一方、流速が相対的に速く、もしくはリブレッ トピッチが大きくなると摩擦抵抗の低減効果はゼロを超え て逆に摩擦抵抗が増大する.この挙動を表したものがFig.2 である [7].とりわけ表面積が大きく高レイノルズ数領域 で乱流摩擦抵抗の寄与が大きな航空機や風力タービン翼の 分野でリブレットの研究が進んでおり [8],[9],産業用コ ンプレッサーやジェットエンジンなどターボ機械にも有効 と考えられている [10],[11].

リブレットピッチは数 µm ~100 µm 程度の微小寸法となることから、機械加工によるリブレットの実現は困難であ



Fig. 2 Drag reduction effect by riblets with various cross section. The number s^+ is a dimensionless riblet size.

り,従来は金型による樹脂フィルム(リブレットフィルム) が用いられた [12].しかし,対象物の形状や流線が複雑な 場合や使用環境が高温である場合にはフィルムは適用が難 しく,特に商用ガスタービンにおいてはフィルムでのリブ レットの実用化は不可能であった.

そこで我々はレーザーアブレーション加工により所定の 形状のリブレットを形成する技術を開発した. レーザーア ブレーション (laser ablation) とは、ナノ秒、ピコ秒、 フェムト秒のパルス幅を持つ極短パルスレーザーによって 非熱的に材料表面の物質を除去する技術である[13], [14]. この技術と、リブレットの最適寸法を導出し流体へ の効果を予測する技術 [15] とを組み合わせることで、従 来リブレットの実現が難しかった複雑形状で高温環境の タービン翼に対して直接リブレットの形成を行うことがで きる. 我々は実際にこうした環境下で運転される金属製の タービン翼に直接,流体解析 (CFD) に基づいて設計した リブレットをレーザー加工で形成しており、これまでに タービン実験評価系における出口案内翼(静翼)にリブ レットを形成した場合の圧損や流れの変化の評価[1]や, 超小型エンジンにおける圧縮機インペラー(動翼)、ディ フューザー(静翼)およびタービンブレード(動翼)に リブレットを形成した場合の推力や燃料効率のエンジン 性能の変化の評価 [16] を行い, 高温環境におけるター ビン部品へのリブレット加工の優位性を示してきた.本 稿では、筆者らの評価結果 [1] に対して、実測と解析の 乖離の要因、および実用条件を想定した場合の影響に考 察を加えた.

2 タービン実験評価系概要

リブレットの効果を検証した実験評価系は、オーストリ ア・グラーツ工科大学(Graz University of Technology, Graz, Austria)の亜音速テストタービン設備(Subsonic Test Turbine Facility for Aerodynamic, Aeroacoustic, and Aeroelastic Investigations; STTF-AAAI)である. Fig. 3 に設備概 略を示す [17]. 共通コンプレッサー設備より最高温度 100℃, 流量 2.5~15 kg/s のエアが供給でき,入口案内翼 (IGV)を経て1段の低圧タービンステージおよびタービン 出口案内翼(TEGV)を通って排気される. タービン動翼 の最大回転数は 6300 rpm である.本設備では全圧,全温, 静圧,静温,流速,流量,音響の各項目が測定可能である.



Fig. 3 Experimental turbine test-rig facility of STTF-AAAI and its TEGV section.

今回は, 翼が個々に取外し可能でレーザー加工が容易な TEGV をリブレットの効果検証の対象とした. TEGV 部は 15枚の翼で構成され, 翼1枚の概略寸法は翼弦長 100 mm× スパン 80 mm で材質は一般構造用圧延鋼材 SS400である.

3 数值的解析

3.1. 解析の概要

リブレット設計および効果予測は CFD により導いた [15]. Fig. 4 にリブレット設計プロセスの概略を示す.ま ず,過去の実測評価とコリレーションを取りながら,全て の物体表面にリブレットの無いベースライン解析を moving mesh (MM) による非定常 LES^{*1}で行い,これを mixing plane model (MPM) による定常 RANS^{*2}と比較して妥当性 を確認した.リブレット有の解析は、リブレットの微小な 形状自体はモデル化せず,別途ミクロな非定常解析によっ て境界層に与える影響を求めた結果を定常 RANS における 壁表面特性として与えることでリブレットを再現し,乱流 モデルには SST-kω を用いた.



Fig. 4 Scheme of riblet design process and correlation between simulation and experiment.

3.2. 解析条件

解析空間を Fig. 5 に示す. 解析セル数は約680万である. リブレット断面形状は Fig. 6 に示すような最大 8 %の摩擦 抵抗低減効果を持つ三角形状のリブレットを仮定し, リブ レットの適用箇所は TEGV の負圧面とした.

タービンの運転条件は,動翼の回転数 4600 rpm,動作圧 95.5 kPa (ゲージ圧),密度は圧縮性流体として扱い,動粘 度は温度依存の Sutherland 則に従うとした.入口では全圧 17.9 kPa, 全温100℃,流入角度46.25°,出口では静圧 0 Pa とした.





3.3. ベースライン解析

解析および実測の分布表示は Fig. 7 のように TEGV 部全 周の1/15にあたる一区画の後方視野の扇形で表す.



Fig. 7 Display of distribution of physical quantities by a single section of TEGVs. TE is a trailing edge of TEGV.

リブレット無しにおける過去実測値およびベースライン 解析(非定常 LES および定常 RANS)の結果を Fig. 8 に示 す. TEGV 部前の Plane C 位置での全圧分布は過去実測値 と非定常 LES とは良く似ており,動翼の wake の影響が明 確に分かる. 定常 RANS は平均化の影響を受けて動翼の影 響は消えている. TEGV 部後の Plane D 位置での全圧分布 は,過去実測値,非定常 LES,定常 RANS いずれも TEGV の翼の後縁部からの wake の影響が見られ,多少形状は異 なるものの同等な wake が再現された.



Fig. 8 Comparison of the past experiment and the baseline simulation results without riblets by unsteady-state LES (MM) and steady-state RANS (MPM).

また, Fig.9 に示すように, 全圧, 流速, 流れのヨー角 の径方向分布について定常 RANS の結果は過去実測値と絶 対値として同等な値が得られた. なお, 流れのヨー角は, 動翼回転方向(Fig.5 の矢印)に向かう流れの向きを正と

*2 Reynolds-Averaged Navier-Stokes.

^{*1} Large-Eddy Simulation.

した. これらの比較を踏まえ, 定常 RANS 結果はリブレット無しのベースラインとして妥当である.



Fig. 9 Validity of the steady-state RANS (MPM) simulation (solid lines) compared to the past experiment (dotted lines).

3.4. リブレット解析

定常 RANS によるリブレット有無の比較結果を Fig. 10 に 示す. 径方向分布では、リブレット無しに比べてリブレッ ト有の方が流速については Plane C, Plane D ともに増大し ており、全圧については Plane C で減少、Plane D で増大 した. リブレット有無での差は僅かではあるが、リブレッ ト有の方が TEGV 部前後の圧損が低減し、流れやすくなる ことが予測された.

また, TEGV 後の全圧の周方向分布についてリブレット 有無を比較すると, Fig. 11 に示すようにリブレット有のほ うが wake の幅が減少することが予測された.

これらの解析結果からは、TEGV部前後の圧損はリブ レットにより1.2%低減すると予測された.

3.5. リブレット最適寸法

Fig. 12 に CFD によって導出されたリブレット最適寸法







Fig. 11 Simulated wake width without and with riblets.



Fig. 12 Riblet design (suction side) obtained by CFD.

を示す. コンターは赤がリブレットピッチが大きく,緑がリ ブレットピッチが小さい. リブレットピッチは 60~120 μm 程度でゆるやかに分布しており,流線も一様ではない.

4 リブレットのレーザー加工

リブレットの加工にはレーザーアブレーション加工の開 発機を用いた. このレーザー加工機は, 波長 532 nm (緑 色), パルス幅約 15 ps, 最大繰返し周波数 4 MHz, 最大出 力 50 W の短パルスレーザーを持つ. レーザー光は照射 ヘッドに導かれ, ガルバノミラーによって同期してスキャ ンされる. レーザー光は f θ レンズによって所定の位置に 集光されるが, 湾曲した翼表面に沿って焦点を追随させる ことができる. 照射ヘッドは, 3 軸ステージによって所定 の XYZ 位置に駆動できる. また, 加工対象物は 2 軸の傾斜 ステージ上で所定の姿勢を示現できる. レーザー光が集光 した対象物の表面はアブレーションにより除去され, これ を連続的にスキャンすることでリブレットの溝が形成され る.

前節で述べた CFD によるリブレット最適寸法を忠実に 再現するため,解析ノードごとのリブレットのピッチと方 向の情報から流線に沿ったリブレットのパスを生成した.



Fig. 13 Laser processing on the surface of TEGV using a development tool with green pulsed laser beam.



Fig. 14 (left) TEGV (suction side) with lasered riblet. (right) A microscopic profile of lasered riblet sample.

これにより,一様でないリブレットピッチを持つ領域内で, 3次元的に計算された流線に沿った曲線上にリブレットを 形成できる. Fig. 13 に TEGV の翼へのレーザー加工中の様 子を示す.

最終的に15枚の TEGV の負圧面にレーザー加工でリブ レットを施した. Fig. 14 にリブレットを施した TEGV の翼 の1枚を示す(Fig. 12 のリブレット最適寸法の図と対応す る). TEGV のやや暗い領域にリブレットが加工されてい る.

5 実測評価

5.1. 評価概要

実験評価機にリブレット無しの翼15枚を設けたテストと、 リブレット有の翼15枚を設けたテストとで各々別に測定を 実施した.タービンの運転条件は、入口温度97℃、動翼の 修正回転数 4042 rpm (CFD における回転数 4600 rpm に相 当する)、修正流量 6.81 kg/sで、レイノルズ数は約34万で ある.

流れの評価は5孔プローブによる TEGV 部前後の圧力, 温度,流速測定および後縁プローブによる TEGV 後の圧力 と流速の測定で行った. Fig. 15 と Fig. 16 に5孔プローブ と後縁プローブの配置を, Table 1 に5孔プローブと後縁プ ローブの測定不確かさを示す.



Fig. 15 Configuration of the five-hole probe.



Fig. 16 Configuration of the trailing-edge probe.

Table 1	Measurement uncertainties of the five-hole probe
	(left) and the trailing-edge probe (right).

Flow variable		Uncertainty, ±		Flow variable		Uncertainty, ±
Mach	number	0.002		Drogouro	total	28 [Pa]
Propouro	total	35 [Pa]		Flessule	static	28 [Pa]
Flessule	static	63 [Pa]		Velocity	absolute	0.60 [m/s]
Temperature	total	60 [K]	1			
	static	80 [K]				
Flow angle	pitch	0.70 [deg]				
	yaw	0.70 [deg]				
	absolute	0.90 [m/s]				
Velocity	axial	0.90 [m/s]				
	radial	0.90 [m/s]				
	circumferential	0.90 [m/s]				

5.2. 5孔プローブによる流れ評価

TEGV 部前の Plane C および TEGV 部後の Plane D にお ける全圧と流れのヨー角について周方向平均の径プロファ イルの測定結果を Fig. 17 に示す. リブレット有の方が TEGV 部前で全圧が低下, TEGV 部後で全圧が上昇したこ とから, 圧損が低減したことが分かった. また, リブレッ ト有の方が TEGV 部前後とも流れのヨー角がゼロに近づい ていることが分かった. また, 扇形領域内の分布における リブレット有無の差異からは, リブレットによって全体的 に圧損が減り, 流れが軸方向に沿うガイド性が向上したこ とが分かった.

5.3. 後縁プローブによる Wake 評価

後縁プローブは,所定の径位置において周方向に移動さ せながら分布を取り,wakeの幅を評価できる.Fig.18 に後 縁プローブによる50%スパンでの周方向流速プロファイル の測定結果を示す.リブレット有の方がwakeの幅が減少す るとともに,よりTEGVの翼に沿った流れとなることが分 かった.他の径位置においても同様な傾向が測定された.



Fig. 17 Difference in total pressure and yaw angle between without and with riblets measured with the five-hole probe.

(top) Radial profile (circumferential average).(bottom) 2D cross-sectional profile.



Fig. 18 Difference in velocity profile (wake) between without riblets and with riblets measured by trailingedge probe.

このことは,負圧面に施したリブレットにより摩擦抵抗 が低減して負圧面側の流速が上がることで,Fig.19に模式 的に示すように後縁で合流した流れにおいて翼後方の流れ のヨー角が小さくなって流れを軸方向に向かわせるガイド 性が向上したと考えられる.すなわち,リブレットは単に 摩擦抵抗を低減させる本質的な効果だけでなく,その結果 リブレット適用面に接する流れの流速を増大させ,後流の コントロールをすることも可能ということができる.

5.4. リブレットによる圧損低減効果

これらの測定結果から,TEGV 部前後の圧損を求めた. Table 2 に TEGV 部前後の全圧および圧力損失のリブレッ ト有無での比較を示す.全圧の算出には面積加重平均と質 量加重平均がよく用いられ [18],全圧等流速に関係した物



- Fig. 19 Schematic concept of assumed effect on the flow velocity and direction by riblets on SS (suction side).
- Table 2 Reduction of pressure loss between Plane C (before TEGV) and Plane D (after TEGV) by riblet: (top) Area-weighted, (bottom) Massweighted.

Total pressure l (PlaneC – Plane	reduction of pressure loss	
without riblets	677.1	ref
with riblets	634.2	-6.3% 💙
without riblets	640.8	ref
with riblets	595.1	-7.1% 💙

理量では質量加重平均が適するとされるが,圧損低減量は, 少なくとも面積加重平均の場合であっても6.3%は低減効果 があることが求められた.

6 まとめ

タービン実験評価機の TEGV にリブレットを適用した場 合の TEGV 部前後の圧損低減効果および最適なリブレット 設計を CFD により求めた. TEGV の負圧面にリブレットを 適用することで, 圧損は1.2%低減すると効果予測された. リブレット設計に従ってレーザー加工によりリブレットを 施した TEGV の翼を実験評価機に設置し, リブレット有無 の圧損を実測評価した結果, TEGV 部前後の圧損はリブ レットを施すことで6.3%低減された. また, リブレットに より流速向上, ガイド性向上の効果が確認できた. これら により, リブレットによる流れ制御特性を持った翼として, ガスタービンなどのターボ機器等の翼設計に有用であると 考えられる.

一方、TEGV 部前後の圧損低減が CFD 予測よりも実測の 方が大きかったのは、リブレット有の場合の CFD 予測が 定常 RANS 解析に拠っており、特に TEGV 正圧面側の非定 常な流れにおける剥離が定常 RANS 解析では再現し難いこ とからリブレットが剥離に与える効果が過少見積となった ことが要因の1つとして考えられる. 現時点では非定常計 算によるリブレット効果予測は計算負荷上の課題があるが, 計算能力向上, アルゴリズム改善により, 非定常における リブレット効果予測精度の向上が図られると考えられる. また、今回評価を行った実験評価機はオフデザインポイン トでのタービンの挙動の評価が主眼の設備のため、運転条 件において翼上に剥離が発生しており、実測と定常 RANS 解析結果に差異が生じた要因と考えているが、通常、ター ビンはデザインポイントにおいて剥離が生じない翼形状で あるため、実用的なタービンに適用した場合は剥離に起因 した実測と解析結果の差異は小さくなり、予測精度は向上 すると考えられる. 実際, 超小型エンジンのブレードにリ ブレットを形成した評価においては、デザインポイントで の運転で実測と解析はよく一致した [16]. すなわち, 発電 用ガスタービンを対象としてリブレットを適用した場合に は、実用的な予測精度でリブレットによる効率向上を予測 し、また実際にリブレットを形成して効率を向上すること ができる.

引用文献

- [1] 白石雅之, 土橋晋太郎, 一ノ瀬剛, 柴崎祐一, P. A. Leitl, A. Flanschger, S. Schreck, R. Benauer, S. Pramstrahler and A. Marn, "タービンテストリグ出口案内翼への最適リブ レット効果予測と, そのレーザー加工によるリブレット 性能評価,"第49回日本ガスタービン学会定期講演会, A-24, 2021.
- [2] 三宅裕, "壁乱流の渦," ながれ, vol. 22, no. 1, pp. 29-34, 2003.
- [3] 鈴木雄二, 笠木伸英, "壁面乱流の知的能動制御," セー ブメーション・レビュー マイクロフローセンサ特集号 (2001), pp. 50-57, 2001.
- [4] D. W. Bechert, G. Hoppe and W.-E. Reif, "On the drag reduction of shark skin," in *Proc. 23rd Aerospace Sciences Meeting*, 1985, doi: 10.2514/6.1985-546.
- [5] D. W. Bechert, M. Bartenwerfer, G. Hoppe and W.-E. Reif, "Drag reduction mechanisms derived from shark skin," in *Proc. 15th Congr. ICAS*, Sep.1986, pp. 1044–1068.
- [6] B. Dean and B. Bhushan, "Shark-skin surfaces for fluiddrag reduction in turbulent flow: A Review," *Phil. Trans. Roy. Soc. A*, vol. 368, no. 1929, pp. 4775–4806, 2010.
- [7] D. W. Bechert, M. Bruse, W. Hage, J. G. T. van der Hoeven and G. Hoppe, "Experiments on drag-reducing surfaces and their optimization with an adjustable geometry," *J. Fluid Mech.*, vol. 338, pp. 59–87, 1997.
- [8] "戦略的省エネルギー技術革新プログラム 省エネル

ギー技術開発事業の重要技術に係る周辺技術・関連課 題の研究 革新的リブレットによる高速移動体の省エ ネルギー化技術の調査研究,"成果報告書 2018年3 月, NEDO, https://www.nedo.go.jp/library/seika/ shosai_201803/2018000000035.html, 2018.

- [9] P. A. Leitl, V. Stenzel, A. Flanschger, H. Kordy, C. Feichtinger, Y. Kowalik, S. Schreck and D. Stübing, "Riblet surfaces for improvement of efficiency of wind turbines," in *Proc. AIAA Scitech 2020 Forum*, 2020, doi: 10.2514/6.2020-0308.
- [10] P. A. Leitl, E. Göttlich, A. Flanschger, A. Peters, C. Feichtinger, A. Marn and B. Reschenhofer, "Numerical investigation of optimal riblet size for TCF strut flow and their impact on the performance", in *Proc. AIAA Scitech 2020 Forum*, 2020, doi: 10.2514/6.2020-0307.
- [11] P. A. Leitl, M. L. Garcia De Albeniz and A. Flanschger, "Nano- and microstructured riblet surfaces for centrifugal industrial compressors," in *Proc. Conf. SUstainable PolyEn*ergy Generation and HaRvesting (SUPEHR), 2019, pp. 32-38.
- [12] A. Sareen, R. W. Deters, S. P. Henry and M. S. Selig, "Drag reduction using riblet film applied to airfoils for wind turbines," in *Proc. 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition*, 2011, doi: 10.2514/6.2011-558.
- [13] B. N. Chichkov, C. Momma, S. Nolte, F. von Alvensleben and A. Tünnermann, "Femtosecond, picosecond, and nanosecond laser ablation of solids," *Appl. Phys. A*, vol. 63, no. 2, pp. 109–115, 1996.
- [14] M. C. Richardson, "New opportunities with intense ultrashort-pulse lasers," in *Proc. of SPIE*, vol. 1410, 1991.
- [15] P. A. Leitl, S. Kuntzagk, A. Flanschger and K. Pfingsten, "Experimental and numerical investigation of the reduction in skin friction due to riblets applied on the surface of a Taylor-Couette cell," in *Proc. of AIAA SciTech Forum*, 2018.
- [16] 稲崎慎也,佐藤真路,一ノ瀬剛, P.A. Leitl, A. Flanschger, S. Schreck and R. Benauer, "超小型ジェットエンジンの 最適リブレット計算とそのレーザ加工,およびエンジン 性能での効果検証,"第49回日本ガスタービン学会定期講 演会, A-25, 2021.
- [17] M. Zenz, A. Hafizovic, L. Simonassi, P. A. Leitl, R. Benauer, F. Heitmeir and A. Marn, "Aerodynamical and aeroelastic investigations of a riblet design applied on the surface of turbine exit guide vanes of a low pressure turbine," in *Proc. of 13th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics*, 2019.
- [18] N. A. Cumpsty and J. H. Horlock, "Averaging nonuniform flow for a purpose," *J. Turbomach.*, vol. 128, no. 1. pp. 12–129, 2006.

Stefan SCHRECK

Richard BENAUER

Bionic Surface Technologies 社

Bionic Surface Technologies 社

Graz University of Technology

Graz University of Technology

Simon PRAMSTRAHLER グラーツ工科大学

Andreas MARN グラーツ工科大学

Bionic Surface Technologies, GmbH

Bionic Surface Technologies, GmbH

白石雅之 Masayuki SHIRAISHI 次世代プロジェクト本部 第二開発部 2nd Development Department Next Generation Project Division

土橋晋太郎 Shintaro TSUCHIHASHI 次世代プロジェクト本部 第二開発部 2nd Development Department Next Generation Project Division

Peter A. LEITL Bionic Surface Technologies 社 Bionic Surface Technologies, GmbH

Andreas FLANSCHGER Bionic Surface Technologies 社 Bionic Surface Technologies, GmbH



白石雅之

土橋晋太郎 Shintaro TSUCHIHASHI



Peter A. LEITL



Andreas FLANSCHGER

Stefan SCHRECK

Richard BENAUER



Andreas MARN





超小型ジェットエンジンの最適リブレット 計算とそのレーザー加工,およびエンジン 性能での効果検証[†]

稲崎慎也, Peter A. Leitl, Andreas Flanschger, Stefan Schreck, Richard Benauer

Numerical and Experimental Investigation of Laser Processed Riblets on Ultra-small Jet Engines and the Impact on the Performance

Shinya INASAKI, Peter A. LEITL, Andreas FLANSCHGER, Stefan SCHRECK and Richard BENAUER

リブレットとは、乱流境界層における粘性抵抗を低減する、サメ肌状の流線形の溝面である. 超小型ジェットエンジン のコンプレッサー、ディフューザー、タービンブレードにリブレットを形成し、エンジン性能の向上を実験的に確認し た.まず、エンジンの3次元モデルを用いた数値流体力学(CFD)により、エンジン性能向上に最適なリブレットデザ インを算出し、その性能向上量はエンジン推力で1.81%向上を予測した.算出したリブレットデザインを、直接のレー ザー加工によってデザインを忠実に再現するようにエンジン部品に形成した.この部品をエンジンに組み込み、エンジン 性能を実測し、レーザー加工されたリブレットはエンジン推力を1.44%向上させるとの結果が得られた.本研究は、高 温・高速回転する部品にレーザー加工リブレットを適用し、ターボ機械の性能を向上させた世界初の実験的実証となる.

Riblets are streamwise grooved surfaces which reduce the viscous drag in a turbulent boundary layer, similar to shark skin. We experimentally confirmed improved engine performance by forming riblets on the compressor, diffuser, and turbine blades of an ultra-small jet engine. The optimum riblet design was calculated by computational fluid dynamics (CFD) using a 3D model of the engine, and the improvement was predicted to be 1.81% in engine thrust. The calculated riblet design was formed on the actual parts by laser ablation. It was experimentally confirmed that the laser processed riblets improved engine thrust by 1.44%. This work is the world's first experimental demonstration of improved turbomachinery performance through the application of laser processed riblets on parts exposed to high temperatures and rotating at high speed.

Key words 超小型ジェットエンジン, コンプレッサー, ディフューザー, タービン, 推力, 効率, リブレット, レーザー加工, 粘性抵抗低減, 流体解析 ultra-small jet engine, compressors, diffuser, turbine, thrust, efficiency, riblet, laser processing, drag reduction, CFD

1 はじめに

ガスタービンやジェットエンジンなどターボ機器の燃料 消費削減や温室効果ガス排出抑制といった経済性や環境性 に対する要求が高まっており,ターボ機器の効率改善は社 会的にも重要になっている.効率改善手段として,我々は 流体抵抗の低減に着目した.流体抵抗は,圧力抵抗(慣性 抵抗)と摩擦抵抗(粘性抵抗)に大別される.壁近傍層で は,縦渦と呼ばれる乱流要素渦があり,特に高レイノルズ 数の乱流領域においては,渦が壁に向かう強い衝撃流を作 り,層流に比べて大きな壁面乱流摩擦抵抗が発生する[2]. 摩擦抵抗は流体機器の効率低下の一因であり、これを低減 することは流体機器の効率を向上させる重要な課題のひと つである.

一方, サメの中でも早く泳ぐ種類においては, 鱗1つ1 つの表面に 35~100 μm 程度の微小な縦溝があることが知 られている [3], [4]. このサメの鱗の溝はリブレット (riblet) と呼ばれ, 平滑面に対して最大8~10%程度の乱 流摩擦抵抗低減を引き起こすことが実験的にも明らかにさ れている [5].

実用に向けた研究としては、とりわけ表面積が大きく高 レイノルズ数領域で乱流摩擦抵抗の寄与が大きな航空機や

*本稿は、著者らの引用文献[1]に対し、タービン翼のエンジン稼働時温度や稼働時間の結果、および金属疲労についての考察を加えたものである.

風力タービン翼の分野でリブレットの研究が進んでおり [6], [7], 産業用コンプレッサーやジェットエンジンなど ターボ機械にも有効と考えられている [8], [9]. ただ, こ れらの機器の最適リブレットは, ピッチが数 µm ~100 µm の微小寸法となることから, 機械加工による壁面へ直接の リブレット付与は実現困難であり, 従来は金型による樹脂 フィルム (リブレットフィルム)が用いられた [10]. しか し, 対象物の形状や流線が複雑であったり使用環境が高温 である場合, また高速で回転する動体である場合にはフィ ルムの適用が難しく, 商用ガスタービンやジェットエンジ ンなどにおいてはリブレットの実用化は困難であった.

そこで我々はレーザーアブレーション加工により所定の 形状のリブレットを形成する技術を開発した.レーザーア ブレーション (laser ablation) とは、ナノ秒、ピコ秒、 フェムト秒のパルス幅を持つ極短パルスレーザーによって 非熱的に材料表面の物質を除去する技術である [11], [12]. この技術と、リブレットの最適寸法を導出し流体へ の効果を予測する技術 [13] とを組み合わせることで、従 来リブレットの実現が難しかった複雑な形状で高温環境、 高速で回転するタービン翼に対して直接リブレットの形成 を行うことが可能である.我々は実際に、超小型ジェット エンジンのタービン翼 (動翼) に加えて、同様に複雑な形 状で高速動体のコンプレッサー (動翼)、ディフューザー (静翼) の3部品にリブレットを施し、その効果をエンジン 性能の改善、効率の改善として示してきた [1].

一方,材料表面にリブレットのような切欠きを形成する と,材料の強度特性の低下が懸念される.これに対し我々 は,圧縮機の部材に直接リブレット加工を施した試験片を 準備し,引張試験,クリープ試験を実施し,部材への直接 のリブレット加工が,金属の強度特性に影響が無いことを 示してきた[14].本稿は,著者らの評価結果[1]に対し, タービン翼のエンジン稼働時温度や稼働時間の結果,およ び金属疲労についての考察を加えたものである.

2 評価系概要

2.1. 超小型ジェットエンジン JB220

リブレットの効果を検証した超小型ジェットエンジンは, JB220 (Behotec, Dahau, Germany) である Fig. 1 に形状の 概略を示す.エアインテークから吸気し,遠心型動翼のコ ンプレッサー,静翼のディフューザー,燃焼室,静翼の Nozzle guide Vane を経て,動翼のタービン,テールコーン から排気される.動翼部の最大回転数は 12万 rpm で,最 大推力は 220 N である.

燃焼機部の外形直径は約 11.3 cm で, 全長は 31.3 cm で ある. コンプレッサーの羽根車径は約 8 cm で, 回転軸方 向厚みは約 3 cm, 羽根は14枚. ディフューザーの直径は約 11 cm で, 回転軸方向厚みは約 2 cm. タービンの羽根車径 は約7 cm で, 軸方向厚みは約1 cm, 羽根は23枚である. 材質は, コンプレッサー, ディフューザーがアルミ系合金 で, タービンのみインコネルである.



Fig. 1 Ultra-small Jet engine configuration

2.2. エンジン評価ベンチ

エンジン性能評価および,リブレット最適化計算に必要 なデータ取得のため,エンジン評価ベンチをフォックス コーポレーション,日本と共同で作成した.評価ベンチの 概要模式図を Fig. 2 に示す.

本評価ベンチは、エンジン本体、エンジン性能計測部、 エンジン内部温度・圧力計測部、外部環境計測部から構成 されている.エンジン本体と性能計測部および内部温度・ 圧力計測部は室内に設置され、吸入空気は、外部環境空気 をそのまま使用している.外部環境計測部は、この外部環 境の温度および気圧を計測するものである.

エンジン本体は,前節のJB220である.エンジン性能計 測部として推力計,回転計,燃料流量計,風速計を配置し ている.吸気流量管理のため,エンジンのエアインテーク 前に内径 11.4 cm の筒を配置し,この筒を通じてエンジン に吸気するよう接続している.推力計測のため,エンジン



Fig. 2 Ultra-small Jet engine evaluation bench overview

は2本の円径マウンターで固定されている.エンジン内部 温度・圧力計測部は,吸入空気の温度,コンプレッサー後 の温度・圧力,燃焼室内温度,テールコーン部温度を計測 しており,エンジン内部に各センサを配置している.外部 環境計測部は,温度,湿度,気圧を百葉箱内で計測してい る.これらの計測器はすべて1つのデータロガーに接続し, サンプリング周期0.5秒で値を記録している.

3 数值的解析

3.1. 解析の概要

リブレット設計および効果予測は流体解析(CFD)によ り導いた.Fig.3にリブレット設計プロセスの概略を示す. まず,実測評価とコリレーションを取りながら,全ての物 体表面にリブレットの無いベースライン解析を moving mesh (MM)による非定常 LES (Large-Eddy Simulation) で行い,次いで mixing plane model (MPM)による定常 RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes)と比較して妥当 性を確認した.リブレットが有る解析は、リブレットの微 小な形状自体はモデル化せず,別途ミクロな非定常解析に よって境界層に与える影響を求めた結果を,定常 RANS に おける壁表面特性として与えることでリブレットを再現し た.リブレット有無の比較と効果予測は、定常 RANS の範 囲内で行った.



Fig. 3 Scheme of riblet design process and correlation between simulation and experiment

3.2. 解析条件

解析メッシュは約950万である. リブレット断面形状は Fig. 4 に示すような最大 8 %の摩擦抵抗低減効果を持つ三 角形状のリブレットを仮定し, リブレットの適用箇所はコ ンプレッサー, ディフューザー, タービン翼, およびター ビンのプラットフォームとし, 3 部品ともにシュラウド部 には未適用とした.



Fig. 4 Assumed riblet cross-section in CFD

エンジンの運転条件は,事前評価の取得条件,実測結果 に即しており,回転数 80,624 rpm,密度は圧縮性流体とし て扱い,動粘度は温度依存の Sutherland 則に従うとした. それ以外の主要な解析条件は、エンジン空気流入量 0.21853 kg/s,同全温 299.45 K,同全圧 1018.10 hPa, タービン動翼へのGas 流入量 0.22368 kg/s,同全温 985.4 K,同流入角度34.54°,エンジン出口側の全温 299.45 K, 同全圧 1018.10 hPa とした.

3.3. ベースライン解析

前節の解析条件を用いた非定常 LES が,実測結果と一致 しているかを確認した.ディフューザー後の温度は,実測 382.15 K,シミュレーション 377.86 K となっており,良 く一致している.また,タービン後の温度についても,実 測の平均値 912.66 K と計測バラつき±13.19 Kの範囲にシ ミュレーション値は分布しており,こちらも良く一致して いる.これらのことから,実測結果と非定常 LES は良く一 致していると言える.

次に,非定常 LES と定常 RANS の結果が一致するか確認 した結果を Fig. 5 に示す.エンジンパフォーマンスで最大 約6%の差,空力性能で最大約3%の差が出ているが,全 体としては良く一致している.定常 RANS 結果はリブレッ ト無しのベースラインとして妥当である.



Fig. 5 Baseline simulation results without riblets by unsteady LES (MM) and steady RANS (MPM)

3.4. リブレット最適寸法とリブレットの効果予測

Fig. 6 に CFD によって導出されたリブレット最適寸法の コンターを示す. コンターは赤がリブレットピッチが広く, 青がリブレットピッチが狭い.

コンプレッサーとディフューザーのリブレットピッチは 10~100 µm 程度で,15~30 µm のピッチが半数以上を占め る.ブレード内の分布としては,周速度の早いエッジ付近 のリブレットピッチが狭い傾向がある.

タービンのリブレットピッチは,35~120 µm 程度であ る. 翼腹側(正圧面,燃焼器側)は40~60 µm のピッチが 半数以上を占めるが,背側(負圧面,テールコーン側)は ブレード根元に広いピッチが多く分布しており,45~ 120 µm 程度でほぼ均一に分布している.

これらのリブレットを適用した際のエンジン性能の改善 は、回転数 80,624 rpm,エンジン吸気量不変の条件におい て、3部品ともリブレットを付与した場合,推力が1.81% 改善,燃料消費量はほぼ変化無しとの予測を得た.



4 リブレットのレーザー加工

4.1. レーザー加工の概要

リブレットの加工にはレーザーアブレーション加工の開 発機を用いた.この模式図をFig.7に示す.このレーザー 加工機は,波長532nm(緑色),パルス幅約15ps,最大 繰返し周波数4MHz,最大出力50Wの短パルスレーザー を持つ.レーザー光は照射ヘッドに導かれ,ガルバノミ ラーによって同期してスキャンされる.レーザー光はfθレ ンズによって所定の位置に集光されるが,湾曲した翼表面 に沿って焦点を追随させることができる.照射ヘッドは3 軸ステージによって所定のXYZ位置に駆動でき,また加工 対象物は2軸の傾斜ステージ上で所定の姿勢を示現できる. レーザー光が集光した対象物の表面はアブレーションによ り除去され,これを連続的にスキャンすることでリブレッ トの溝が形成される.





前節で述べた CFD によるリブレット最適寸法を忠実に 再現するため,解析ノードごとのリブレットのピッチと方 向の情報から流線に沿ったリブレットのパスを生成した. これにより,一様でないリブレットピッチを持つ領域内で, 3次元的に計算された流線に沿った曲線上にリブレットを 形成できる.

4.2. リブレットの加工結果

最終的にコンプレッサー,ディフューザー,タービンの 3部品にリブレットのレーザー加工を施した. CFD 条件と 同様に,3部品とも共通して部品外側のシュラウド部は未 加工である.

コンプレッサーはブレードの負圧面と正圧面の一部とハ ブ面の一部に加工を行った.Fig.8にリブレットの加工済 みのコンプレッサーを示す.見た目の色の濃淡は、リブ レットピッチの変化による物である.ブレード間では共通 のリブレットデザインを適用しているため、結果として、 すべてのブレードで同じ濃淡が描かれている.コンプレッ サーブレードはお互いが接近しており、レーザーが照射で きない部分があるが、コンプレッサーを傾けるなど可能な 限り広い面積に加工を行った.コンプレッサーの空気流路 に対するリブレットの加工面積率は約50.3%である.なお、 前節の CFD による推力改善予測量1.81%は、上記加工面 積にリブレットを付与した場合の予測となっている.



Fig. 8 Compressor with lasered riblet

ディフューザーは15箇所有る空気流路内側に加工を行った. Fig.9にリブレットの加工済みのディフューザーを示す. 同様に色の濃淡はリブレットピッチの変化によるものであり,同じ濃淡が各流路内に描かれている.ディフューザーの 羽根にいくつか存在する穴は,エンジン組み立て用のネジ穴 で有り,このネジ部にはリブレットの加工は行ってない.

タービンは、ブレードの腹側(正圧面),背側(負圧面) の両面と、プラットフォームに加工を行った.Fig.10にリ ブレットの加工済みタービンを示す.表面に模様があるよ うに見えているが、模様の入り方はピッチの変化と良く一 致しており、これが見えているものと考えられる.前2部 品と見え方が異なるのは、材質が異なるためと考えられる (前2部品はアルミ系合金、タービンはインコネル).



Fig. 9 Diffuser with lasered riblet



Fig. 10 Turbine with lasered riblet

5 超小型ジェットエンジン実測評価

5.1. 評価方法の概要

エンジン性能の評価は、コンプレッサー、ディフュー ザー、タービンの3部品にリブレットが無い部品とリブ レットが有る部品を用意し、同じ日に部品を入れ替える方 法で評価を行った.上記3部品とタービンに付いている シャフト以外の部品は、燃焼室も含め共通で使用している. なお、これらの交換部品によるエンジン性能の差は、推力、 燃料消費量ともに計測再現性以下であることを確認してい る.また、リブレット有りの評価は、上記3部品すべてリ ブレット有りとする場合のみを評価した.

エンジンの運転条件は CFD 解析条件と同様で,回転数 80,624 rpm,燃料は灯油 (JIS K 2203 1号灯油) にシャフト ベアリング向け潤滑剤を約6%配合した物を使用した.吸 入空気は外気をそのまま使用しているため,吸気温度,気 圧は時間経過により変動してしまうが,リブレット有り/ 無しの比較検証実施時の平均値は吸気温度 305.53 k (32.38℃), 大気圧 1011.48 hPa であった.

5.2. 温度·気圧変動補正

1

前節にあるように,吸気は外気をそのまま使用している ため,気温変動,気圧変動によりエンジン性能が変化して 計測されてしまう.

そこで、気温、気圧の変動を、標準気温、標準気圧相当 に換算可能な以下の計算式を使用し、エンジン性能を比較 することにした.エンジン運転時の大気状態を気圧:P,温 度:Tとし、標準の大気状態を P_0 , T_0 とし、 δ = P/P_0 , θ = T/T_0 とすると、

⑧正回転数
$$N_0 = \frac{N}{\sqrt{\theta}}$$
 (1)

修正推力
$$F_0 = \frac{F}{\delta}$$
 (2)

修正燃料流量
$$mf_0 = \frac{mf}{\delta\sqrt{\theta}}$$
 (3)

と表すことが出来る [15], [16].

回転数についても、気温、気圧により修正後の回転数は 基準回転数では無い回転数となってしまう.これを基準回 転数の 80,624 rpm にそろえるため、別途 70,000 rpm と 90,000 rpm の計測データを取得し、推力と回転数の相関か ら、常に 80,624 rpm 相当に換算する補正を行った.

これらの内容を適用,計算した修正推力と,計測した生 データの推力との結果の比較をFig.11に示す.修正前の推 力値は約2.8%バラついているが,修正推力の計算後は 0.7%のバラつきに収まっており,修正計算が良く機能して いることが解る.



5.3. リブレット付与によるエンジン性能比較

エンジン性能は、修正推力、修正燃料流量、修正燃料効率(=修正燃料流量/修正推力)の3性能で比較を行った. 計測再現性確保のため、リブレット有り/無し共に、7回 計測を行っている.

リブレット有り/無しのエンジン性能の比較検証結果を Fig. 12 に示す. 修正推力は,7回計測の平均値で比較する と,リブレット有りが平均1.44%上昇との結果であった. このときの計測再現性は,7回平均時には3σ率で0.42%が 期待でき,計測再現性上も優位な差と言える.次に修正燃 料流量は,リブレット有りが平均で0.20%消費量が多いと の結果であったが,計測再現性は3σ率で0.34%であり,こ ちらは優位差無しと判断した.これらから計算した修正燃 料効率は,リブレット有りが平均で1.22%効率が良いとの 結果で,同様に計測再現性は,3σ率で0.59%が期待でき, こちらは優位差と言える.

上記の値と、CFD 予測を比較した結果をTable 1 に示す. 実測値と CFD 予測との差は、修正推力で0.37%、修正燃 料効率で0.59%である.修正燃料流量は、実測値が優位差 では無く、CFD 予想の"変化無し"との差は無いものと判 断した.修正推力および修正燃料効率における、実測値と CFD 予想との差の原因は、リブレットの加工結果が完全な 理想形状には成っていないことが考えられる.リブレット の深さや、リブレットの峰頂点のとがり具合など加工形状 のさらなる改善を行えば、さらにエンジン性能が改善する 可能性もある.全体としては、実測値は CFD 予測と近い 結果と考えられる.以上のように、比較検証を行った3性 能において、リブレットがエンジン性能、効率を改善して いるとの検証結果を得た.



Fig. 12 Results of verification of riblet effect by actual measurement

		Corrected	Corrected fuel flow rate	Corrected fuel efficiency
CFD		1.81%	0 %	1.81%
Measured value		1.44%	-0.20%	1.22%
	Measurement reproducibility 3σ	0.42%	0.34%	0.59%
CFD - Measured value		0.37%	0%	0.59%

Table 1 Riblet improvement effect (experimental value, measurement reproducibility, CFD forecast)

超小型ジェットエンジンのコンプレッサー,ディフュー ザー,タービンにリブレットを適用した場合の,エンジン 推力の改善効果および,最適なリブレット設計を CFD に より求めた.上記3部品ともにリブレットを適用した場合 には,推力は1.81%上昇すると予測された.リブレット設 計に従ってレーザー加工によりリブレットを施したコンプ レッサー,ディフューザー,タービンを超小型ジェットエ ンジンに搭載し,リブレット有無のエンジン性能を実測評 価した結果,修正推力は1.44%上昇,修正燃料流量は優位 差無し,修正燃料効率は1.22%効率が改善した.これらに より,複雑な形状で高温環境,高速に回転するターボ機器 内の部品へ,レーザー加工によりリブレットを形成し,そ の効果をターボ機器性能の改善として示すことに世界で初 めて成功した.

また、本評価の稼働時タービン温度は約800-900℃であ り、本稿の効率改善結果は、リブレット付与後トータル8 時間以上稼働後の評価結果である.本評価後のリブレット は形状が問題無く維持されていることを確認しており、ま たこれまで示したように、効率改善も十分確認出来ている. 我々が行った母材の強度特性試験では、600℃条件の引張試 験、クリープ試験において、リブレット有無では強度特性 に差が無いことが確認されており [14]、本稿評価のタービ ンとは材質、温度、負荷時間などが異なるものの、直接加 工のリブレットに強度的な問題がないことは同様の傾向と なっている.

これらのことから,高温,回転系の空力部品にリブレットを付与し,ターボ機器の効率を改善する事は,確実に実 用化に近づいていると考えられる.

7 謝 辞

本研究の評価データ取りには,(有)フォックスコーポ レーション 橋本様,遠藤科学(株)馬塚様に多大なるご協 力を頂きました.ここに感謝の意を表します.

引用文献

- [1] 稲崎慎也, 佐藤真路, 一ノ瀬剛, P.A. Leitl, A. Flanschger,
 S. Schreck and R. Benauer, "超小型ジェットエンジンの 最適リブレット計算とそのレーザ加工,およびエンジン 性能での効果検証," 第49回日本ガスタービン学会定期講 演会, A-25, 2021.
- [2] 三宅裕, "壁乱流の渦," ながれ, vol. 22, pp. 29-34, 2003
- [3] 鈴木雄二, 笠木伸英, "壁面乱流の知的能動制御," セー ブメーション・レビュー,マイクロフローセンサ特集号, pp. 50-57, 2001.
- [4] D. W. Bechert, G. Hoppe and W.-E. Reif, "On the drag reduction of shark skin," in *Proc. 23rd Aerospace Sciences Meeting*, 1985, doi: 10.2514/6.1985-546.
- [5] D. W. Bechert, M. Bartenwerfer, G. Hoppe and W.-E. Reif, "Drag reduction mechanisms derived from shark skin," in *Proc. 15th Congr. ICAS*, vol. 2, pp. 1044–1068, 1986.
- [6] "戦略的省エネルギー技術革新プログラム 省エネルギー技術開発事業の重要技術に係る周辺技術・関連課題の研究 革新的リブレットによる高速移動体の省エネルギー化技術 の調査研究,"成果報告書 2018年3月, NEDO, https://www. nedo.go.jp/library/seika/shosai_201803/2018000000035.html, 2018.
- [7] P. A. Leitl, V. Stenzel, A. Flanschger, H. Kordy, C. Feichtinger, Y. Kowalik, S. Schreck and D. Stübing, "Riblet surfaces for improvement of efficiency of wind turbines," in *Proc. AIAA Scitech 2020 Forum*, 2020, doi: 10.2514/6.2020-0308.
- [8] P. A. Leitl, E. Göttlich, A. Flanschger, A. Peters, C. Feichtinger, A. Marn and B. Reschenhofer, "Numerical investigation of optimal riblet size for TCF strut flow and their impact on the performance," in *Proc. AIAA Scitech 2020 Forum*, 2020, doi: 10.2514/6.2020-0307.

- [9] P. A. Leitl, M. L. Garcia De Albeniz and A. Flanschger, "Nano- and microstructured riblet surfaces for centrifugal industrial compressors," in *Proc. Conf. SUstainable PolyEn*ergy Generation and HaRvesting (SUPEHR), 2019, pp. 32-38.
- [10] A. Sareen, R. W. Deters, S. P. Henry and M. S. Selig, "Drag reduction using riblet film applied to airfoils for wind turbines," in *Proc. 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition*, 2011, doi: 10.2514/6.2011-558.
- [11] B. N. Chichkov, C. Momma, S. Nolte, F. von Alvensleben and A. Tünnermann, "Femtosecond, picosecond, and nanosecond laser ablation of solids," *Appl. Phys. A*, vol. 63, pp. 109–115, 1996.
- [12] M. C. Richardson, "New opportunities with intense ultrashort-pulse lasers," in *Proc. OPTICS, ELECTRO-OPTICS, AND LASER APPLICATIONS IN SCIENCE AND ENGI-NEERING*, 1991, doi: 10.1117/12.43608.
- [13] P. A. Leitl, S. Kuntzagk, A. Flanschger and K. Pfingsten, "Experimental and numerical investigation of the reduction in skin friction due to riblets applied on the surface of a Taylor-Couette cell," in *Proc. of AIAA SciTech 2019Forum*, 2019, doi: 10.2514/6.2019–1625.
- [14] 綿引健二,蘆田憲一,土橋晋太郎,土橋広和,佐藤真路, ーノ瀬剛,"ガスタービン圧縮機部材へのレーザー加工に よる、リブレット形成と機械特性評価結果,"第49回日本 ガスタービン学会定期講演会,B-27,2021.
- [15] 日本ガスタービン学会,ガスタービン工学,改訂第一版, 日本ガスタービン学会,2017.
- [16] 中村佳朗, 鈴木弘一, ジェットエンジン, 森北出版, 2004.

Stefan SCHRECK

Richard BENAUER

Bionic Surface Technologies 社

Bionic Surface Technologies 社

Bionic Surface Technologies

Bionic Surface Technologies

稲崎慎也 Shinya INASAKI 次世代プロジェクト本部 第二開発部 2nd Development Department Next Generation Project Division

Peter A. LEITL Bionic Surface Technologies 社 Bionic Surface Technologies

Andreas FLANSCHGER Bionic Surface Technologies 社 Bionic Surface Technologies













稲崎慎也 Shinya INASAKI

Peter A. LEITL

Andreas FLANSCHGER

Stefan SCHRECK

47

Richard BENAUER



綿引健二,蘆田憲一,土橋晋太郎,土橋広和

Riblet Formation by Laser Ablation on Gas Turbine Compressor Materials and Evaluation Results of Mechanical Properties

Kenji WATAHIKI, Kenichi ASHIDA, Shintaro TSUCHIHASHI and Hirokazu TSUCHIHASHI

圧縮機翼やタービン翼表面にリブレット形状を形成する事は、ガスタービンの効果率改善の可能性があるが、機械的 な強度特性への影響が懸念される.我々はレーザーアブレーション加工で、表面にリブレット形状を施した材料の強度 試験を実施した.引張強度およびクリープ特性への影響は見られなかったが、疲労強度の低下を確認した.その対策と して、コーティング施工とリブレット加工を組み合わせる手法の検討を行った.我々は、アルミ系の耐食コーティング やTIAIN 系の硬質コーティングを用いて作成したサンプルで評価を行い、疲労強度低減を抑制できる事を実験的に確認 した.適切なコーティングの選択と施工を行う事で、疲労強度低下を抑制して、リブレット形状を形成できると考えら れる.

Forming riblets on the surface of a compressor blade or turbine blade can improve a gas turbine's performance, but there is concern about detrimental effects on mechanical strength characteristics. We conducted strength tests on a material with riblets formed on the surface by laser ablation. No effect on tensile and creep properties was seen, but fatigue strength was decreased by riblet processing. To prevent fatigue strength reduction, we examined a method that combines coating and riblet processing. We evaluated samples prepared with either an aluminum-based corrosion-resistant coating or a TiAlN-based hard coating, and experimentally confirmed that the effect on fatigue strength can be reduced. It is proposed that selecting an appropriate coating, optimizing the coating method, and optimizing the process of riblet formation can yield performance improvements without sacrificing tensile, creep, or fatigue strength.

Key words ガスタービン、リブレット、レーザー加工、高サイクル疲労試験、コーティング gas turbine, riblet, laser processing, high cycle fatigue test, coating

はじめに

ガスタービンをはじめとする流体機器の効率の向上は大 きな課題の一つである.流体抵抗は圧力抵抗(慣性抵抗) と摩擦抵抗(粘性抵抗)に大別され,特に高レイノルズ数 の乱流領域においては,層流に比べて大きな壁面乱流摩擦 抵抗が発生する[2].乱流摩擦抵抗を低減させるために, 流体機器表面に微小な縦溝を施工する手法がある.リブ レット(riblet)と呼ばれる,サメの鱗[3],[4]のような 35~100 µm 程度の微小な縦溝が表面に存在すると,平滑面 に対して,8~10%程度の乱流摩擦抵抗低減を引き起こす ことが実験的にも明らかにされている[5].また,産業界 への応用に関して,風力タービン向けに金型を用いた樹脂 フィルムでリブレット形状を作成した事例がある [6].

我々は、上記のリブレット形状をレーザーアブレーショ ン加工により形成する技術を開発し、ガスタービンの圧縮 機やタービン翼への適用を検討している.レーザーアブ レーション (laser ablation) とは、ナノ秒、ピコ秒、フェ ムト秒のパルス幅を持つ極短パルスレーザーによって非熱 的に材料表面の物質を除去する技術である [7],[8].この 技術を用いて、任意の形状を材料表面に形成する事ができ る.また、ガスタービンの圧縮機やタービン翼には、各種 合金の他、金属・セラミックの様々なコーティングが用い られる [9],[10].レーザーアブレーション技術を用いれ ば、それら部材表面にも任意の微細形状のリブレットの直 接加工を行う事が可能である.我々は、これまでにリブ

^{*}本稿は、自著の引用文献[1]に対して実測と解析の乖離の要因、および実用条件を想定した場合の影響に考察を加えたものである。

レットの優位性の検証のため、金属性のタービン翼に直接、 流体解析(CFD)に基づいて設計したリブレットをレー ザー加工で形成し、その実測を行った。タービンテスト設 備の出口案内翼(静翼)にリブレットを形成した評価で、 リブレットによる圧損低減効果の実測を行った[11].また、超小型ジェットエンジンの各翼にリブレット加工を行い、推力や燃料効率の向上を確認した[12].

一方,材料表面にリブレットのような切欠きを形成する と,材料の強度特性の低下が懸念される.特に疲労強度は, 一般に表面の微小な切り欠き形状により影響を受ける事が 知られている [13].そこで,我々は圧縮機部材に直接リブ レット加工を施した試験片を準備し,引張・クリープ・疲 労試験を実施して,その特性を評価した.また,母材の疲 労強度低減の防止策として,コーティングにリブレットを 形成する手法を検討し,その加工の適用性と疲労強度特性 を評価した.本稿では,筆者らの評価結果 [1] に対して, リブレット形状による応力集中について追加評価結果と解 釈を加えたものである.

2 リブレット加工

リブレットの加工にはレーザー加工の開発機を用いた. Fig. 1 にその模式図を示す. このレーザー加工機は, 波長 532 nm (緑色), パルス幅約 15 ps, 最大繰返し周波数 4 MHz, 最大出力 50 W の短パルスレーザーを持つ. レー ザー光は照射ヘッドに導かれ, ガルバノミラーによって同 期してスキャンされる. レーザー光は f θ レンズによって 所定の位置に集光される. 加工対象物は 3 軸ステージに よって所定の XYZ 位置に駆動できる. レーザー光が集光し た対象物の表面はアブレーションにより除去され, これを 連続的にスキャンすることでリブレットの溝が形成される. 条件を制御する事でピッチや深さ, リブレット形状を制御 する事が可能である.



Fig. 1 Schematic diagram of a laser processing machine for forming riblets on the surface of an object

3 実験方法

3.1. 試験片

試験片は,各強度試験に合わせた形状の平板を用意して, そこにリブレット加工を施した.材質は圧縮機の前段側の 翼で用いられる SUS630 [9] を用いた.コーティングと組 み合わせた試験片には SUS304を用いた.試験片形状,加 工領域の模式図を Fig. 2 に示す.リブレット加工は,平行 部の 25 mm の領域に行い,ピッチと深さは,それぞれ 50 µm, 25 µm を目標値として加工を行った.この寸法は, 流体低減効果を確認しているものの中で,代表的なサイズ である.また,1本の試験片でリブレット加工の影響の有 無を評価するため,リブレット加工は片面にのみ行った.

リブレット形成後の疲労強度の低下対策として, Fig.3 に示す2種類のコーティングを検討した.リブレットのサ イズに対して十分に厚い膜のコーティングと,薄いタイプ である.薄いタイプはリブレット加工後にコーティングを 施工した.

厚膜のタイプは圧縮機翼のコーティングとして用いられ るものを用いた. 母材に Al 粒子を含んだ中間コーティング を塗布,中間コーティングにリブレット加工を実施し,そ の上からトップコーティング (~5 μm)を施工した.

薄膜のタイプは TiAlN 膜を用いた.一般に工具や刃物に 用いられる非常に高硬度のものである. Ti 合金へ施工し, ガスタービン向けへの検討例もある [14]. 母材にリブレッ ト加工を行ったあとに, PVD でコーティング (~3 μm)を 行った.リブレット加工した上に高硬度のコーティングを 施工する事で,表面のクラック生成を防ぎ,疲労強度を改 善できると考えた.なお,コーティングの施工条件によっ ては良好な疲労強度を示す結果が得られている [13].



Fig. 2 Dimensions of each strength test sample and riblet



(b) Riblet the base material and

then apply a coating

Fig. 3 Coating methods for test samples

3.2. 機械試験の条件

Table 1 に今回実施した機械試験項目と条件を示す. 各試 験は試験機関にて JIS Z2241, 2271, 2273に則り実施した. 圧縮機へのリブレット加工の適用を想定し,引張試験は室 温と600℃の2条件で実施した. クリープ試験は600℃, 200 MPaの条件で実施した. 高サイクル疲労試験の試験モード は軸方向荷重制御で,応力比は0,波形は sim 波である.

Test item	Test condition	Sample	
Tensile strength test	(1) RT	SUS630	
	(2) 600°C		
Creep strength test	600℃, 200 MPa		
High cycle fatigue test	RT.pulsating tension (Tensile)	(1) SUS630	
		(2) SUS304 without coatmg	
		(3) SUS304 with Al including coating	
		(4) SUS304 with TiAIN coating	

Table 1 Strength test condition

また,破壊メカニズム等の調査のため,試験後に光学顕 微鏡,走査型電子顕微鏡 (SEM)等を用いて破面の表面お よび断面観察を行った.試験片は,引張試験とクリープ試 験は SUS630で実施し,高サイクル疲労試験は SUS630と SUS304, SUS304にコーティングを施工した試験片を用意 し,計4条件で実施した.なお,各試験片で,リブレット 加工が有るものと無いものをそれぞれ用意して,試験を実 施した.

4 実験結果および考察

4.1. リブレット加工の適用性

Fig. 4 に SUS630にリブレット加工を行い、その形状を レーザー顕微鏡で評価した結果を示す. 目標値に対して、 深さがやや大きいが、ピッチ 50 µm で周期的な溝構造が形 成出来ている事が分かる.

同様に Fig. 5 にコーティングとリブレット加工を組み合

わせた試験片のリブレット形状を評価した結果を示す. コーティング前後の結果も載せている.いずれの試験片で も、周期的な溝構造が作成できており、コーティングの上 からでもリブレット加工が出来ている事が分かる.また、 コーティング前後の結果を見ると、2種類とも形状の差異 がほとんど見られず、リブレット加工後に薄膜をコーティ ングする手法でも、リブレットを形成する事が可能である 事が分かる.なお、試験片で、リブレット形状にバラつき があるが、加工条件を調整する事で、このバラつきは小さ くする事ができる.



Fig. 4 Microscopic profiles of lasered riblet SUS630 sample



Fig. 5 Microscopic profiles of lasered riblet SUS304 with and without coating sample

リブレット加工前後の断面を光学顕微鏡で観察した結果 を Fig.6 に示す.室温にて高サイクル疲労試験を実施した 後の破断部から離れた位置での観察結果である.リブレッ ト加工面の直下での金属組織の変化や,加工変質層などは 見られなかった.レーザーによる溶接や切断等,熱影響が 生じる加工では,強度が低下する事例が知られているが, リブレットの形成はアブレーション加工であるため,熱影 響が小さいことが伺える.

4.2. リブレット加工材の機械的特性

Fig. 7, Fig. 8 にリブレット加工有無の引張試験およびク リープ試験の結果を示す. 各試験とも N 数 3 で実施し, そ



Fig. 6 Metallographic observation of SUS630 stainless steel before and after riblet processing





(c) Strength (600°C) (d) Elongation (600°C)

Fig. 7 Tensile strength and elongation for with and without riblet



(a) Rupture time

(b) Rupture elongation



の平均値でグラフをプロットした.引張強さ,0.2%耐力, 伸びともにリブレット加工の有無で有意差は見られず,リ ブレット加工により引張特性の低下は見られなかった.

クリープ試験の結果を Fig. 8 に示す. 破断時間および伸びともほぼ同等の値を示し, リブレット加工によりクリー

プ特性の低下は見られなかった.

リブレット加工による疲労強度への影響は負荷応力を変 えて、破断までの繰り返し数を求め、S-N曲線を作成し、 10⁷サイクル以上の疲労限を求めた.その結果をFig.9に示 す.リブレット加工により、強度低下している事が分かる. なお、リブレット加工が有る試験片の試験応力の算出は、 試験片の厚みからリブレット加工深さ(約25 μm)分を除 いた値で算出した.



Fig. 9 Fatigue limits for with and without riblet SUS630 sample



Fig. 10 Fracture surface observation result of SUS630 samples



リブレット加工による疲労限が減少した要因を考察する ため、破面観察と応力解析を行った.結果をそれぞれ破断 Fig. 10, Fig. 11 に示す.リブレット加工がない試験片の破 面は、内部に平坦な脆性破壊部がわずかに認められ、それ以 外は大きく塑性変形が生じており、ほとんどが延性破壊を呈 していた.内部の介在物を起点として、クラックが発生、成 長して疲労破壊が生じ、その後、塑性変形を伴って破断し たと推測される.一方、リブレット加工が有る試験片では、 リブレット加工部と非加工部の境界で破断が生じていた. 破断の形態は直線的で、リブレットの溝に沿って脆性的に 破壊、その後は塑性変形を伴って破壊している事を確認で きた.次に応力解析から、リブレットの各底部で応力が集 中する事が分かった.また、最も応力が集中する部分は加 工の際部分であり、実験での破断位置と一致した.以上の 事から、リブレット形状による切り欠きにより、溝部で応 力集中が生じ、クラックが発生し、進展したと推測される.

4.3. コーティングとリブレット加工材の高サイクル疲労特性 コーティングとリブレット加工を組み合わせた材料の疲 労強度を調べた.その結果をFig.12に示す.試験応力を算 出するための試験片の厚みは、コーティング皮膜の厚さを 考慮せず、母材の値とした.また、SUS304試験片は、 SUS630の場合と異なり、リブレット加工深さは未考慮とし た.同条件で複数の試験片で試験を行った結果は、平均値 でグラフをプロットしている.コーティングを付与する事 で、疲労強度に違いが見られた一方で、リブレット有り・ なしの差は見られなくなった.

コーティングがない試験片の観察結果を Fig. 13 に示す. リブレット加工なしの試験片では,角部が起点となり,ク ラックが進展,その後,塑性変形を伴って破断している. 一方,リブレット加工が有る試験片では,破断位置は加工 部の境界で,リブレット溝部が起点となり,クラックが進 展,その後,塑性変形を伴って破断したと考えられる.応 力集中により,リブレット加工なしと比較して,早期にク ラックが発生,進展したため破断までの繰り返し数が低下 したと考えられる.



Fig. 12 Comparison of the number of cycles to fracture at 225 MPa stress amplitude of SUS304 samples

Fig. 14 に厚膜のタイプのコーティングを施工した試験片の観察結果を示す.リブレット加工有り・なし共に,破断

位置は試験片の中心付近であった. この形態はコーティン グなし・リブレット加工なしの結果と同様である. 破断部 付近はコーティングの剥離が生じていた. SEM 観察で,表 面に無数のクラックが生じていたが,そのクラックが母材 に進展している様子は見られなかった.

以上の事から, 試験初期にコーティングにクラックが生 じて, クラックが母材に進展することなく, コーティング の剥離が生じ, 母材表面が露出, その後, 破断したと推測 される. クラックの進展特性は, コーティングの種類や母 材との密着性で変化し, ヤング率の低いコーティングは進 展しにくいとされる [15], [16]. 今回, 用いたコーティン



Fig. 13 Fracture surface observation result of SUS304 without coating



Fig. 14 Fracture surface observation result of SUS304 with Al including coating

グは、表面にクラックが生じやすいが、母材との密着力が 比較的小さく、母材へのクラックの進展が生じなかったと 考えられる、なお、リブレット加工がない試験片で、コー ティング施工有り・なしを比較すると、コーティング施工 で疲労強度が若干低下している. 同様の例は古くから知ら れている[17]. 表面残留応力の変化. クラックの発生しや すいコーティングを付加した時など複数の要因が考えられ る. 今回のケースでは、コーティング施工過程内で残留応 力の変化もしくは界面の粗さの変化によるものと考える. 今回実施している疲労試験では引張応力を負荷しているた め、あらかじめ引張の残留応力が生じていると、その分、 疲労強度が低下する事が考えられる.後者は、粗さの変化 により、クラックの生成がしやすくなった事が考えられる. これらの要因を調査し、コーティング施工方法を適正にす る事で、疲労強度を維持し、リブレット加工を行う事が可 能であると考えられる.



Fig. 15 Fracture surface observation result of SUS304 with TiAIN coating

Fig. 15 に薄膜タイプのコーティングを施した試験片の観 察結果を示す.破断位置はリブレット有り・なしで異なり, リブレット加工がない試験片は中心付近.リブレットが有 る試験片は加工部の境界であった.SEM 観察より,リブ レット加工なしでは,コーティング部において,応力方向 に垂直な無数のクラックが観察され,一部は母材にまで進 展しているクラックも見られた.リブレット加工が有る試 験片では,リブレット溝部を中心にコーティングが剥離し ている様子が見られた.

コーティングを施工していなく、リブレット加工もない

試験片と比較すると,疲労強度が低下している.無垢の母 材表面よりも TiAIN コーティングは非常に硬く,延性が低 いため、母材の大きな変形に追従せず、クラックが生じ、 その後、一部のクラックが母材に進展し易くなったと考え られる.延性が異なるコーティングや、他の母材に適用す る事で疲労強度が改善する可能性があると考えられる.リ ブレット加工しても疲労強度がさらに低下しないのは、応 力集中部を含め、リブレット加工部の表面が硬質膜で保護 されたためと考える.

5 まとめ

レーザーアブレーション加工でリブレット形状を施した 材料の加工の適用性および強度評価を実施した. 金属表面 の他, アルミ系の耐食コーティングや TiAIN 系の硬質コー ティングにもリブレット加工が適用できることを確認した.

機械的特性に及ぼすリブレット加工の影響について,引 張およびクリープ特性への影響は認められなかったが,高 サイクル疲労強度は、リブレット形状により,応力集中部 が生じて低下した.その対策として、コーティング施工と リブレット加工を組み合わせる手法の検討を行った.その 結果、母材までクラックが進展しにくいコーティングにリ ブレット加工する手法、またはリブレット加工後にクラッ クが母材まで入りにくい薄いコーティングを付加する手法 により、疲労強度の低下を抑制できると考えられる.母材 との組み合わせを含む、最適なコーティングの施工方法の 開発を引き続き行っていく予定である.

引用文献

- [1] 綿引健二,蘆田憲一,土橋晋太郎,土橋広和,佐藤真路 ーノ瀬剛,"ガスタービン圧縮機部材へのレーザ加工によ る、リブレット形成と機械特性評価結果,"第49回日本ガ スタービン学会定期講演会,B-27,2021.
- [2] 三宅裕, "壁乱流の渦," ながれ, vol. 22, no. 1, pp. 29-34, 2003.
- [3] 鈴木雄二,笠木伸英,"壁面乱流の知的能動制御," セー ブメーション・レビュー マイクロフローセンサ特集号 (2001), pp. 50-57, 2001.
- [4] D. W. Bechert, G. Hoppe, W.-E. Reif, "On the drag reduction of shark skin," in Proc. 23rd Aerospace Sciences Meeting, 1985, doi: 10.2514/6.1985-546.
- [5] D. W. Bechert, M. Bartenwerfer, G. Hoppe, W.-E. Reif, "Drag reduction mechanisms derived from shark skin," in *Proc. 15th Congr. ICAS*, Sep. 1986, pp. 1044–1068.
- [6] A. Sareen, R. W. Deters, S. P. Henry, M. S. Selig, "Drag Reduction Using Riblet Film Applied to Airfoils for Wind Turbines," in Proc. 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace, doi:10.2514/6.2011-

558.

- [7] B. N. Chichkov, C. Momma, S. Nolte, F. von Alvensleben, A. Tünnermann, "Femtosecond, Picosecond, and Nanosecond Laser Ablation of Solids," *Appl. Phys. A*, vol. 63, no. 2, pp. 109–115, 1996.
- [8] M. C. Richardson, "New Opportunities with Intense Ultra-Short-Pulse Lasers," in *Proc. of SPIE*, vol. 1410, 1991.
- [9] 吉岡洋明, 土井裕之, 武田淳一郎, 難波浩一, 岡田郁生, 武浩司, 伊藤健之, "発電用ガスタービンの材料技術," 日本ガスタービン学会誌, vol. 32, no. 3, pp. 4-47, 2004.
- [10] R. Rajendran, "Gas turbine coatings An overview," *Engineer-ing Failure Analysis*, vol. 26, pp. 355–369, 2012, doi:10.1016/j.engfailanal.2012.07.007.
- [11] 白石雅之, 土橋晋太郎, 一ノ瀬剛, 柴崎祐一, P. A. Leitl, A. Flanschger, S. Schreck, R. Benauer, S. Pramstrahler, A. Marn, "タービンテストリグ出口案内翼への最適リブレッ ト効果予測と, そのレーザー加工によるリブレット性能 評価," 第49回日本ガスタービン学会定期講演会, A-24, 2021.

- [12] 稲崎慎也, 佐藤真路, 一ノ瀬剛, P.A. Leitl, A. Flanschger, S. Schreck, R. Benauer, "超小型ジェットエンジンの最適 リブレット計算とそのレーザ加工, およびエンジン性能 での効果検証," 第49回日本ガスタービン学会定期講演 会, A-25, 2021.
- [13] 日本機械学会, 金属材料 疲労強度の設計資料1, 改訂第
 2 版,東京:日本機械学会, 1982.
- [14] N. P. Sivagnanam Chandra, Y. Otsuka, Y. Mutoh, K, Yamamono, "Effect of coating thickness on fatigue behavior of TiAlN coated Ti-alloys," *International Journal of Fatigue*. vol 140, pp. 105767, 2020. doi:10.1016/j.ijfatigue.2020.105767.
- [15] 伊藤義康,斉藤正弘,石渡裕, "MCrAIY 合金コーティン グ部材の高サイクル疲労寿命特性,"溶接学会論文集, vol. 15, no. 2, pp. 359-364, 1997.
- [16] 伊藤義康,斎藤正弘,宮崎松生,"減圧プラズマ溶射皮膜の機械特性とき裂進展特性,"日本機械学会論文集 [A 編],vol. 60, no. 579, pp. 2538-2543, 1994.
- [17] 日本機械学会,金属材料 疲労強度の設計資料2,改訂第2 版,東京:日本機械学会,1984.

綿引健二 Kenji WATAHIKI 次世代プロジェクト本部 第二開発部 2nd Development Department Next Generation Project Division

蘆田憲一 Kenichi ASHIDA 次世代プロジェクト本部 第二開発部 2nd Development Department Next Generation Project Division

B

Kenji WATAHIKI

綿引健二



蘆田憲一 Kenichi ASHIDA

E.

土橋晋太郎 Shintaro TSUCHIHASHI



土橋広和 Hirokazu TSUCHIHASHI

土橋晋太郎 Shintaro TSUCHIHASHI 次世代プロジェクト本部 第二開発部 2nd Development Department Next Generation Project Division

土橋広和 Hirokazu TSUCHIHASHI 次世代プロジェクト本部 第二開発部 2nd Development Department Next Generation Project Division



高階知已, 伊藤 充, 長浦 仁, 若林英佑

Design of Curved Raycasting-based Interactive Surfaces in Virtual Environments and Its Application to an Immersive Photo Browser[†]

Tomomi TAKASHINA, Mitsuru ITO, Hitoshi NAGAURA and Eisuke WAKABAYASHI

3次元ユーザインタフェースが一般的になると、素早く操作でき信頼性の高い選択方法・操作方法が必要とされる. 我々は仮想空間の中でレイキャスティングを用いて操作する仮想ディスプレイ(インタラクティブ・サーフィス)が曲 率を制御できる曲面を持っているとして、その操作性を評価する.ユーザはヘッドマウントディスプレイを装着し、そ の中に見えるインラクティブ・サーフィスをハンドコントローラにより操作する.我々は操作にかかる時間と操作の精 度を様々な条件の曲面に対して調査した.異なる曲面の条件に対してのユーザの操作能力を調べるために、完全な平面 を含む異なる曲率を持った曲面を用いて実験を行った.実験結果から、表示面の曲率を変えることで、最も効果的な場 合には、完全な平面に対して28%精度が良く、15%高速にポインティングできることがわかった.この結果を応用し、 我々は、曲面に写真を配置する没入型写真ブラウザを設計・実装した.これらの結果は、一般的な2次元スタイルのア プリケーションにおいて、空中ポインティング機能を持った、曲面のインタラクティブ・サーフィスに適用することが 可能である.

As three-dimensional user interfaces become more popular, quick and reliable aerial selection and manipulation are desired. We evaluated a virtual curved display (interactive surface) with controllable curvature based on raycasting. The user operates the surface by pointing using a head-mounted display and grip-type controller. We investigated the operation speed and accuracy of curved interactive surfaces under various presentation conditions. To investigate the users' operation ability for different curved conditions, we experimented with multiple surface curvature radii, including completely flat conditions. The experimental results showed that varying the curvature of the display improved the pointing accuracy by 28% and the speed by 15% over the flat surface in the most effective cases. By utilizing the analysis results, we designed and implemented an immersive photo browser in which photos are placed on a curved surface. These findings can be applied to curved interactive surfaces with mid-air pointing for generic two-dimensional-style applications.

Key words 仮想空間, インタラクティブ・サーフィス, 仮想ディスプレイ, 空中ポインティング, レイキャスト, 写真ブラウザ virtual reality, interactive surface, virtual display, mid-air pointing, raycasting, photo browser

1 Introduction

Displays in a virtual environment (VE) provide a fully programmable workspace without the need for large physical spaces. The advantage of such virtual workspaces is that they allow us to adopt findings regarding operational efficiency from physical large screen display design [4]. Large workspaces display a large amount of information, however manipulation through the pointing interface is difficult. One of the solutions to these problems is to design a curved workspace [1], [2].

Although such large displays are difficult to operate, the raycasting technique can be used to interact with objects in a virtual world, which is advantageous compared to pointing in the real world [3], [6]. Therefore, we compared the operational efficiencies of flat and curved surfaces assuming that raycasting was used in VEs.

In this study, we evaluated curved virtual interactive sur-

[†] This paper is based on [5] and includes a new section for an application of the proposed method.

faces and investigated the effects of curvature, size, and presentation distance on operational efficiency. The operation was performed using ray casting to point away from the user. The design parameters were analyzed based on Fitts' law, which accounts for the amount of ray travel.

The remainder of this paper is organized as follows. First, we present a theoretical analysis of the operation time for flat and curved surfaces. Next, we describe experiments to evaluate the operational efficiency of the interactive surface with respect to pointing and clicking on position and size. We then introduce our implementation of an immersive photo browser based on the results of the experiments. Finally, we conclude this paper.

2 Operation Time Analysis by Fitts's Law

Shupp investigated the curvature of a real large display and found that users could operate it 30% faster than flat displays [4]. In a virtual world, a display shape can be designed without any physical restrictions.

We compared the operational efficiencies of flat and curved surfaces. We conducted a theoretical analysis of the time required to point to the leftmost and rightmost selective targets using Fitts's law: $T = a + b\log_2(1 + D/W)$. For the analysis of pointing via raycasting, the ray is controlled by changing the angle of the hand. Thus, we used *W* and *D* as the values converted into angles. Let T^f and T^c be the times required to point to the edge targets on a flat panel and curved panel, respectively. Fig. 1(a) and (b) show the schematics of flat and curved surfaces and the operations based on the assumption of one-dimensional movements. If we assume a = 0, the speedup of a curved surface can be expressed as

 $S^* = (T^{f} - T^{c})/T^{f} = 1 - \log (1 + D/W) / \log (1 + D/W).$



Fig. 1 Models for Interactive Surfaces. The user's operation angle is controlled by the curvature radius of the virtual surface.

3 Experiment

To evaluate the suitability of different shapes for an immersive interactive surface, we conducted within-subject experiments to investigate the effects of display size and curvature radius on the selection of a grid of visual objects. The participants were required to perform pointing tasks in a virtual space, as shown in Fig. 2. A virtual interactive surface with a grid was shown to each participant at a time (Fig. 3). The shape of the surface is defined by a combination of several parameters (Fig. 4). The grid had the same pitch in both the horizontal and vertical directions. The width was calculated from the height such that the aspect ratio tended to be 16:9. We employed grids of different sizes to vary the pointing difficulty.

The surfaces have the same arc length (corresponding to the width w of a flat surface) for different curvature radii r_c when the height is fixed. The viewing distance was also varied (Fig. 4(a)). To investigate the percentage of correct responses and the operation time for the user's average operation angle, the length of the presentation distance was varied to be longer and shorter than the minimum radius of curvature.

The participant sat on a chair, put on an Oculus Rift S, and held two Oculus Touch controllers, as shown in Fig. 2(b). The software for this experiment was implemented in Unity. Stimuli were provided to the participants as colored squares for each surface condition. Eight healthy adults (age, $38 \pm$ 10 years; gender, male) participated in the experiment.

The number of surface conditions is 90 $(3 \times 5 \times 2 \times 3)$. A surface was chosen in order from the combination table of the four attributes. Because the first factors vary the fastest (refer to Fig. 4(c)) in the combination table and flat conditions scatter in the surface sequence, a counterbalance on the factor of curvature radius was achieved. The stimuli were provided as defined in each experiment. We measured







Fig. 3 Participant's Perspective of Marginal Areas on the Interactive Surface: (a) Flat screen (b) Curved screen. The green target is the selective target.



Fig. 4 Surface Conditions for Experiments. (a) Curvature radii and distance are presented in all combinations. (b) The number of squares, width, and height vary as shown in the table (c).

the time from the appearance of the stimulus until the participant pressed the trigger button. If a participant pressed the trigger button while aiming the ray at a wrong square, we counted it as an error.

3.1. Experiment 1: Target Pointing without Search

The target squares repeatedly appeared at three fixed locations (left end, right end, and center as a reset position) of the center row. In this experiment, we measured the basic sensorimotor response for raycasting on a virtual surface. There were 540 trials (90 surface conditions \times 6 stimuli without centers) for each participant.

Fig. 5 shows the plots of the percentage of correct answers vs. curvature radius (r), and Table 2 shows the error ratios of Experiment 1. The larger the radius of the curvature, the larger the error ratio. For small squares (27×15 grid), the worst percentage of correct answers was 70% when the flat surface was operated from viewpoint A. This percentage could be improved to 98% using curved conditions (r = 12 or 16), which was an improvement of 28%. One reason for this is that the squares contain large perspective distortions in the edges when a flat screen is used (Fig. 3).



Fig. 5 Percentage of Correct Answers in Experiment 1

Table 1 Speedup by Curved Surface (27 × 15 grid)

Viewpoint	Time by Curved Surface [sec]	Time by Flat Surface [sec]	Speedup Measured [%]	Speedup Predicted [%]
А	$1.05 \pm 0.24 \ (r = 20)$	1.20 ± 0.47	12.8*	33.6
В	$0.95 \pm 0.18 \ (r = 16)$	1.00 ± 0.30	4.9	23.7
С	$0.87 \pm 0.20 \; (r = 16)$	1.02 ± 0.46	14.6*	14.0

 $a \pm b$ denotes that a is a mean and b is a standard deviation.

*denotes that it is significant at 5% level of significance by T-test.

Table 2 Average Error Ratios Obtained in Experiments 1 and 2 [%]

	r = 12	r = 16	r = 20	r = 30	flat
Experiment 1 (without Search)	1.2	1.8	2.3	4.3	8.2
Experiment 2 (with Search)	3.7	5.0	5.1	5.5	5.7

For the response time, the curvature radii of the shortest operation time were 20 (A), 16 (B), and 16 (C) for the smallest target size. We summarize the speedup from the flat surface along with the predicted speedup obtained by Fitts's law (S^*_c) in Table 1. Using a t-test, we confirmed that curved surfaces enable speedup in pointing operations. Fitts' law fitted well with the measured data from viewpoint C. Although the learning effect was included in the result by repeated actions, it is considered that the effect occurred on all factors equally, and we can regard the observed tendency as reliable.

3.2. Experiment 2: Target Pointing with Search

This experiment incorporates a target-seeking factor in addition to Experiment 1 to prevent the user from remembering the location of the target. For each surface condition, participants had to point to three targets. A target appeared in a position from a position sequence at a time, generated randomly for each surface condition, and was common among all participants. There were 270 trials (90 surface conditions \times 3 stimuli) for each participant. No reset was given in this experiment.

Table 2 lists the average error ratios in Experiment 2. The larger the radius of curvature, the larger the error ratio. This trend is consistent with that observed in Experiment 1.

As for the response time, the observed trends were different from those observed in Experiment 1. Although we omitted the details here, the flat condition was the fastest. There are two possible reasons: (a) the effect of seeking time for out-of-sight targets is large, and (b) difficulty varies between factors because each position sequence is generated randomly and short. In the next step, we need to improve the experiments carefully to address these issues.

4 Application: Immersive Photo Browser

The number of photos has been astronomically increasing with the introduction of modern technologies such as mobile devices, cloud photo storage, and high-speed continuous shooting. It is extremely difficult to search for and view photos because of this increase. Virtual reality (VR) can address this issue by providing portable large-screen environments.

Based on the evaluation experiment in the previous sec-

tion, we designed and implemented a prototype immersive photo browser. It is a suitable application for curved raycasting-based interactive surfaces because it provides a large display with quick and accurate operations.

We developed this application using Unity 2018. The users experienced this VR application using Oculus Rift S as the display and two Oculus Touch controllers as the gesture controllers. Representative features are described in this section.

4.1. Thumbnail Wall

A thumbnail wall is the basis of an immersive photo browser and is used to view a large number of photos simultaneously. We designed and employed a curved surface for the thumbnail wall based on the evaluation experiment described in Section 3. Users select photos of the thumbnail wall for various operations.

Fig. 6 shows an example of a thumbnail wall. Thumbnails at the edge of the wall can be observed to be of sufficient size because they include less perspective distortion with the advantage of a curved surface.

Users can move anywhere in this VE. Continuous navigation (i.e., a user continuously moving in a space) is intuitive, but it easily induces VR sickness. Continuous zooming operations, which are popular in smartphones, also induce VR sickness when used in VR environments.

Therefore, warp-type navigation (i.e., a user moving to a location in a discontinuous manner) should be the primary navigation method coupled with continuous navigation to smoothly adjust the viewpoint of the user.

In the warp-type navigation of an immersive photo browser, users can move to the front of a specified photo by pointing and pressing buttons with the right Oculus Touch controller. Fig. 7 illustrates the scene after moving to the front of the specified photo. For continuous navigation, users can move freely using the left Oculus Touch controller.



Fig. 6 Thumbnail Wall: A total of 1500 photos can be arranged on a wall. A user can view the whole wall naturally as they turn their head.



Fig. 7 View after Warping to the Front of a Selected Photo. Green lines show a selection and the cyan line is a ray extended from the user's hand.



Fig. 8 Photo Panel. Photos can be looked at closely in the immersive environment. A user can move photos freely and compare them in the space.



Fig. 9 Collaboration in the Immersive Photo Browser. The avatar of another user can be seen from the viewpoint of the user.



Fig. 10 Virtual Gallery in the Immersive Photo Browser. The photos were selected by pointing to the thumbnail wall and the layout can be adjusted freely.

4.2. Other Features

By pointing at a photo on the thumbnail wall and pressing the trigger button, users can closely view the photo (Fig. 8). Users can quickly move and resize a photo using an Oculus Touch controller.

Fig. 9 shows a scene in which a user collaborates with another user. This collaboration facility is useful in photorelated workflows, such as photo selection for magazine editing, photo galleries, and lectures. Users can also communicate using text chatting and voice chats.

Users can locate photos anywhere they desire to hold personal exhibitions in a virtual gallery (Fig. 10). In addition, users can invite their friends to this gallery.

Among all these features, pointing operations on a thumbnail wall are crucial and a curved interactive surface is considered significantly effective.

5 Conclusion

In this study, we designed experiments to evaluate raycasting-based interactive surfaces and measured the percentage of correct answers and the operation time when surface factors were changed in a VE. The results showed that in the curved surface condition, the percentage of correct answers improved in basic and realistic situations, and the operation time was shortened in situations without target-seeking activities.

These findings can be applied to two-dimensional-style applications, such as photo browsers and GIS. For future work, an experiment should be conducted to clarify the effect of out-of-sight target seeking and normalize the difficulty of the target-seeking task.

References

- A. Endert, L. Bradel, J. Zeitz, C. Andrews, and C. North, "Designing large high-resolution display workspaces," in *Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces*, AVI '12, pp. 58–65. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2012. doi: 10.1145/2254556.2254570
- [2] B. Gao, B. Kim, J. I. Kim, and H. Kim, "Amphitheater Layout with Egocentric Distance-Based Item Sizing and Landmarks for Browsing in Virtual Reality," in *International Journal of Human–Computer Interaction*, 35(10), 2018. doi: 10.1080/10447318.2018.1498654
- [3] J. Liu, A. Prouzeau, B. Ens, and T. Dwyer, "Design and evaluation of interactive small multiples data visualisation in immersive spaces," in 2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), pp. 588–597, 2020. doi: 10.1109/VR46266.2020.00081
- [4] L. Shupp, R. Ball, B. Yost, J. Booker, and C. North, "Evaluation of viewport size and curvature of large, high-resolution displays," in *Proceedings of Graphics Interface 2006*, GI '06, pp. 123–130. Canadian Information Processing Society, CAN, 2006.
- [5] T. Takashina, M. Ito, H. Nagaura, and E. Wakabayashi, "Evaluation of Curved Raycasting-based Interactive Surfaces in Virtual Environments," in 2021 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), 2021, pp. 534–535, doi: 10.1109/VRW52623.2021.00149
- [6] C. Wingrave and D. A. Bowman, "Baseline factors for raycasting selection," in *Proceedings of Virtual Reality International*, p. 10 pgs, 2005.

高階知已 Tomomi TAKASHINA 映像ソリューション推進室 Imaging Solution Development Department

伊藤 充 Mitsuru ITO 映像ソリューション推進室 Imaging Solution Development Department





高階知已 Tomomi TAKASHINA

長浦 仁 Hitoshi NAGAURA



若林英佑 Eisuke WAKABAYASHI

長浦 仁 Hitoshi NAGAURA 株式会社ニコンシステム Nikon Systems Inc.

若林英佑 Eisuke WAKABAYASHI 株式会社ニコンシステム Nikon Systems Inc.

領域別に適正露光制御可能な高ダイナミック レンジ1型 17 Mpixel 1000 fps 積層CMOS イメージセンサ

平田友希,村田寛信,有井 卓,松田英明,米持 元,手塚洋二郎,綱井史郎

A 1-inch 17 Mpixel 1000 fps Block-Controlled Coded-Exposure Back-Illuminated Stacked CMOS Image Sensor for Computational Imaging and Adaptive Dynamic Range Control[†]

Tomoki HIRATA, Hironobu MURATA, Taku ARII, Hideaki MATSUDA, Hajime YONEMOCHI, Yojiro TEZUKA and Shiro TSUNAI

人間の知覚を超えた,広い明暗差に対応かつ,高速高解像で画像取得可能なビジョンシステムを提案する.イメージ センサは観賞用カメラだけではなく,ロボットビジョンなど幅広い分野に使われている.例えば自動運転用途では,暗 いトンネル内や真夏の日差しの中で,動きに追従して高精細に,かつ高速に物体を認識する必要がある.

しかしながら、1つのカメラで明暗差のある移動被写体を撮る場合、高精細とフレームレート、画素サイズとダイナ ミックレンジ (DR) にトレードオフの関係があるため、すべての性能を満たすことは困難であった. 我々は、4 K×4 K の解像度で 1000 fps の読み出し動作が可能で、2.7 µm の微細画素でありながら 110 dB の DR を実現する高速ビジョ ンシステムを開発した. 具体的には、高 DR 手法として画素アレイを複数のブロックに分割して個別に露光時間を制御 する機能を採用し、ブロック毎に AD 変換器を並列配置することで高速読み出しを実現し、3 次元ウェハ積層技術によ り回路と画素を高密度に集積することでこれらの課題を克服した. 本システムは暗い箇所と明るい箇所が画面内に混在 するような高 DR が必要な用途に加えて、符号化露光 (Coded Exposure)を用いたコンピューテーショナルイメージ ングへの応用が期待される.

This study introduces a vision system that can acquire images at high speeds and high resolutions. It can handle wide differences in brightness beyond human perception. Image sensors are not only used in digital still cameras but also in a wide range of fields, such as robot vision. Object recognition and movement tracking at high speeds and high definitions are essential in automated driving systems, especially in dark tunnels or in the mid-summer sunshine. However, capturing a moving subject with a high contrast and achieving a high performance concerning all aspects is challenging because of the tradeoff between high definition and high frame rate, and pixel size and dynamic range (DR). We developed a high-speed vision system capable of 1000-fps readout operation at a resolution of 4K x 4K and achieving a DR of 110 dB and fine pixels of 2.7 µm. These characteristics were achieved simultaneously using coded exposure (CE), which divides the image plane into smaller blocks and controls the exposure time of each block individually. A high-speed readout was achieved by arranging analog to digital converters in parallel for each block. A high resolution was realized by integrating both circuits and pixels at a high density using three-dimensional wafer stacking technology. This system is expected to be applied to computational imaging using CE, in addition to applications that require high DR in which dark and bright areas coexist in a scene.

Key words ビジョンシステム、ブロック並列、積層型 CMOS イメージセンサ、高ダイナミックレンジ、高速撮影、符号化露光 vision system, block parallel, stacked CMOS image sensor, high dynamic range, high-speed imaging, coded exposure

1 Introduction

also increasingly expected to serve as intelligent systems with surrounding configurations. Coded exposure (CE) [1], [2] is a method applied in intelligent system approaches, and

Image sensors are not only used for taking photos but

[†] This paper was modified from reference [11], and results and discussions were added on artifacts and application examples.

thus various functions can be realized by selecting an integration variable in the plenoptic function. High dynamic range (HDR) can be realized when the integration variable is time. Various methods have been proposed to achieve HDR. A method, such as a lateral overflow integration capacitor (LOFIC), was introduced that could provide the plurality of detection capacitors [3]. In addition, another method was presented to prevent the photodiode saturation by adding low-sensitivity pixels [4]. However, various proposed methods require an enlarged pixel size. Alternatively, a high-speed readout, such as an array-parallel analog-todigital converter (ADC) structure [5], is useful for integrating multiple frames [6] to realize an HDR. However, it increases the noise level and requires a faster readout to reduce motion artifacts. To mitigate these adverse effects, a method was proposed in which a pixel array is divided into multiple blocks, and the signal integration time of each block is individually controlled [7]. In another method, CE was demonstrated using the pixel-level control of the exposure time [8]. However, in these methods, the readout path and control circuitry should be arranged within the same plane because these are unstacked sensors; thus, the pixel size is relatively large and high resolution is difficult to realize. Therefore, we designed a sensor that could simultaneously achieve a 4 K × 4 K resolution and a high-speed readout of 1000 fps. Using a stacked structure, we demonstrated the CE capability by individually controlling the exposure time for each block of the pixels.

2 Sensor Architecture

2.1. Block Diagram

Fig. 1 shows a conceptual diagram of the image sensor. This 1-inch image sensor has two layers: the top chip comprises BSI pixels with a 65-nm process and the bottom chip is used for signal processing; the layers are bonded to each



Fig. 1 Device structure

other. The highest-density area consists of two contacts per pixel. The top chip has a pixel array (H4224 × V4224, 2.7- μ m pitch), which is divided into H264 × V264 exposure control blocks with a basic unit of H16 × V16 pixels. The bottom chip has ADC circuits, logic circuits, high-speed interfaces (HS-IF), and H264 × V132 readout circuits (readout units), which are arranged directly below the pixels. Each readout unit corresponds to H16 × V32 pixels as a basic unit. Pixel signals are converted into parallel digital data using ADC circuits located in each readout unit. Binary conversion and correlated double sampling (CDS) operations are performed using the readout logic located in the bottom chip. Subsequently, signals are outputted through 48 channels of the HS-IF, which operates at 4.8 Gbps per channel.

2.2. Block Array Structure

Fig. 2 shows a diagram of the readout unit and two exposure blocks. Each pixel comprises a photodiode (PD) and five transistors. The reset transistor (RST) and select transistor (SEL) are controlled by a global pixel driver placed in the periphery of the bottom chip. Both the photoelectron transfer transistor (TX1) and PD reset transistor (TX2) are controlled for each block by the local pixel driver in the readout unit. The readout unit is composed of 16 column ADCs, a data transfer circuit, an integration time controller, and a local pixel driver. Moreover, ADC is a 12-bit single slope type, and the ramp signal and counter are supplied from the peripheral circuitry of the bottom chip. Each ADC is con-



Fig. 2 Exposure block and readout unit

nected to its corresponding pixels (1–32) via a vertical signal line and source followers (SF). The digital signal, converted in ADC, is transferred to the readout logic via the transfer path for each set of 16 columns.

2.3. Exposure Control

The exposure control has two operation modes. One is "No Skip Mode" for short exposure time less than one frame, and the other is "Skip Mode" for long exposure time more than one frame. Fig. 3 shows a simplified block diagram and timing chart of exposure control. The integration time controller comprises a row counter, address decoder, and four flip-flops that hold an exposure time register setting. The register has four bits per block, of which three are used to encode eight different exposure times within one frame. The remaining one bit is a mode select signal, used as a mask signal that skips the reading of photoelectrons. The register can be updated for each frame. TX2 is controlled using the AND logic applied to the eight exposure time settings and timing signal linked with the register. TX1 is controlled using the AND logic of the TX1SEL signal from the global control logic and TX1MASK signal. The local pixel driver, composed of a level shift circuit and driver circuit, scans pixels in a predetermined row based on the decode signal of the integration time controller and SEL signal. Each readout unit is associated with 32 rows of pixels, corresponding to two exposure blocks per frame. In the No Skip Mode, TX1 is sequentially controlled to cross two exposure blocks, and TX2 is independently controlled for each block according to the integration time, as presented by blocks (1,1) and (1,2) in Fig. 3. Short exposure times of one horizontal period or less can be achieved because the controls for TX1 and TX2 are independent. Skip Mode can

be realized by skipping the TX1 and TX2 operations using the mask signal, as presented by block (264,263) in Fig. 3. With the above configuration, the exposure time of each block is individually set by the integration time controller, and the rolling shutter reading of 16×32 pixels in each unit is performed simultaneously. Each block has an exposure time controller that includes the selection of two operations. The exposure table is changed for each frame. Thus, various exposure patterns can be created in a two-dimensional manner, resulting in HDR imaging.

3 Configuration of the Experimental System

Fig. 4 shows the system configuration. This system comprises a camera head, camera control unit, and host computer (PC). The camera head has a lens unit and image sensor board. The camera control unit is composed of two field programmable gate arrays (FPGA) and a power supply board and functions to control the image sensor, supply power, and receive image data. The PC controls the entire system, processes, and then saves the images.

The image data from the sensor are inputted to each FPGA in the camera control unit via 24 channels at a time. The FPGA adjusts the data rate and data width and transfers data to the PC through the optical fiber.

To calculate the exposure time of each block, we prototyped two types of systems according to the application. The first system is to calculate the exposure time in FPGAs in the camera control unit, assuming that the subject moved at a high speed. The exposure value can be updated in every 8 frames by calculating the exposure value using the pipeline operation without a frame memory. The second system is to



Fig. 3 Block exposure control structure and timing chart



Fig. 4 Camera system architecture

calculate it in PC. More advanced and precise exposure control is possible in case of considering the surrounding blocks or multiple frames.

4 Results and Discussion

4.1. Coded Exposure

Fig. 5 presents the experimental results of CE. To generate an exposure table, the original image was first divided into blocks of 264×264 , and the average value of each block was converted into 3-bit gradation data. Subsequently, the exposure time was set from 1/128 to 1 ms corresponding to the 3-bit data. The photography was performed on a light box without patterns under a uniform illumination using the exposure table. The block exposure method can produce a coded image in a single shot. Furthermore, setting the exposure time frame-by-frame or across frames yields various coded patterns.

4.2. HDR Imaging

Fig. 6 shows the experimental results for an HDR. The image shown on the left side was obtained by exposure bracketing, which is a conventional technique of taking multiple shots with different exposure times. Moreover, dynamic range (DR) of each image was relatively small where blackouts and whiteouts occurred. Therefore, many images were required, which required a long time to capture. The image on the right side is a HDR image acquired with CE using this sensor and calculated in PC. The sensor was driven at 1000 fps, and the post-processing system and integration



Fig. 5 Experimental results of CE



Fig. 6 Experimental results of HDR
time operated in every 16 frames. Image acquisition was performed by changing the exposure time for each block based on the exposure table, indicated by time value (TV), which logarithmically defines the exposure time. The calculation performed multiplication and addition processing of the acquired image according to the TV. Consequently, images with a total of 11 exposure stops can be acquired at a high speed by setting the exposure time for 7 stops within one frame and 4 stops for over a period of 16 frames.

Considering the block steps, if the exposure times of the adjacent blocks are different, the signal-to-noise ratio (SNR) steps occur at the boundary of the blocks. To mitigate the block steps, smoothing the number of stops of the exposure time between adjacent blocks is preferable. In addition, the SNR can be improved by adding multiple frames to the blocks with a short exposure time.

4.3. HDR Tracking for Moving Object

Fig. 7 shows the results of the responsiveness of exposure control to a moving object. The sensor was operated at 1000 fps and an object moved horizontally on the screen. The image on the left was captured without an exposure control. When the object dashes from the dark to bright area of frame #345 with respect to the initial state of frame #1, the characters on the body are oversaturated. The results of dynamic exposure control in every 8 frames are demonstrated on the right side. Updating the exposure table in every 8 frames suppresses the oversaturation of characters on the body and realizes an HDR image.



(b) w/ CE (update exposure time every 8 frames) Fig. 7 Experimental results of exposure tracking

4.4. Sensor Specifications

Table 1 presents a comparison between the performance of our sensor with that of other sensors presented in the existing studies. At first, our developed sensor achieves high speed readout with a resolution of 17 Mpixel. In addition, this paper demonstrates HDR with small pixel of 2.7-um pitch. The total power of the sensor was 7.4 W at 1000 fps. The chip micrograph is shown in Fig. 8. Both chips were fabricated using a 65-nm process.

4.5. More Applications Using Coded Exposure

Fig. 9 shows an application that overlays the information

 Table 1
 Sensor specifications

	This work	IISW2019 [3]	ISSCC2020 [4]	VLSI2017 [5]	IISW2015 [7]	ISSCC2019 [8]
Process	Stacked BSI Top: 65nm Bottom: 65nm	BSI 65nm 1P4M	Stacked BSI Top: 90nm/65nm 1P4Cu Bottom: 40nm 1P6Cu1AL	Stacked BSI Top: 90nm 1P4M Bottom: 55nm 1P7M	FSI 0.18µm 1P4M	0.11µm
HDR technology	Integration time controllable for each block	LOFIC	Sub-pixel	-	Integration time controllable for each block	Integration time controllable for each pixel
Number of pixels [Mpix]	17.8	0.6	5.7	4.1	0.4	0.05
Pixel pitch [µm]	2.7	2.8	3.0	4.8	5.0	11.2
Bit depth [bit]	12	-	12	-	-	-
Frame rate [fps]	1000	-	30	630		25
Conversion gain [µV/e-]	161	10 (Low) 160 (High)	6.7 (Low) 197 (High)	65	-	-
Random noise [e-]	2.9	-	0.6	4.2	-	-
Sensitivity [ke-/lux · s]	20.7	-	38.0	28.4	-	1-1
FWC[ke-]	7.4	120.0	165.8	-	-	-
Dynamic-range [dB]	110 @ 1 frame 134 @ 16frames		132	-	120	-



Fig. 8 Chip micrograph



Fig. 9 (a) Experimental results of the overlay information on the real image and (b) an application example of CE

on a real image. Encoding the exposure time for each region implies that an arbitrary virtual pattern can be generated in the image. The experimental result is shown in Fig. 9(a). The photograph on the upper left shows the actual subject. The lower left figure presents an image of the exposure table, where a pseudo image is formed by expressing eight different exposure settings as gradations. The dark area indicates a short exposure, whereas the bright area indicates a long exposure. The results obtained using this exposure map are illustrated on the right side. It can be observed that a virtual image is embedded in the subject in the real space. In addition, this exposure table is created based on an actual subject; that is, it can also be used as an image-recording function.

Fig. 9(b) shows an application, where it is possible to embed tag information or a head-mounted display for virtual or augmented reality [9], [10]. Overlaying them on the image sensor reduces the processing power of the subsequent system and improves latency.

5 Conclusions

In this study, we have newly developed a CMOS image sensor with a stack structure that operates at 1000 fps while having a high resolution of 17 Mpixel with small pixel of 2.7-um pitch. By using the block-wise coded exposure function, 110 dB DR is achieved at 1000 fps in a single frame, and 134 dB DR in 16 frames. This vision system can be applied to various computational imaging using the coded exposure function, in addition to high dynamic range imaging in scenes where dark and bright areas of the subject are mixed in the frame.

Acknowledgements. The authors would like to thank all engineers at the Nikon Corporation Advanced Technology Research & Development Division, Opto Device Development Center, and Mathematical Sciences Research Laboratory for their support in this work.

References

- R. Raskar, et al., "Coded exposure photography: Motion deblurring using fluttered shutter," *ACM SIGGRAPH* 2006 Papers, SIGGRAPH '06, 2006, pp. 795–804.
- [2] Y. Hitomi, et al., "Video from a single coded exposure photograph using a learned over-complete dictionary," *IEEE ICCV*, 2011, pp. 287–294.
- [3] K. Miyauchi, et al., "A high optical performance 2.8 μm BSI LOFIC pixel with 120ke FWC and 160 μV/e conversion gain," in *Proc. Int. Image Sensor Workshop*, 2019.
- [4] Y. Sakano, et al., "A 132dB single-exposure-dynamic-range CMOS image sensor with high temperature tolerance," in *IEEE Int. Solid-State Circuits Conf. (ISSCC) Dig. Tech. Papers*, San Francisco, CA, USA, Feb. 2020, pp. 106–108.
- [5] T. Takahashi, et al., "A 4.1Mpix 280fps stacked CMOS image sensor with array-parallel ADC architecture for region control," in *Proc. IEEE Symp. VLSI Circuits*, Jun. 2017, pp. 244–245.
- [6] S. Velichko, et al., "140 dB dynamic range sub-electron noise floor image sensor," in *Proc. Int. Image Sensor Workshop*, 2017.
- [7] A. Peizerat, et al., "A 120dB DR and 5µm pixel pitch imager based on local integration time adaptation," in *Proc. Int. Image Sensor Workshop*, 2015.
- [8] N. Sarhangnejad, et al., "Dual-tap pipelined-code-memory coded-exposure-pixel CMOS image sensor for multiexposure single-frame computational imaging," in *IEEE Int. Solid-State Circuits Conf. (ISSCC) Dig. Tech. Papers*, San Francisco, CA, USA, Feb. 2019, pp. 102–104.
- [9] J. Wang, et al., "Augmented reality navigation with automatic marker-free image registration using 3-d image overlay for dental surgery," *IEEE Transaction on Biomedical engineering*, 2014, vol. 61, no. 4, pp. 1295–1304.
- [10] H. Hile and G. Borriello, "Positioning and orientation in indoor environments using camera phones," *IEEE Computer Graphics and Applications*, 2008, vol. 28. no. 4, pp. 32–39.
- [11] T. Hirata, et al., "A 1-inch 17Mpixel 1000fps block-controlled coded-exposure back-illuminated stacked CMOS image sensor for computational imaging and adaptive dynamic range control," in *IEEE Int. Solid-State Circuits Conf. (ISSCC) Dig. Tech. Papers*, Feb. 2021, pp. 120–121.

平田友希 Tomoki HIRATA 先進技術開発本部 光デバイス開発センター Opto Device Development Center Advanced Technology Research & Development Division

村田寛信 Hironobu MURATA 先進技術開発本部 光デバイス開発センター Opto Device Development Center Advanced Technology Research & Development Division

有井 卓 Taku ARII 先進技術開発本部 光デバイス開発センター Opto Device Development Center Advanced Technology Research & Development Division

松田英明 Hideaki MATSUDA 先進技術開発本部 光デバイス開発センター Opto Device Development Center Advanced Technology Research & Development Division

0

平田友希 Tomoki HIRATA



村田寛信 Hironobu MURATA



有井 卓 Taku ARII



松田英明 Hideaki MATSUDA

米持 元 Hajime YONEMOCHI 先進技術開発本部 光デバイス開発センター Opto Device Development Center Advanced Technology Research & Development Division

手塚洋二郎 Yojiro TEZUKA 先進技術開発本部 光デバイス開発センター Opto Device Development Center Advanced Technology Research & Development Division

網井史郎 Shiro TSUNAI 先進技術開発本部 光デバイス開発センター Opto Device Development Center Advanced Technology Research & Development Division

手塚洋二郎

Yojiro TEZUKA



米持 元 Hajime YONEMOCHI



綱井史郎 Shiro TSUNAI

エシェロンミラーを用いた高スループットな テラヘルツ分光ラインイメージング

浅井 岳,秦 大樹,原田真太郎,笠井達基,嵐田雄介,片山郁文

High-throughput Terahertz Spectral Line Imaging using an Echelon Mirror[†]

Gaku ASAI, Daiki HATA, Shintaro HARADA, Tatsuki KASAI, Yusuke ARASHIDA and Ikufumi KATAYAMA

本研究では、エシェロンミラーを用いたシングルショットテラヘルツ(THz)分光法と位相オフセット電気光学検出 を組み合わせることにより、広帯域スペクトル情報を高感度に取得するテラヘルツ分光ラインイメージングを提案する. 計測用カメラの単一ラインから得られるテラヘルツ帯スペクトル情報に対して、約40dBの信号対雑音比が得られ、1.2 kV/cmのピーク電場強度で最大2THzの帯域を検出できることを確認した。ラインイメージングにおける空間分解能 は、テラヘルツ波のスペクトル成分ごとに回折限界程度であることが確認されている。今回提案したテラヘルツ分光ラ インイメージングシステムにおいてサンプルを高速にスキャンすることで、二糖類(ラクトース、スクロース)の錠剤 の成分分析・イメージングや樹脂サンプル等の膜厚・形状計測が可能となり、高いスループットで分光イメージングが 可能であることを示した。

This work demonstrates terahertz (THz) line imaging that acquires broadband spectral information by combining echelon-based single-shot THz spectroscopy with high-sensitivity phase-offset electrooptic detection. A signal-to-noise ratio of approximately 40 dB is obtained for a THz spectrum from a single line of a camera with a detection bandwidth of up to 2 THz at the peak electric-field strength of 1.2 kV/cm. The spatial resolution of the image is confirmed to be diffraction limited for each spectral component of the THz wave. We use the system to image sugar tablets (lactose, sucrose) and film thickness/shape measurement of resin samples through a shield by quickly scanning the sample, which illustrates the capacity of the proposed spectral line imaging system for high-throughput applications.

Key words テラヘルツ波, 超高速分光, イメージング, 非破壊検査, 高感度検出 terahertz wave, ultrafast spectroscopy, imaging, non-destructive inspection, high sensitivity detection

1 Introduction

Terahertz (THz) imaging is one of the most important applications of THz science and technology. It can be used to map materials that are difficult to distinguish using other frequency regimes [1], [2]. The material properties that can be detected using THz imaging include polymorphisms of organic materials [3], strain in rubbers [4], refractive indices of chemicals and proteins [5], [6], pigments in artificial paints [7], carriers in semiconductors [8], and foams in polymeric materials [9]. For these imaging applications, researchers have used THz cameras from microbolometers [10], THz CMOS cameras [11], and up-conversion to the near-infrared or visible range [12], etc. Although spectral information is fundamentally crucial for this technology, obtaining complete spectral information using these techniques is difficult and time-consuming.

An advanced technique for THz imaging is THz timedomain spectroscopy (THz-TDS), which uses ultrashort laser pulses and offers an important advantage over competing techniques [13], [14]. Because THz-TDS acquires the full temporal waveform of the THz transients, it can provide a precise broadband spectrum. However, increasing the measurement throughput is difficult because the temporal domain must be scanned to acquire the full waveform of the THz pulses, in addition to the spatial dimensions normally required for THz imaging.

Recently, significant efforts have been devoted to circumvent this difficulty by developing single-shot THz-TDS [15] – [17]. Yasui *et al.* used oblique crossings of THz waves and

⁺ This paper was modified from reference [27] and added the result of thickness imaging of resin films as Fig. 5.

probe pulses in an electro-optic (EO) crystal to demonstrate single-shot THz line imaging [18]. However, the obliquecrossing technique requires a large EO crystal to map out sufficient temporal information; more importantly, the temporal information can be distorted by spatial inhomogeneities in the EO crystal and/or by scattered THz waves because different temporal information comes from different parts of the crystal.

The reflective echelon technique uses a stair-step mirror to map the temporal information to spatial positions on the mirror and allows us to focus the probe pulses on the EO crystal, which can reduce the distortion of the temporal waveforms [19], [20]. THz-TDS in a pulsed magnetic field and Kerr-gate spectroscopy have already been demonstrated using this method and have illustrated the precise acquisition of the temporal waveform and the corresponding spectrum [21]–[23]. In this study, we combine this technique based on an echelon mirror with a phase-offset method to enhance electric-field detection [24], and we implement the system in an imaging system to realize high-throughput line imaging.

2 Experiments

Fig. 1 summarizes the system used in this study. We used a Ti: sapphire regenerative amplifier with an output power of 1 mJ, center wavelength of 800 nm, and repetition rate of 1 kHz to generate and detect THz waves. Part of the laser output was used to pump the LiNbO₃ prism with a wavefront tilt to efficiently generate an intense THz wave [25], [26], which was subsequently collimated by using a spherical lens



Fig. 1 Experimental setup for THz spectral line imaging using an echelon mirror. TL: THz Tsurupika lenses, TCL: THz cylindrical lens, CL: cylindrical lenses, EOC: electro-optic crystal, Pol: polarizers, QWP: quarter wave plate.

placed after the LiNbO₃ prism and linearly focused onto the sample with a cylindrical lens. Next, the THz image of the sample was transferred to the detection EO crystal, which detected the birefringence induced by the THz electric field and spatial distribution.

The remaining laser output of approximately 50 mW was used to probe the electric field distribution on the EO crystal, which was 1-mm-thick (110) ZnTe. The probe was reflected from an echelon mirror with a step width of 25 µm and step height of 2.5 µm, and linearly focused onto the crystal to cover the focal line of the THz wave. The number of steps on the echelon surface was 750. Because each segment of the echelon mirror reflects the probe pulse at different delay times (see inset of Fig. 1), the temporal information is mapped to the horizontal axis of the THz camera (16 bit, 2560×2160 pixels with a pixel size of $6.5 \times 6.5 \ \mu m^2$; full-well capacity of the camera was 30000 e-) upon imaging the echelon surface onto the camera. We used a set of cylindrical lenses after the EO crystal to image spatial information in the vertical direction. Using these setups, our system becomes scanless in THz spectral line imaging, which conventionally requires 2D scanning.

Because the THz pulses are linearly focused in our system, the electric field strength at the focus is less than that in other THz-TDS systems that use tightly focused THz pulses. To compensate for this reduced electric field strength, we enhanced the sensitivity of the EO sampling to obtain line imaging with a large signal-to-noise ratio (SNR). Here, we used the phase-offset method in the detection setup [24], and placed an EO crystal between the crossed polarizers and quarter wave plate with a slight offset rotation.

To describe the detection mechanism, we first write the Jones vector E_{in} of the incident probe pulse as:

$$E_{\rm in} = \begin{pmatrix} E_{\rm x} \\ E_{\rm y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{1}$$

The Jones matrix of modulated EO crystal is

$$J_{\rm EO} = \begin{pmatrix} \cos\frac{\Delta}{2} & i\sin\frac{\Delta}{2} \\ i\sin\frac{\Delta}{2} & \cos\frac{\Delta}{2} \end{pmatrix},\tag{2}$$

where Δ is the THz field-induced phase difference between the probe pulses. The Jones matrix of the offset quarter wave plate is

$$J_{\frac{\pi}{4}} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\frac{\pi}{4}} & 0\\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{4}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$
(3)
$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1+i\cos2\theta & i\sin2\theta\\ i\sin2\theta & 1-i\cos2\theta \end{pmatrix},$$

where θ is the angle of rotation in the 001 direction of the EO crystal. After the crossed analyzer polarizer, the output signal is

$$\begin{split} E_{\text{out}} &= J_{\text{pol}} J_{\frac{\pi}{4}} J_{\text{EO}} E_{\text{in}} \\ &= \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 + i \cos 2\theta & i \sin 2\theta \\ i \sin 2\theta & 1 - i \cos 2\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\Delta}{2} \\ i \sin \frac{\Delta}{2} \end{pmatrix} \qquad (4) \\ &= \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ i \sin 2\theta \cos \frac{\Delta}{2} + i \sin \frac{\Delta}{2} + \cos 2\theta \sin \frac{\Delta}{2} \end{pmatrix}. \end{split}$$

The intensity of the signal is then

$$I(\theta, \Delta) = \left| E_{\text{out}} \right|^2$$

= $\frac{1}{2} \left| E_0 \right|^2 \left(\sin^2 2\theta \cos^2 \frac{\Delta}{2} + \sin^2 \frac{\Delta}{2} + \sin^2 \frac{\Delta}{2} + \sin^2 \theta \sin \Delta + \cos^2 2\theta \sin^2 \frac{\Delta}{2} \right).$ (5)

To eliminate the quadratic terms in this equation, we subtracted the data with the opposite phase offset to obtain

$$\frac{I(\theta,\Delta) - I(-\theta,\Delta)}{I(\theta,0)} = \frac{\Delta I}{I(\theta,0)} = \frac{2\sin\Delta}{\sin2\theta}.$$
 (6)

This equation ensures a one-to-one correspondence between the signal intensity and the electric field strength. Furthermore, enhancing the sensitivity of the measurement is possible by only changing the rotation angle θ of the QWP.

$\boldsymbol{\boldsymbol{\beta}}$ Results

Fig. 2(a) and 2(b) show the images obtained with the THz pulses at phase-offset angles of $+ 2^{\circ}$ and -2° , respectively, with an exposure time of 50 ms. The images clearly show the THz pulses forming into a stripe pattern, with the two offset angles producing opposite polarities. Fig. 2(c) and 2(d) show the linear profiles taken along the 700th line of the images shown in Fig. 2(a) and 2(b), respectively, produced by calculating

$$\Delta I / I = (I_{\text{THzon}} - I_{\text{THzoff}}) / I_{\text{THzoff}}.$$
(7)

Using Eq. (6) to estimate the electric field, we subtracted the waveform with a negative phase offset from that with a positive phase offset to calculate the electric field strength, as shown in Fig. 2(e). Although the data were from a single line of the camera with no spatial averaging, the THz waveform obtained had a reasonable SNR.

Owing to the phase-offset method, we can use the full

dynamic range of the camera for THz detection to enhance sensitivity. In contrast, if we use the QWP set at 45° for detection, as in the normal EO sampling method, we can use only 5% of the dynamic range, which results in a much worse SNR (typically 20 dB lower than SNR of the phase offset method if the THz electric field strength is similar to this work). Further enhancing the SNR may be possible if we simultaneously obtain signals with positive and negative phase offsets [16], [22]. The single-shot acquisition of an image can be demonstrated if we use a much higher power for the probe, although the data are not shown here.



Fig. 2 THz spectral line imaging. Images taken with phase offset of (a) + 2° and (b) -2°. (c) and (d) are the vertical line profiles of the images shown in panels (a) and (b), respectively. (e) THz waveform obtained by subtracting the data of panel (d) from that of panel (c). (f) Fourier transform of panel (e).

Fig. 2(f) shows the Fourier transform of the line shown in Fig. 2(e). The spectrum of the THz wave clearly indicates that spectroscopy is possible for each pixel of the camera up to 2 THz. The SNR of this line reached 40 dB, which is very promising for THz line imaging with spectroscopic resolution. The SNR is determined primarily by the shot noise of the camera. The maximum count of the image can be set to approximately several 10000, which leads to an SNR of 100 for the electric field strength, and, thus, 40 dB for the intensity spectrum. Note that vertically averaging over several lines within the diffraction limit further increases the SNR. The results clearly demonstrate the possibility of enhancing the throughput of THz imaging because we only need to scan one dimension (horizontal direction in our setup) to obtain full 2D information on the transmitted THz waveform at each point of the sample. The spectroscopic information acquired by this system allows us to both analyze materials with different characteristic THz absorptions and investigate the modifications of the spectrum in the THz range.

To demonstrate and characterize the imaging performance of the system, we measured the spatial resolution of the imaging system by blocking one part of the object plane with a metal plate. Fig. 3(a) shows a typical result of such an experiment, with the metal plate blocking part of the vertical extent of the image to characterize the spatial resolution in the vertical direction. In addition to the vertical lines that correspond to the incident THz pulses, we observed several non-vertical lines that originated from the edges of the metal plate. These correspond to THz pulse diffraction from the edge of the metal plate and the formation of interference patterns.



Fig. 3 (a) THz line image acquired with a metal plate blocking the bottom half of the object plane. (b) Vertical line profile of the measured THz wave at 1 THz. (c) Vertical and (d) horizontal spatial resolutions as a function of frequency estimated from the fitting shown in (b). Blue triangles, green rectangles, and red circles are the estimated spatial resolutions when the metal plate was placed just at the focus of the THz wave (0 mm), 5 mm, and 10 mm closer to the TCL, respectively. The solid line is the calculated spatial resolution considering the numerical aperture (0.3) of our setup.

The spatial resolution was estimated by fitting the vertical profile for each frequency component using the error function

$$I_0\{1 + \exp[2\sqrt{\ln 2}(x - x_0) / d]\} / 2,$$
(8)

as shown in Fig. 3(b), where x_0 is the central position of the THz wave, I_0 is the THz intensity, and *d* is the spatial resolution of the system. To characterize the horizontal resolution, we scanned the metal plate horizontally and examined the decrease in spectral intensity as a function of the position of the metal plate. The data were fitted to an error function to estimate the horizontal spatial resolution.

Fig. 3(c) and 3(d) show the vertical and horizontal spatial resolutions estimated from the width of the error function as a function of frequency. The black curve represents the diffraction limit of the system, calculated by assuming an estimated numerical aperture of 0.3. The data obtained with the metal plate not at the focal plane are also plotted. These results were consistent with those of the measured spatial resolution of the system, although the data for the vertical direction were slightly worse than those of the diffraction limit. This difference may be caused by a slight misalignment of the system, especially the focusing lens, before the sample. Because the imaging system was designed with spherical lenses, the spatial resolutions for the horizontal and vertical directions were the same, even though the sample was illuminated with a cylindrical lense.



Fig. 4 (a) Transmittance spectra of the sucrose and lactose tablets.
(b) Picture of the disaccharide tablets under investigation.
The lower part shows the full spectral absorption image plotted in color for 3D. (c) Slices of the 3D transmittance data taken at indicated frequencies.

Next, to demonstrate spectral line imaging, we prepared two disaccharide tablets with different spectral characteristics in the THz region, as shown in Fig. 4(a). Lactose has a characteristic absorption at 0.53 THz, whereas sucrose only has a smooth absorption up to 1 THz. We scanned the sample shown in Fig. 4(b) in the horizontal direction, and data for a width of approximately 36 mm and height of approximately 5 mm were obtained. The vertical direction (y-axis) was imaged using the line-imaging system. The obtained full spectral imaging data plotted as a 3D image are shown in the lower part of Fig. 4(b). Fig. 4(c) shows the slices of the data at several frequencies: 0.48 THz, 0.53 THz, 0.58 THz. The data clearly show the difference in the absorption at 0.53 THz between two tablets where strong absorption of lactose exists.



Fig. 5 (a) Picture of plastic film samples of different thickness (measurement range is in the red frame). (b) Conceptual diagram of the principle of thickness measurement. (c) Distribution of delay time transmitted through plastic film. (d) Cross-sectional graph on the black line.

Finally, to demonstrate the advantages of time-resolved spectroscopic imaging, an example of thickness imaging of a resin film that is opaque to visible light is presented. As shown in Fig. 5(a), samples with different numbers of films depending on the position were prepared and measured using the spectroscopic line-imaging system proposed in this paper. As shown in Fig. 5(b), the delay time τ (= nd/c) of the THz pulse changes depending on the thickness of the transmitted sample. Therefore, the film thickness is obtained by extracting the peak value of the time waveform acquired by time-domain spectroscopy (n: refractive index in the THz region, d: film thickness, c: speed of light). Fig. 5(c) shows a thickness map wherein the delay time is plotted for film samples of different thicknesses. Fig. 5(d) shows a crosssectional graph on the black line (equivalent to an optical path length difference of 300 µm per 1 ps delay time).

These figures show that the step difference due to the change in the number of films is well represented. Using time-resolved spectroscopic imaging, the transmitted thickness imaging of a sample that is opaque to visible light was demonstrated and it was shown to be a promising means for measuring the 3D and film thickness of resins and ceramics in the future.

The results shown in Fig. 4 and Fig. 5 indicate that spec-

tral line imaging using an echelon mirror is very promising for future industrial and scientific applications. A 3D color image of the sample is of essential importance for comparing and distinguishing materials with different THz responses. Using our imaging system, spectral information is obtained on a single-shot basis, which can avoid distorting the THz waveform due to temporal fluctuations, such as changes in the spectrum or position of the sample. Additionally, combining our system with a compressive sampling technique to expand the spatial dimensions of the imaging is possible. The full and reliable spectral information in the THz region obtainable in our system can be the key to realizing such applications in the future.

4 Conclusion

In summary, we demonstrated spectral line imaging by combining a single-shot THz detection technique using an echelon mirror with the phase offset method. The obtained SNR of the single line reached 40 dB, thereby offering a sufficient dynamic range for spectroscopy applications. The spatial resolutions in both the horizontal and vertical directions were comparable to the diffraction limit of the THz waves at each frequency component. The results obtained from the imaging of disaccharide tablets demonstrate the high potential of spectral line imaging for future applications.

References

- M. Tonouchi, "Cutting-edge terahertz technology," Nat. Photonics, vol. 1, no. 2, pp. 95–105, 2007.
- H. Guerboukha, K. Nallappan, and M. Skorobogatiy, "Toward real-time terahertz imaging," *Adv. Opt. Photonics*, vol. 10, no. 4, pp. 843–938, 2018.
- [3] K. Ajito, Y. Ueno, H.-J. Song, E. Tamechika, and N. Kukutsu, "Terahertz Spectroscopic Imaging of Polymorphic Forms in Pharmaceutical Crystals," *Mol. Cryst. Liquid Cryst.*, vol. 539, no. 1, pp. 33–38, 2011.
- [4] A. Moriwaki, M. Okano, and S. Watanabe, "Internal triaxial strain imaging of visibly opaque black rubbers with terahertz polarization spectroscopy," *APL Photonics*, vol. 2, no. 10, 106101, 2017.
- [5] K. Kawase, Y. Ogawa, Y. Watanabe, and H. Inoue, "Nondestructive terahertz imaging of illicit drugs using spectral fingerprints," *Opt. Express*, vol. 11, no. 20, pp. 2549–2554, 2003.
- [6] X. Han, S. Yan, Z. Zang, D. Wei, H. L. Cui, and C. Du, "Label-free protein detection using terahertz time-domain spectroscopy," *Biomed. Opt. Express*, vol. 9, no. 3, pp. 994– 1005, 2018.

- [7] K. Fukunaga, N. Sekine, I. Hosako, N. Oda, H. Yoneyama, and T. Sudou, "Real-time terahertz imaging for art conservation science," *J. Euro. Opt. Soc.*, vol. 3, 08027, 2008.
- [8] A. J. Huber, F. Keilmann, J. Wittborn, J. Aizpurua, and R. Hillenbrand, "Terahertz Near-Field Nanoscopy of Mobile Carriers in Single Semiconductor Nanodevices," *Nano Lett.*, vol. 8, no. 11, pp. 3766–3770, 2008.
- [9] D. J. Roth, S. Reyes-Rodriguez, D. A. Zimdars, R. W. Rauser, and W. W. Ussery, "Terahertz computed tomography of NASA thermal protection system materials," in *AIP Conf. Proc.*, vol. 1430, p. 566, 2012.
- [10] J. Oden, J. Meilhan, J. Lalanne-Dera, J.-F. Roux, F. Garet, J.-L. Coutaz, and F. Simoens, "Imaging of broadband terahertz beams using an array of antenna-coupled microbolometers operating at room temperature," *Opt. Express*, vol. 21, no. 4, pp. 4817–4825, 2013.
- [11] F. Schuster, D. Coquillat, H. Videlier, M. Sakowicz, F. Teppe, L. Dussopt, B. Giffard, T. Skotnicki, and W. Knap, "Broadband terahertz imaging with highly sensitive silicon CMOS detectors," *Opt. Express*, vol. 19, no. 8, pp. 7827– 7832, 2011.
- [12] P. Bai, Y. Zhang, T. Wang, Z. Fu, D. Shao, Z. Li, W. Wan, H. Li, J. Cao, X. Guo, and W. Shen, "Broadband THz to NIR up-converter for photon-type THz imaging," *Nat. Commun.*, vol. 10, no. 1, 3513, 2019.
- [13] B. Ferguson and X.-C. Zhang, "Materials for terahertz science and technology," *Nat. Mater.*, vol. 1, no. 1, pp. 26–33, 2002.
- [14] T. Kampfrath, K. Tanaka, and K. A. Nelson, "Resonant and nonresonant control over matter and light by intense terahertz transients," *Nat. Photonics*, vol. 7, no. 9, pp. 680–690, 2013.
- [15] Z. Jiang and X.-C. Zhang, "Electro-optic measurement of THz field pulses with a chirped optical beam," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 72, no. 16, pp. 1945–1947, 1998.
- [16] S. M. Teo, B. K. Ofori-Okai, C. A. Werley, and K. A. Nelson, "Invited Article: Single-shot THz detection techniques optimized for multidimensional THz spectroscopy," *Rev. Sci. Instrum.*, vol. 86, no. 5, 051301, 2015.
- [17] Z.-H. Zhai, S.-C. Zhong, J. Li, L.-G. Zhu, K. Meng, J. Li, Q. Liu, Q.-X. Peng, Z.-R. Li, and J.-H. Zhao, "Time-resolved single-shot terahertz time-domain spectroscopy for ultra-fast irreversible processes," *Rev. Sci. Instrum.*, vol. 87, no. 9, 095101, 2016.

- [18] T. Yasui, K.-I. Sawanaka, A. Ihara, E. Abraham, M. Hashimoto, and T. Araki, "Real-time terahertz color scanner for moving objects," *Opt. Express*, vol. 16, no. 2, pp. 1208–1221, 2008.
- [19] Y. Minami, Y. Hayashi, J. Takeda, and I. Katayama, "Singleshot measurement of a terahertz electric-field waveform using a reflective echelon mirror," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 103, no. 5, 051103, 2013.
- [20] I. Katayama, H. Sakaibara, and J. Takeda, "Real-Time Time-Frequency Imaging of Ultrashort Laser Pulses Using an Echelon Mirror," *Jpn. J. Appl. Phys.*, vol. 50, no. 10, 102701, 2011.
- [21] X. Li, K. Yoshioka, M. Xie, G. T. Noe, W. Lee, N. Marquez Peraca, W. Gao, T. Hagiwara, O. S. Handegard, L.-W. Nien, T. Nagao, M. Kitajima, H. Nojiri, C.-K. Shih, A. H. MacDonald, I. Katayama, J. Takeda, G. A. Fiete, and J. Kono, "Terahertz Faraday and Kerr rotation spectroscopy of Bil-xSbx films in high magnetic fields up to 30 tesla," *Phys. Rev. B*, vol. 100, no. 11, 115145, 2019.
- [22] G. T. Noe, I. Katayama, F. Katsutani, J. J. Allred, J. A. Horowitz, D. M. Sullivan, Q. Zhang, F. Sekiguchi, G. L. Woods, M. C. Hoffmann, H. Nojiri, J. Takeda, and J. Kono, "Single-shot terahertz time-domain spectroscopy in pulsed high magnetic fields," *Opt. Express*, vol. 24, no. 26, pp. 30328–30337, 2016.
- [23] G. Mead, I. Katayama, J. Takeda, and G. A. Blake, "An echelon-based single shot optical and terahertz Kerr effect spectrometer," *Rev. Sci. Instrum.*, vol. 90, no. 5, 053107, 2019.
- [24] J. Degert, M. Cornet, E. Abraham, and E. Freysz, "Simple and distortion-free optical sampling of terahertz pulses via heterodyne detection schemes," *J. Opt. Soc. Am. B*, vol. 33, no. 10, pp. 2045–2050, 2016.
- [25] J. Hebling, G. Almasi, I. Z. Kozma, and J. Kuhl, "Velocity matching by pulse front tilting for large-area THz-pulse generation," *Opt. Express*, vol. 10, no. 21, pp. 1161–1166, 2002.
- [26] H. Hirori, A. Doi, F. Blanchard, and K. Tanaka, "Singlecycle terahertz pulses with amplitudes exceeding 1 MV/ cm generated by optical rectification in LiNbO₃," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 98, no. 9, 091106, 2011.
- [27] G. Asai, D. Hata, S. Harada, T. Kasai, Y. Arashida and I. Katayama, "High-throughput terahertz spectral line imaging using an echelon mirror," *Opt. Express*, vol. 29, no. 3, pp. 3515–3522, 2021.

浅井 岳 Gaku ASAI 光学本部 要素開発部 Fundamental Technology Development Department Optical Engineering Division

秦 大樹 Daiki HATA 光学本部 要素開発部 Fundamental Technology Development Department Optical Engineering Division

原田真太郎 Shintaro HARADA 横浜国立大学 Yokohama National University



秦 大樹 Daiki HATA









笠井達基 Tatsuki KASAI



Yusuke ARASHIDA

笠井達基 Tatsuki KASAI

Yokohama National University

嵐田雄介 Yusuke ARASHIDA

片山郁文 Ikufumi KATAYAMA

Yokohama National University

University of Tsukuba

横浜国立大学

筑波大学

横浜国立大学



片山郁文 Ikufumi KATAYAMA

ミストデポジションと高水分散性 ITO ナノ 粒子によるフレキシブル基板上への高性能 ITO 薄膜の作製

鈴木涼子,西 康孝,松原正樹,村松淳司,蟹江澄志

Fabrication of High-Performance ITO Flexible Thin Films Utilizing Mist Deposition and ITO Nanoparticles with High Water Dispersibility[†]

Ryoko SUZUKI, Yasutaka NISHI, Masaki MATSUBARA, Atsushi MURAMATSU and Kiyoshi KANIE

フレキシブルデバイスの作製において、耐熱性の乏しい樹脂基板への透明導電膜の低温成膜は重要な技術である. ミストデポジションは超音波振動子を用いて霧化させた原料を基板に吹き付けて成膜する手法である. 高温処理が不要であることから樹脂基板への成膜に適した手法だと考えられる. 本報告ではミストデポジションと以前我々が報告した高水分散性酸化インジウムスズ(ITO) ナノ粒子を組み合わせて透明導電膜の作製を試みた. ミストデポジションで作製した ITO ナノ粒子膜は他の成膜法で成膜した場合よりも低い表面粗さと低い抵抗率を示した. 成膜条件の制御が容易なミストデポジションを用いることで膜内部,表面での ITO ナノ粒子の凝集を抑制する条件の調整が可能であり,高性能透明導電膜の作製が可能であることが分かった.

In process of preparation of flexible device, providing a low-temperature coating method of transparent conductive film for polymeric a substrate with low heat tolerance is very important. Mist deposition is a suitable method for coating these substrates as high-temperature processes are not required. Herein, mist is formed by atomizing the coating liquid. Subsequently, it is deposited on the substrate and dried to form a thin film. In this report, a transparent conductive film is prepared utilizing mist deposition and indium tin oxide (ITO) nanoparticles with high water dispersibility, as detailed in our previous report. The mist-deposited ITO thin film exhibits the lowest roughness and resistivity when compared to the films formed using other coating methods. The results indicate that a densely packed film can be prepared by changing the coating conditions, which are easily controlled during the mist deposition. Thus, a high-performance transparent conductive film is successfully prepared using an "eco-friendly" process without high-temperature treatment.

Key words ミストデポジション法, ITO ナノ粒子, 透明導電膜 mist deposition method, ITO nanoparticles, transparent conductive film

1 Introduction

Recently, low-temperature processes for the fabrication of electric wiring on substrates with poor heat tolerances have become important technologies owing to the growth of flexible devices [1] and film-type solar cells [2]. In particular, printed electronics (PE), which is the direct drawing of electrical wirings onto a substrate using conventional printing methods [3]–[5], is one of the most attractive technologies. Resist coating, exposure, and etching, which are included in the conventional process for fabrication of the electrode, are not necessary in the PE process. Therefore, PE has the advantages of low environmental load and low cost. However, the drawing of electrical wiring requires the use of conductive pastes, which results in a higher resistivity of PE electric wirings than that of the conventional process.

Indium tin oxide (ITO) is a transparent conductive oxide with low resistivity, high transparency, and moderate chemical stability and is the most commonly used material for transparent electrodes [6]. Transparent conductive films

[†] Reuse of R. Suzuki, Y. Nishi, M. Matsubara, A. Muramatsu and K. Kanie, "A nanoparticle-mist deposition method: fabrication of high-performance ITO flexible thin films under atmospheric conditions," Sci Rep, vol. 11, pp. 10584, 2021.

using ITO nanoparticles have been prepared by inkjetprinting [7]–[9] and brash printing [10], [11]. In these reports, organic solvents and dispersants were used for the preparation of ink containing ITO nanoparticles; therefore, high-temperature treatment (possibly over 400°C) was necessary to remove organic residue for the preparation of lowresistivity ITO electric wiring. Essentially, only substrates with heat resistance can be used in the PE process.

Mist deposition, which does not use organic solvents and dispersants, has been reported as a method for the fabrication of films consisting of nanoparticles. The mist deposition process is as follows. First, the coating liquid is atomized. The resulting mist is carried by a carrier gas, deposited on the substrate, and dried to form films (Fig. 1a). The mist deposition method is similar to that of spray coating; however, the droplets in the mist are smaller than those in spray coating and remain in the air for a longer period. From this characteristic, mist deposition has the advantages of mist droplet transportation by a carrier gas and control of the film structure by tuning the gas flow. Among the reports on mist deposition, there are several reports on mist chemical vapor deposition (CVD) [12]-[14]. Gallium-doped ZnO (GZO) film and borondoped ZnO (BZO) film were prepared by mist CVD. On the other hand, there are a few reports on mist deposition using nanoparticles. Qin et al. prepared a mist-deposited TiO₂ nanoparticle film [15] where a TiO₂ nanoparticles aqueous dispersion was used as the coating liquid and deposited on a Si wafer heated to 150°C. The obtained films exhibited a characteristic ring pattern on their surfaces. These patterns were formed by the aggregation of TiO₂ nanoparticles during the evaporation of water from the mist droplets on the substrate. Additionally, these patterns differed according to their position inside the Si wafer. These results indicated that mist deposition can be used to fabricate films using a lowtemperature process and the surface structure of the film can be controlled by changing the evaporation conditions.

In our previous reports, protruded ITO nanoparticles [16] had a much higher water dispersibility than conventional cubic-shaped ITO nanoparticles [17]. The protruded ITO nanoparticles were single-crystalline nanoparticles with many protrusions on their surfaces, which resulted in a larger surface area and higher surface water absorption than cubic-shaped ITO nanoparticles. These protruded ITO nanoparticles could maintain their dispersion state in an aqueous medium for over one month without any dispersant. Hence, protruded ITO nanoparticles can be applied for mist deposition because of their high water dispersibility. Therefore, we expect that protruded ITO nanoparticles can form densely packed and flat surfaced films using mist deposition during a low-temperature process.

Herein, we report the advantages of mist deposition for the fabrication of transparent conductive films and the advantages of using protruded ITO nanoparticles for mist deposition.

2 Experimental Procedure

ITO nanoparticles were prepared as described in our previous reports [16], [17]. Two types of ITO nanoparticles, C-NP and P-NP, were prepared, which were cubic-shaped and protruded ITO nanoparticles, respectively, with an Sn doping of 14 at%. C-NP and P-NP powders were added to water and dispersed using a homogenizer to prepare an aqueous dispersion of ITO nanoparticles. P-NP had a higher water dispersibility in water than C-NP because of the high hydrophilicity originated from its shape. P-NP maintained a good dispersibility for over one month; whereas, C-NP settled at the bottom of the vessel after standing for one day.

ITO thin films on the substrates were prepared using the mist deposition system (Fig. 1b, 1c). The mist generation unit consisted of four ultrasonic oscillator units. The mist produced from ITO nanoparticle aqueous dispersion was transported by an N_2 carrier gas and deposited on the substrate. On the way, it was passed through a water trap to remove large mist droplets. The flow rate was fixed at 10–20 L·min⁻¹ and the resulting thin films were heat treated in air. The thickness of the ITO thin films was adjusted to 300 nm by controlling the deposition period.



Fig. 1 (a) Scheme of film formation by mist deposition, (b) scheme of mist deposition system, and (c) appearance of experimental mist deposition system.

3 Results and Discussion

3.1. Preparation of C-NP and P-NP

From X-ray diffraction (XRD) measurement, it was confirmed that C-NP and P-NP had In₂O₃ crystal structure

(JCPDS No. 6-0416). Then, the doping amounts of Sn based on In calculated from the inductively coupled plasma (ICP) results were 14.4 mol% and 14.2 mol% in C-NP and P-NP, respectively. From these results, it was confirmed that ITO was successfully prepared. Transmission electron microscopy (TEM) and high-resolution TEM (HR-TEM) images of C-NP and P-NP are shown in Fig. 2. C-NP had a cubic shape with smooth edge surfaces (Fig. 2a), whereas P-NP had a large number of protrusions on the surface (Fig. 2c). The mean particle size of C-NP and P-NP were 39 \pm 12 and 38 \pm 10 nm, respectively. In the HR-TEM images (Fig. 2b, 2d), C-NP and P-NP showed uniform crystal orientations. The crystallite sizes of C-NP and P-NP were calculated to be 35 and 33 nm, respectively, using Scherrer's equation. The calculated sizes were close to the mean particle diameters determined by TEM observations. The results suggested that C-NP and P-NP have single-crystalline structures. Additionally, the uniform distribution of In and Sn atoms in the nanoparticles was confirmed by energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) mapping images. These results indicate the successful preparation of the two types of ITO nanoparticles.



Fig. 2 Transmission electron microscopy (TEM) images of (a) C-NP and (c) P-NP, and high resolution (HR)-TEM images of (b) C-NP and (d) P-NP.

3.2. Effect of Deposition Method on Resistivity of P-NP Thin Films

To investigate the effect of the coating methods on resistivity, a glass substrate was coated with P-NP using several coating methods: mist deposition, bar coating, spray coating, spin coating, and drop casting. Fig. 3a shows the resistivities of P-NP thin films prepared by the different coating methods after heat treatment at 150, 200, 300, 400, and 500°C for 1 h under an H2-Ar (4% H2) atmosphere.

The mist-deposited P-NP film had the lowest resistivity $(9.0 \times 10^{-3} \,\Omega \cdot cm)$ after heat treatment at 150°C. At the same process temperature, the resistivities of the films fabricated by bar-coating, spray coating, spin coating, and drop casting were $3.0 \times 10^{-1} \Omega \cdot \text{cm}$, $4.0 \times 10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$, $5.0 \times 10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$, and 4.0×10^{-2} Ω ·cm, respectively. The resistivity of the thin films decreased with increasing process temperature for all coating methods. After heat treatment at 500°C, the mist-deposited films had the lowest resistivity $5.0 \times 10^{-3} \Omega$ cm. Fig. 3b-3f show scanning electron microscopy (SEM) images of the surfaces of the P-NP films after heat treatment at 150°C. From the SEM images (Fig. 3b, 3c, 3e), it was observed that P-NP films prepared by the mist deposition, spray coating, and spin coating methods had flat and smooth surfaces. In contrast, the bar-coated (Fig. 3d) and drop-casted (Fig. 3f) P-NP films had rough surfaces with aggregated P-NP structures. The roughness (R_a) of the P-NP film surfaces was measured by atomic force microscopy (AFM). The mistdeposited P-NP films had the lowest R_a of 7.6 nm. Additionally, bar-coated, spray-coated, spin-coated, and drop-casted P-NP films exhibited an R_a of 7.8, 10.0, 15.8, and 12.6 nm, respectively. In a previous report [18], the resistivity of ITO thin film decreased with decreasing $R_{\rm a}$. In this study, the P-NP film with the lowest $R_{\rm a}$ exhibited the lowest resistivity.

Above mentioned about mist deposition, the evaporation rate of liquids in the droplets can be adjusted by controlling the substrate temperature and carrier gas flow rate, which reduces the agglomeration of nanoparticles in the mist droplets and on the substrates. The insets of Fig. 3b–3f show



Fig. 3 (a) Resistivities of P-NP films prepared by different coating methods and scanning electron microscopy (SEM) images of P-NP film surface coated by (b) mist deposition, (c) spray coating, (d) bar coating, (e) spin coating, and (f) drop casting methods. These images were taken after annealing at 150°C. The insets in (b)-(f) are enlarged views of the surfaces.

enlarged views of the corresponding P-NP film surfaces. A densely packed uniform surface was observed, as shown in Fig. 3b, which indicates that mist deposition is advantageous for fabricating high-performance ITO thin films at low processing temperatures and is applicable to flexible films.

3.3. Characterization of Mist-Deposited C-NP and P-NP Films

ITO thin films were prepared by mist deposition using aqueous dispersions of C-NP and P-NP. Fig. 4a summarizes the resistivities of the C-NP and P-NP films fabricated by mist deposition in a low process temperature between room temperature and 200°C. Resistivities of the C-NP and P-NP films after annealing at 150°C were $8.0 \times 10^{-2} \Omega$ ·cm and 9.0 $\times 10^{-3} \Omega$ cm, respectively. Fig. 4b-4c presents SEM images of the surfaces of the C-NP and P-NP films after annealing at 150°C, respectively. The C-NP film had a rough and porous surface structure. In contrast, a densely packed and flat surface was observed on the P-NP film. The lower resistivity of the P-NP film compared to that of the C-NP film can be attributed to the more densely packed structure of the P-NP film. Fig. 4d-4e present cross-sectional TEM images of C-NP and P-NP films on a polyethylene naphthalate (PEN) substrate (TEONEX, Q51-188, TOYOBO Co., Ltd., Osaka, Japan, t = 188 µm) with thicknesses of ca. 200 nm. These images correspond to the SEM images shown in Fig. 4b-4c. Loosely deposited porous inner structure with voids and irregularities was observed in the C-NP film. Additionally, a densely deposited inner structure of the P-NP film was observed. The difference in film structure between the C-NP and P-NP films is attributed to the difference in the dispersion states of C-NP and P-NP in the mist water droplets.



Fig. 4 (a) Resistivity of C-NP and P-NP films after heat treatment between room temperature and 200°C, scanning electron microscopy (SEM) images of the surfaces of the (b) C-NP and (c) P-NP films after annealing at 150°C, and cross-section transmission electron microscopy (TEM) images of (d) C-NP and (e) P-NP particles on polyethylene naphthalate (PEN) substrate.

The dispersion states of C-NP and P-NP in the mist water

droplets were investigated using small-angle X-ray scattering (SAXS) measurements. In the water droplets, the mean particle size of particles in P-NP was 41 ± 13 nm, which was consistent with the size determined by TEM observation. This result indicates that P-NP were the primary particles in the water droplets. In contrast, C-NP had two particle sizes in water droplets, 54 ± 10 and 159 ± 30 nm. The smaller and larger sizes corresponded to the C-NP dispersed as primary and secondary particles, respectively. It was assumed that the high water dispersibility of P-NP resulted in a primary particle state in the water droplets. From these results, the stability of the ITO nanoparticles in aqueous dispersions was maintained in the mist water droplets and primary-dispersed nanoparticles can be used to form thin films with densely packed structures.

Furthermore, the effect of the ITO nanoparticle dispersion state was investigated. C-NP and P-NP films prepared using different elapsed times after the preparation of the aqueous dispersions were fabricated and their resistivities were measured (Fig. 5). The resistivity of the C-NP films increased as the elapsed time of the C-NP aqueous dispersion increased. Conversely, the P-NP films maintained a low resistivity regardless of the elapsed time. As mentioned in Section 2, C-NP has a lower water dispersibility than P-NP and settles at the bottom of the vessel after standing for one day. These results corresponded to the results that the high water dispersibility of P-NP was appropriate for high-performance ITO nanoparticle thin films.



Fig. 5 Effect of elapsed time after preparation of indium tin oxide (ITO) nanoparticle dispersion on resistivity of mist-deposited film.

3.4. P-NP Mist Deposition on Flexible Films

P-NP was coated on a flexible PEN substrate by mist deposition with 300 nm thickness followed by annealing at 150° C for 1 h under N₂ atmosphere. The resulting P-NP film

showed high transparency (Fig. 6a) and had a low resistivity of 9.0 \times 10⁻³ Ω ·cm, which is similar to the resistivity of P-NP film on a glass substrate. Additionally, the transmittance of this P-NP film was greater than 85% in the visible region (Fig. 6b). It was assumed that a highly transparent ITO thin film could be obtained on a flexible film by mist deposition. Furthermore, P-NP patterned films were fabricated by mist deposition on pre-treated hydrophilic flexible films. The method for selective deposition was as follows. First, Novec 1720 (3M) was precoated onto a PEN film (TEONEX, Q51-50, TOYOBO Co., Ltd., Osaka, Japan, t = 50 μ m or t = 188 μ m) to prepare a hydrophobic surface. The films were dried at 100°C for 30 min. The films were masked using a patterned SUS430 thin substrate (t = $100 \mu m$). The resulting masked PEN films were treated with a UV-ozone cleaner for 5 min to obtain patterned hydrophilic areas. Fig. 6c and Fig. 6d exhibit an SEM image and the corresponding EDS mapping image of the P-NP film In ions on a PEN substrate, respectively. The water droplets in the mist spontaneously were deposited on the hydrophilized area of the flexible films to form a uniform pattern. Selective and spontaneous processes will become a powerful technique for fabricating ITO-patterned films under ecofriendly atmospheric roll-to-roll PE conditions.



Fig. 6 (a) Appearance of P-NP film on polyethylene naphthalate (PEN) substrate coated by mist deposition, (b) transmittance spectra of the P-NP film, (c) scanning electron microscopy (SEM) image, and (d) corresponding energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) mapping image of P-NP film In ions on patterned PEN substrate.

4 Conclusion

The design and synthesis of protruded ITO nanoparticles with high water dispersibility have been detailed in our previous report. ITO nanoparticles are one of the most stable materials for the fabrication of thin films using mist deposi-

tion. In this study, we prepared flexible films with high-performance ITO thin film on flexible film, that had low resistivity and high transparency using a combination of mist deposition and protrusion-rich ITO nanoparticles. A comparison to cubic ITO nanoparticles with low water dispersibility revealed that the high water dispersibility of protrusion-rich ITO nanoparticles played a critical role in fabricating high-performance ITO thin films. The high dispersibility of protrusion-rich ITO nanoparticles was maintained in mist water droplets. Protruded ITO nanoparticles were deposited on substrates in a primary particle state, and densely packed films were formed. The ITO thin films obtained by mist deposition have the following advantages. (i) Single-crystalline protrusion-rich ITO nanoparticles are readily dispersed in water for a long period without the use of surfactants or dispersants. (ii) ITO nanoparticle-based thin films can be fabricated under mild atmospheric conditions without the use of expensive vacuum production systems or dangerous and environmentally-harmful chemicals that are used in the current sputtering and etching procedure. Finally, (iii) Low resistivity and high transparency can be achieved with low-temperature annealing, which is applicable for the deposition of ITO thin films on flexible substrates. Mist deposition is a promising and powerful technique for the production of key materials essential for sustainable progress in PE technology as well as next-generation ondemand fabrication processes for wearable devices.

References

- J. Koo, D. Kim, H. Shim, T. Kim and D. Kim, "Flexible and Stretchable Smart Display: Materials, Fabrication, Device Design, and System Integration," *Adv. Funct. Mater.*, vol 28, no 35, pp. 1801834, 2018.
- [2] Y. Li, G. Xu, C. Cui and Y. Li, "Flexible and Semitransparent Organic Solar Cells," *Adv. Ener. Mater.*, vol. 8, no 7, pp. 1701791, 2018.
- [3] Y. Kamikoriyama, H. Imamura, A. Muramatsu and K. Kanie, "Ambient Aqueous-Phase Synthesis of Copper Nanoparticles and Nanopastes with Low-Temperature Sintering and Ultra-High Bonding Abilities," *Sci. Rep.*, vol. 9, pp. 899, 2019.
- [4] D. Li, W.-Y. Lai, Y.-Z. Zhang and W. Huang, "Printable Transparent Conductive Films for Flexible Electronics," *Adv. Mater.*, vol. 30, no. 10, pp. 1704738, 2018.
- [5] Y. Khan, A. Thielens, S. Muin, J. Ting, C. Baumbauer and A. C. Arias, "A New Frontier of Printed Electronics: Flexible Hybrid Electronics," *Adv. Mater.* vol. 32, no. 15, pp. 1905279, 2020.
- [6] T. Minami, "Present status of transparent conducting oxide

thin-film development for Indium-Tin-Oxide (ITO) substitutes," *Thin Solid Films*, vol. 516, no. 17, pp. 5822–5828, 2008.

- [7] M. Hwang, B. Jeong, J. Moon, S. Chun and J. Kim, "Inkjetprinting of indium tin oxide (ITO) films for transparent conducting Electrodes," *Mater. Sci. Eng. B*, vol. 176, no. 14, pp. 1128–1131, 2011.
- [8] D. Angmo, T. T. Larsen-Olsen, M. Jørgensen, R. R. Søndergaard and F. C. Krebs, "Roll-to-Roll Inkjet Printing and Photonic Sintering of Electrodes for ITO Free Polymer Solar Cell Modules and Facile Product Integration," *Adv. Ener. Mater.*, vol. 3, no. 2, pp. 172–175, 2013.
- [9] E. N. Dattoli and W. Lu, "ITO nanowires and nanoparticles for transparent films," *MRS Bull.*, vol. 36, no. 10, pp. 782– 788, 2011.
- [10] J. Jeong and H. Kim, "Ag nanowire percolating network embedded in indium tin oxide nanoparticles for printable transparent conducting electrodes," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 104, pp. 071906, 2014.
- [11] H. Shin, K. Kim, T. Kim and H. Kim, "Fiber laser annealing of brush-painted ITO nanoparticles for use as transparent anode for organic solar cells," *Ceram. Int.*, vol. 42, no. 12, pp. 13983–13989, 2016.
- [12] T. Kawaharamura, G. T. Dang and M. Furuta, "Successful Growth of Conductive Highly Crystalline Sn-Doped α -Ga₂O₃ Thin Films by Fine-Channel Mist Chemical Vapor

Deposition," Jpn. Appl. Phys., vol. 51, pp. 040207, 2012.

- [13] T. Kawaharamura, "Physics on development of open-air atmospheric pressure thin film fabrication technique using mist droplets: Control of precursor flow," *Jpn. Appl. Phys.*, vol. 53, pp. 05FF08, 2014.
- [14] T. Shirahata, T. Kawaharamura, S. Fujita and H. Orita, "Transparent conductive zinc-oxide-based films grown at low temperature by mist chemical vapor deposition," *Thin Solid Films*, vol. 597, pp. 30–38, 2015.
- [15] G. Qin and A. Watanabe, "Surface Texturing of TiO₂ Film by Mist Deposition of TiO₂ Nanoparticles," *Nano-Micro Lett.*, vol. 5, no. 2, pp. 129–134, 2013.
- [16] R. Suzuki, Y. Nishi, M. Matsubara, A. Muramatsu and K. Kanie, "Single-Crystalline Protrusion-Rich Indium Tin Oxide Nanoparticles with Colloidal Stability in Water for Use in Sustainable Coatings," ACS Appl. Nano Mater., vol. 3, no. 5, pp. 4870–4879, 2020.
- [17] K. Kanie, T. Sasaki, M. Nakaya and A. Muramatsu, "Quaternary Ammonium Hydroxides-Assisted Solvothermal Synthesis of Monodispersed ITO Nanoparticles with a Cubic Shape," *Chem. Lett.*, vol. 42, no. 7, pp. 738–740, 2013.
- [18] W. Tang, Y. Chao, X. Weng, L. Deng and K. Xu, "Optical Property and the Relationship between Resistivity and Surface Roughness of Indium Tin Oxide Thin Films," *Phys. Procedia*, vol. 32, pp. 680–686, 2012.

鈴木涼子 Ryoko SUZUKI 先進技術開発本部 材料・要素技術研究所 Materials & Advanced Research Laboratory Advanced Technology Research & Development Division 東北大学 Tohoku University

西 康孝 Yasutaka NISHI 東北大学 Tohoku University FPD 装置事業部 開発統括部 先端技術開発部 Advanced Technology Development Department Development Sector FPD Lithography Business Unit 松原正樹 Masaki MATSUBARA 東北大学 Tohoku University

村松淳司 Atsushi MURAMATSU 東北大学 Tohoku University

蟹江澄志 Kiyoshi KANIE 東北大学 Tohoku University





鈴木涼子 Ryoko SUZUKI

西 康孝 Yasutaka NISHI



松原正樹 Masaki MATSUBARA



村松淳司 Atsushi MURAMATSU



蟹江澄志 Kiyoshi KANIE

燃焼~溶融の CAE による機能性評価と 感度調整による試作レス開発プロセスの 確立[†]

小西洋平,武村直輝,中野史康,齊藤卓一

Establishment of a Prototype-less Development Process by Functionality Evaluation and Sensitivity Setting using Numerical Simulation for Combustion to Melt

Yohei KONISHI, Naoki TAKEMURA, Fumiyasu NAKANO and Takuichi SAITO

生産本部技術統括部製造部では半導体露光装置や FPD 露光装置に使用される高純度合成石英ガラスを製造している. 石英ガラス合成は燃焼~溶融といった複雑反応を伴うため、炉内状態の計測や予測が難しい. このため従来はプロセス 条件変更による品質,生産性向上のために,複数回の実機による試作~品質確認が必須であり,膨大な開発コストの発 生と量産安定性に課題があった.本報では,課題解決のため,実機試作レス開発プロセスを確立したので報告する. 網羅的な機能性評価を行うため,実験は数値シミュレーション(CAE)を用いて行った. CAE を用いた二段階設計を 実現するため,まずプロセス機能展開によるシステム全体の俯瞰に取り組んだ.プロセス機能展開は机上で複数の技術 者によって行い,プロセス機能展開表としてシステムの見える化をすることができた. ここから抽出された制御因子や 誤差因子をとりあげ, CAE を用いて網羅的に評価することで, CAE による二段階設計を実現した. 従来の開発で必要 だった実機実験を CAE で代替したことによって,信頼性の高いプロセス条件を短期間で確立することができ,生産性 向上を達成した.

Production Department Technology Sector Production Technology Division manufactures high-purity synthetic silica glass used in semiconductor lithography system and flat panel display (FPD) lithography system. Silica glass synthesis involves complicated reactions such as combustion and melting, so it is difficult to measure and predict the state inside the furnace. For this reason, in the past, to improve quality and productivity by changing process conditions, it was essential to perform trial production and quality confirmation with actual machines multiple times, which caused enormous development costs and problems in mass production stability. In this study, we have established an actual prototype-less development process to solve the problem.

Experiments were conducted using computer-aided engineering (CAE) for comprehensive functional evaluation. To achieve a two-step optimization using CAE, we first worked on a bird's-eye view of the entire system by process-function deploying. The process-function deploying was performed by multiple engineers on the desk, and the system could be visualized as a process function deployment table. By taking up the control factors and error factors extracted from this and comprehensively evaluating them using CAE, we achieved a two-step optimization by CAE. By substituting CAE for the actual machine experiment required in the conventional development, highly reliable process conditions could be established in a short period of time, and productivity was improved.

Key wordsCAE, 熱流体解析, 品質工学, 二段階設計, 合成石英ガラス
CAE, Thermo-fluid analysis, Quality engineering, Two-step optimization, Synthetic silica glass

1 はじめに

高純度石英ガラス合成プロセスの生産効率を向上させる ことを目的に、数値シミュレーション (CAE) を応用した 網羅的かつ効率的な技術開発プロセスを確立したため,報 告する.

本論文では,まず石英ガラス合成における火炎燃焼~ガ ラス溶融の各過程を工程における機能として定義した.プ

*本稿は引用文献[6]に、新たに6.3新規合成炉の開発状況を加えたものである.

ロセス機能展開の手法によりプロセス全体を俯瞰しCAEで 直積実験を行うことで,機能性に関する要因効果図を獲得 した. さらにCAEでL₁₈実験によって制御因子の感度への 効果を評価した. この結果得られたロバスト・エンジニア リング情報(RE情報)を用いて実生産炉の運転条件を設定 することにより,試作レスで良品を獲得し,本開発プロセ スの信頼性の高さを示した[1],[2].

2背景

2.1. 合成プロセスの説明





当社では直接法により光学用途合成石英ガラスを製造し ている. 直接法石英ガラスでは,パーナーから酸素,水素 といった燃焼ガスと,原料となる塩化ケイ素ガスを供給す ることで,火炎を形成し,火炎中の化学反応によりシリカ 微粒子を生成する. 生成されたシリカ微粒子を石英ガラス 表面に堆積させながら,パーナー火炎によって堆積物を加 熱溶融することで高純度な石英ガラス塊(インゴット)を 得ることができる (Fig. 1).

合成中の石英ガラス表面は高温にさらされることで溶融 し、インゴット外周側にガラスが流れて広がる過程を経て 低温となり固化する.この石英ガラスの溶融から冷却まで の過程によって石英ガラスの光学的品質は変化するため、 合成中の炉内環境を一定に保つことが品質の安定性に対し て重要である.一方で周囲環境の様々な変動により、合成 中の石英ガラス周囲の温度場、ガス濃度場が絶えず変化す るので、これらの変動に対して石英ガラスの品質を変動さ せにくい炉内構造設計、合成条件が求められる.

我々は石英ガラスの歩留まりを改善させるため、取得す る石英ガラス部品の品質を変更せずに合成するインゴット を小型化することによって、合成にかかるリードタイム (L/T) 短縮、廃棄されるガラス重量の最小化に取り組ん だ.

2.2. 課題

石英ガラス合成炉内では,火炎中の加水分解反応,粒子 堆積,溶融,冷却といった現象が同時に起きており,かつ 炉内での合成期間が長いため,以下の課題を抱えていた.

①炉内状態の把握,評価が難しい.

②操業中の条件変更による実験のコストが高く,再現性のある条件改良検討が難しい.

③インゴットのサイズを変更しつつ,同じ品質の部品を 作製することが難しい.

そこで,石英ガラス品質を維持しつつインゴットサイズ を変更するための合成条件設計のため, CAE を用いた機能 性評価プロセス開発を試みた.

3 対策 - 評価の進め方

3.1. プロセス機能展開とシステム分割

炉内燃焼の網羅的な把握に向けて,システムの機能を明 確にするため,まずプロセス機能展開を行った.複数の技 術者による協議を行った上で,石英ガラス合成炉及び周辺 設備・環境に関わるパラメーターを抽出し,プロセス機能 展開表にまとめた.プロセス機能展開を行った結果,炉に 関わる各パラメーターはいくつかの補助的な機能(サブシ ステム)に分けて整理できることが分かった.

3.2. サブシステムの機能とシステム範囲

石英ガラス合成システムに付随するサブシステムの機能 として,我々は,①原料供給,②粒子合成,③粒子堆積, ④溶融,⑤冷却,の5つの機能に分割して考えた.それぞ れのサブシステムの工程における機能を,

①原料供給:

設定供給量に対して常に安定した供給量にする.

②粒子合成:

火炎中で生成されるシリカ粒子の粒子径分布を常に一定 にする.

③粒子堆積:

堆積するシリカ微粒子の堆積量が石英ガラス表面の位置 ごとのシリカ微粒子堆積量分布を一定にする.

④溶融, ⑤冷却:

堆積によって生成した石英ガラスの表面に与えられる熱 量の分布を時間的に常に一定とする.

とそれぞれ定義した.石英ガラス合成システムに付随する 制御因子(設計パラメーター及び操業パラメーター)は, 一つのパラメーターが複数のサブシステムの機能に影響し ていると考えられる.例えばバーナーを通じて火炎の温度 をコントロールすることができるが,これによって②粒子 合成,③粒子堆積,④溶融,⑤冷却,の各サブシステムに 対してそれぞれ別種の変化を与えると予想できる.このた め,パラメーターを変化させた際の個別のサブシステムご との評価を行うのではなく,システム全体を一つの実験で 総合的に評価する必要があると判断した.

3.3. 機能の定義と評価指標

今回のシステムの評価指標と機能について検討を行った. 合成中の石英ガラス表面では、中心部分の温度が高い領域 でガラスが溶融し、溶融したガラスが周辺部へと流動して 広がっていく過程で冷却され、固化する.よって、合成さ れる石英ガラスの状態を一定にするためには、溶融~流 動~冷却の過程に生じる温度変化のばらつきを評価しなけ ればならない.

しかし,高温酸性ガス環境である実生産炉内でガラスの 流動速度変化や,それに伴う温度変化を時間とともに観測 することは困難である.そこで CAE による評価を検討し た. CAE を適用した場合の問題は,高温のガラスの流動が 長時間にわたる非定常的な現象であるため,計算負荷が高 いことであった.ただし,石英ガラスの溶融~流動~冷却 による固化の過程は,いずれも温度変化によって制御され る過程である.つまり,ガラス表面に加わる熱エネルギー 収支(熱流束)の変動を評価できれば,非定常性を直接表 現しないまでも,ガラス流動の変動に対する代替指標とし て適用できると考えた [3].

3.4. 予備実験による評価部位の確認

予備実験として,石英ガラス表面の熱流束分布を変化さ せた条件下でのCAE及び実際の石英ガラス合成の小規模実 験を行い,評価の妥当性検証を行った.

バーナーに供給するガス流量,流速を変化させて,熱流 束を変更した条件(条件1,2,Fig.2)を設定した.CAE 解析から,条件1では熱流束の大きい領域が石英ガラスイ ンゴット表面の右側に偏っているのに対して,条件2では 中心付近にあることがわかる.熱流束が小さい領域では, ガラスの流動速度が遅くなり,熱流束が大きい領域ではガ ラスの流動速度が速くなるため,条件2で合成したガラス インゴットは回転対称な形状を維持し,条件1では回転対 称形状を維持できないと予想される.



Fig. 2 石英ガラス表面の熱流束分布図(CAE) (1)条件 1, (2)条件 2

実際に合成したインゴットの合成中の様子を比較すると (Fig. 3),条件1では熱流束が大きい側のガラスが流動に よって片減りして,回転対称な形状を維持できないことが 確認された.



 Fig. 3
 各テスト条件で合成された石英ガラスインゴット

 (1)条件1,(2)条件2



Fig. 4 石英ガラス表面熱流束分布評価の模式図



Fig. 5 基本機能(熱流束分布)と標準 SN 比評価の模式図

合成されたインゴットの品質悪化の主な原因は合成中の インゴット表面でのガラス流動の不均一であるから,以上 の予備実験より, CAE 解析で得られる石英ガラス表面の位 置ごとの熱流束の分布(中心:高い,周辺低い, Fig. 4)を 評価することが必要と判断した.

そこで合成中の石英ガラス表面の中心からの位置を信号 とし、シミュレーションによって算出される各位置の熱流 束を出力とし、各位置における熱流束の誤差に対する安定 性を評価することにした (Fig. 5).

3.5. CAE による実験方法

実験は CAE 解析ソフト中に作製したシミュレーションモ デルにより行った.シミュレーションモデルは,実物の設 置寸法,壁面及び各ガス種の物性値を境界条件として数値 化し,有限要素法による数値計算を行った.

モデル上で直交表に対応して CAE の境界条件を変更させ るため,解析ソフトと自動最適化用ソフトを連動させること で,CAE によって自動で直積実験を実行することができた.

3.6. 誤差因子と水準

CAE の実験はばらつきを持たないため, 誤差因子につい てはプロセス機能展開表から実際のプロセス変動に関する 11因子を抽出した.実際に起こりうる製造条件の変動幅を, 仮想的な誤差としてL₁₂外側直交表に割り付け,実生産炉に おけるプロセス変動を再現することにした[4],[5].

3.7. SN 比算出方法

CAE で得られた熱流束分布は各実験行の平均値に対する 値のばらつきを標準 SN 比として評価した.標準 SN 比は

$$\eta = 10 \log \frac{S_{\beta} - V_{e}}{V_{N}} \tag{1}$$

式で算出した. Fig. 5 に CAE で得られた 1 行分(12サン プル)の熱流束分布曲線と,各位置における熱流束の平均 値を標準条件(N₀)として,標準条件の出力を信号(横軸) にしたグラフの例を示す.

4 CAE による機能性評価結果

4.1. 制御因子の決定

制御因子はプロセス機能展開表を基に、各サブシステム に属する制御因子から46因子を取り上げ、二つの L_{36} 内側直 交表にそれぞれ23因子ずつ割り付けた. 誤差因子は先に取 り上げた11因子を L_{12} 外側直交表に割り付け、2回の L_{36} × L_{12} の直積実験をCAEで行った. 実験リードタイム短縮の 観点から、二つの直交表を並行して計算させることを考え た. プロセス機能展開表にあるすべての因子を公平に評価 するため、二つの直交表の間で誤差因子を共通とすること にした.

4.2. 実験結果



得られた2回分のL₃₆×L₁₂実験の要因効果図を示す(Fig. 6).

得られた要因効果図の最適条件と比較条件の確認実験を 行い,利得の再現性を確認した(Table 1). Table 1の確認 実験の利得から,今回の1度目と2度目の実験ともに利得 の再現性が得られていると判断した.

Table 1 確認実験結果

	1 st batch/db			2 nd batch/db		
	Best	Comparison	Gain	Best	Comparison	Gain
Estimated	70.8	58.5	12.3	68.5	62.6	5.9
Confirmation experiment	70.2	59.3	10.9	69.4	61.5	7.9

5 CAEによる感度情報の獲得と調整

5.1. 理想熱流束分布の定義

L₃₆×L₁₂実験で得られた要因効果図から,SN 比に効果が 大きい因子と効果の小さい因子があることがわかった.SN 比への効果が大きい因子は,操業上SN 比が高くなる水準 に固定するべきなのに対し,効果が小さい因子は目的を最 大化するための感度調整に適用できると考えた.次にこの 感度調整因子を用いた感度調整方法について検討した.

3.4節で述べたように、合成中の石英ガラス形状を維持す るためには、熱流束分布を適切な状態に保つ必要がある. そこで着目しているインゴットを小型化した場合の石英ガ ラス表面の熱流束分布を CAE で調査したところ、Fig.7の ようになることが分かった.





Fig. 7 から, インゴットサイズを変化させることで,石 英ガラス表面の熱流束が中心付近で大きく低下することが 示唆された.感度調整因子を用いて現行の操業条件の熱流 束分布に合わせこむ事ができれば,インゴットサイズを小 型化させた際にも品質を安定させたまま合成することがで きると考え, CAE による感度情報の取得を試みた.

5.2. 感度情報の取得

Fig. 7 に示した熱流束分布は、いずれも複数の変曲点を 持つ分布形状を示している.この分布形状への感度調整を 行うため、得られた熱流束分布の変曲点ごとにデータを①、 ②、③のように区切り、それぞれの区間に対する感度を算 出することにした.これは、感度調整を行うにあたり、ガ ラス表面の中心付近の熱流束と、外周付近の熱流束を別個



に変化させることによって、全体の熱流束分布を制御する 必要があると考えたためである.

また二次の曲率成分の評価を行うため、感度はチェビ シェフの一般直交多項式に従う計算方法で β1, β2までを算 出し、現行操業条件を理想と置いた時の感度に対する効果 を CAE による L₁₈直交表実験により解析した [1]. この時 予め感度調整因子とした因子以外は SN 比が大きい水準に 固定して実験を行った.

Fig. 8 に L₁₈直交表実験で得られた感度の要因効果図を示 す.要因効果図から,各因子の感度に対する効果と,理想 条件への合わせこみのための感度調整の方向を把握するこ とができた.ここまでの取り組みにより,各制御因子につ いて,標準 SN 比及び感度の要因効果を得ることができた. これらの要因効果図をサブシステム及びプロセス機能展開 表に紐づけて整理することで,石英ガラス合成システムに 関するロバスト・エンジニアリング情報(RE 情報)とし て,網羅的な設計情報にまとめることができた.

6 実生産炉での検証と展開

6.1. CAE での操業条件決定

得られた RE 情報を基に実炉での操業条件を決定するため、インゴットサイズを小さくした条件で感度の要因効果 図β1,β2を用いて操業条件への熱流束の感度調整を行った. Fig.9 に CAE による感度調整で得られた条件での熱流束分 布を示す.Fig.9より、中心側の熱流束が増加し、全体の 分布形状が現行条件に近づいていることが確認できた.





6.2. 実生産炉での合成条件の調整と決定

得られた条件を適用して実生産炉合成を行ったところ, 試作一回目の合成から安定した形状の石英インゴットを得 ることができた.このことから, CAE により得られた RE 情報が現実のシステムを表現できていることを確認した.

また得られた合成条件を生産展開することで,当初のね らい通り,品質を変化させずに1バッチあたりのL/Tの短 縮及び歩留まりの低減を達成した.それぞれ,L/Tは従来 比84%,部品あたりの投入費用は従来比72%に低減できた. ここから,時間当たりの投入費用から見た生産性(L/T短 縮率×部品コスト低減率)を従来の1.6倍とすることに成功 した.今回のCAEによる取り組みにより大幅な損失コスト の低減に成功した.

6.3. 新規合成炉の開発

我々はさらに生産性の高い石英合成を目指し、現在石英 ガラス合成炉の熱効率改善に取り組んでいる. ここでは, 石英ガラス合成炉構造を変更することにより、石英ガラス 合成に必要な酸水素ガス使用量を低減することを目的とし ている. 石英ガラス表面の熱流束についての CAE 解析から 得られた RE 情報(Fig. 6)を用いて検討することにより, SN 比への寄与が大きい因子として炉内吸気口形状及び排 気口の位置が重要であることが示唆された. そこで, これ らの因子を現行よりも SN 比が大きくなる側へ水準変更し、 SN 比の安定性を担保した。そのうえで目的の熱効率を高 めるため、炉内容積を20%低減することとした. Fig. 10 に 今回新規に設計した炉での石英ガラス表面熱流束の CAE 解 析結果を示す、なお、新規炉での解析では、6.1節で述べた 感度調整と同様の手法により操業条件を設定している. Fig. 10 に示した熱流束分布の結果から、新規炉においても現行 と同様の熱流束分布を再現できることが確認された. また 感度調整により得られた新規炉での操業条件では、酸水素 ガス使用量が約20%減となっており、目的とする熱効率の 改善効果が得られることが予想された.

以上のように、CAE を用いた二段階設計により、新規炉



Fig. 10 従来条件と新規炉での熱流束分布の比較

構造を短い期間で,かつ RE 情報からの根拠を持って決定 することができた.設計した新規炉は現在製作を完了し, 実合成での品質確認を行っている.また実際に酸水素ガス 量を低減した条件で合成を行い,石英インゴットが取得で きることを確認できており,今後の生産性への寄与を目指 して開発を継続している.

7 まとめ

本研究では、石英ガラス合成プロセスの生産効率を向上 するため、まずプロセス機能展開を行うことで網羅性のあ る制御因子、誤差因子の抽出を行い、合成炉内環境の CAE による機能性評価を行った.次に理想の熱流束分布曲線を 考慮した感度調整を行い、実生産炉に適用可能な製造条件 を見出した.

本論文では,石英ガラス合成の開発を通じて,機能性評 価手法の効果を確認できた.複雑な現象を伴うパラメー ターの効果を機能に対する要因効果としてプロセス機能展 開表上に整理することで、定量的かつ網羅的な技術情報と して蓄積した. CAE による熱流束分布形状の感度調整と、 実生産炉での効果を確認したことで、CAE を用いた試作レ スの開発プロセスを確立することができた.

以上により得られた RE 情報は,今回機能として選んだ 熱流束分布だけでなく,他の品質及び生産性課題について も汎用的に適用できるものである.今後今回得られた RE 情報を用いて,石英ガラス合成の更なる生産性向上及び高 品質化に取り組んでいく.

引用文献

- [1] 田口玄一, 横山巽子, ベーシックオフライン品質工学, 日本規格協会, 2008.
- [2] 嘉指伸一, "プロセス機能展開表の活用とロバストエンジ ニアリング情報の活用による初期型不良の撲滅と立上げ リードタイムの短縮," 全国能率大会, 63, pp. B73-76, 2012.
- [3] 水谷幸夫, 燃焼工学 第3版, 森北出版株式会社, 2013.
- [4] 嘉指伸一, "品質工学を実務で活用する「品質工学ステッ プ展開」,"標準化と品質管理, vol. 69, no. 9, pp. 57-69, 2016.
- [5] 佐藤幸太, 嘉指伸一, "プロセス機能展開表を活用した光 学ガラスの溶解技術開発,"品質工学, vol. 29, no. 1, pp. 30-38, 2021.
- [6] 小西洋平,武村直輝,齊藤卓一,"燃焼~溶融の CAE に よる機能性評価と感度調整による試作レス開発プロセス の確立,"第29回品質工学研究発表大会,No. 5, pp. 20-25, 2021.

小西洋平 Yohei KONISHI 生産本部 技術統括部 製造部 Production Department Technology Sector Production Technology Division

武村直輝 Naoki TAKEMURA 生産本部 技術統括部 製造部 Production Department Technology Sector Production Technology Division

中野史康 Fumiyasu NAKANO 生産本部 技術統括部 製造部 Production Department Technology Sector Production Technology Division

齊藤卓一 Takuichi SAITO 生産本部 技術統括部 製造部 Production Department Technology Sector Production Technology Division



Yohei KONISHI



Naoki TAKEMURA



中野史康



齊藤卓一 Fumiyasu NAKANO

Takuichi SAITO

Nikon Research Report Vol. 4 発行年月 2022年9月

禁無断転載

NIKON CORPORATION